

**F4110**  
**Kvantová fyzika atomárních soustav**  
**letní semestr 2011 - 2012**

**IV.**  
**Elektronová optika**

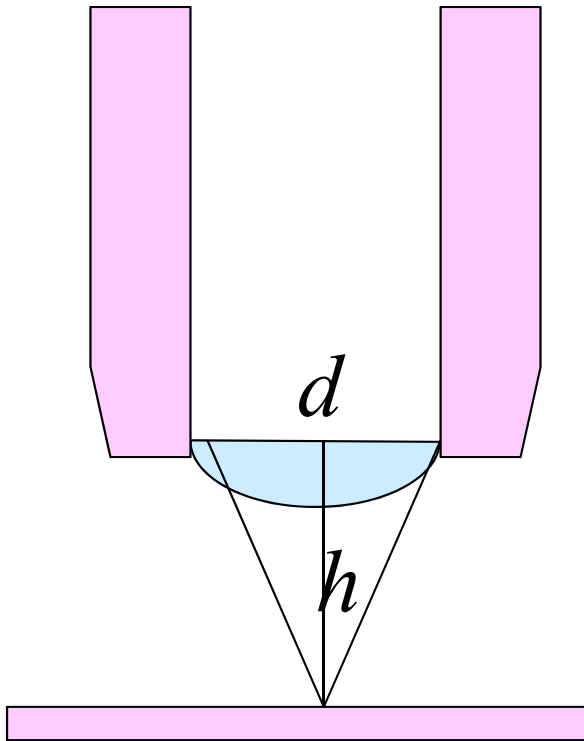
**KOTLÁŘSKÁ 21. BŘEZNA 2012**

**F4110**  
**Kvantová fyzika atomárních soustav**  
**letní semestr 2011 - 2012**

**IV.**  
**Elektronová mikroskopie**

**KOTLÁŘSKÁ 21. BŘEZNA 2012**

# Preludium: rozlišovací mez (optického) mikroskopu



Rozlišovací mez mikroskopu je dána vlnovou délkou použitého světla ... **Projeví se vlnové vlastnosti**

$$\delta = \frac{0.61\lambda}{\text{NA}} \quad \text{poloměr prvního difrakčního peaku}$$

NA numerická apertura

$$\text{NA} = \sin \vartheta = d / 2\sqrt{h^2 + \frac{1}{4}d^2}$$

# Grafické znázornění difrakčních obrazců

Numerical Aperture and Airy Disc Size

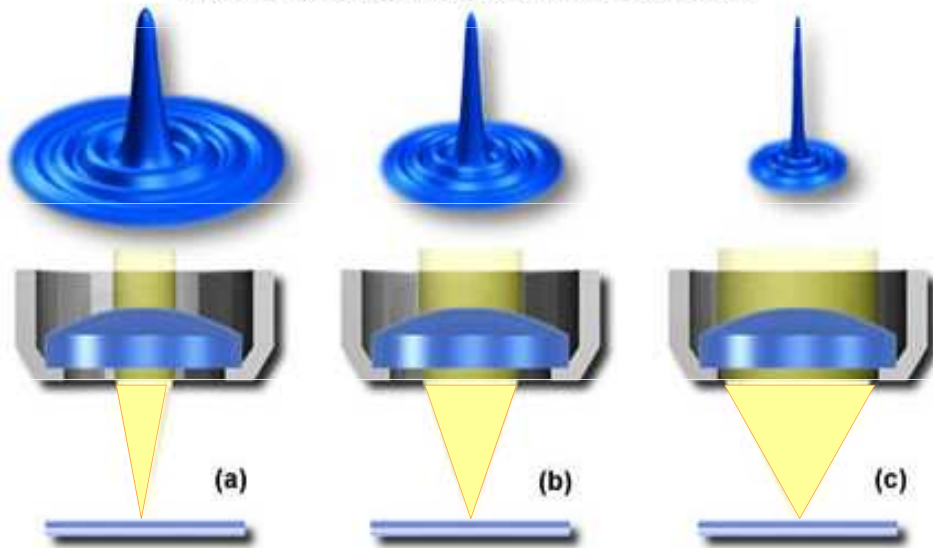


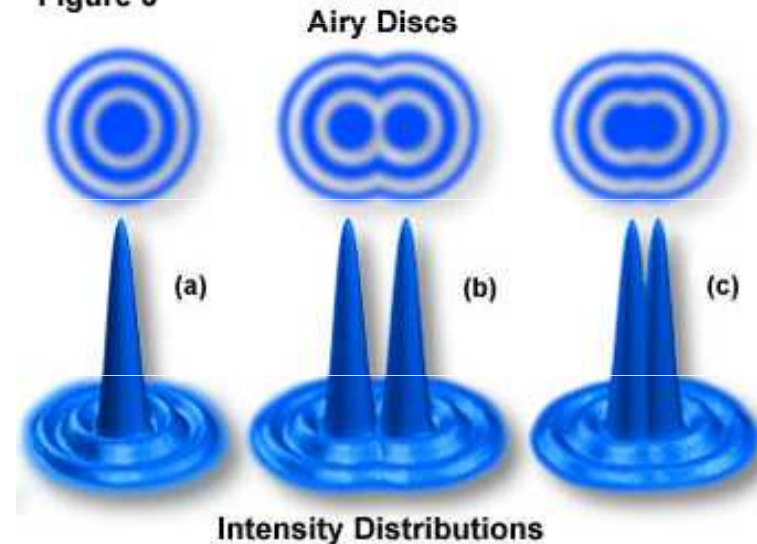
Figure 4

$$\delta = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad \text{poloměr prvního difrakčního peaku}$$

NA numerická apertura

$$NA = \sin \vartheta = d / 2\sqrt{h^2 + \frac{1}{4}d^2}$$

Figure 3



Intensity Distributions

Rozlišení:

Kdy ještě dva difrakční  
obrazce nesplývají

Lidské oko rozliší 0,2 mm  
Optický mikroskop 0,2  $\mu\text{m}$   
... Zkrátit vlnovou délku

# Grafické znázornění difrakčních obrazců

Numerical Aperture and Airy Disc Size

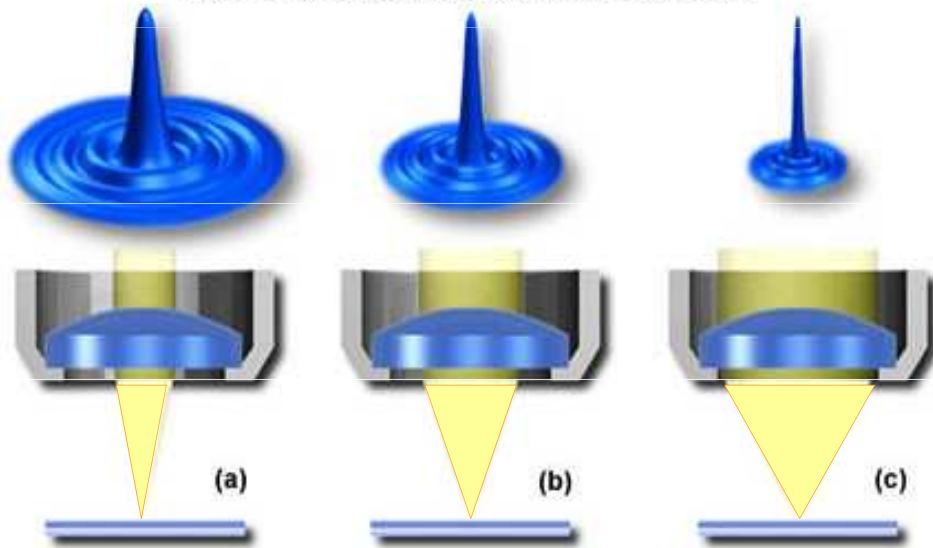


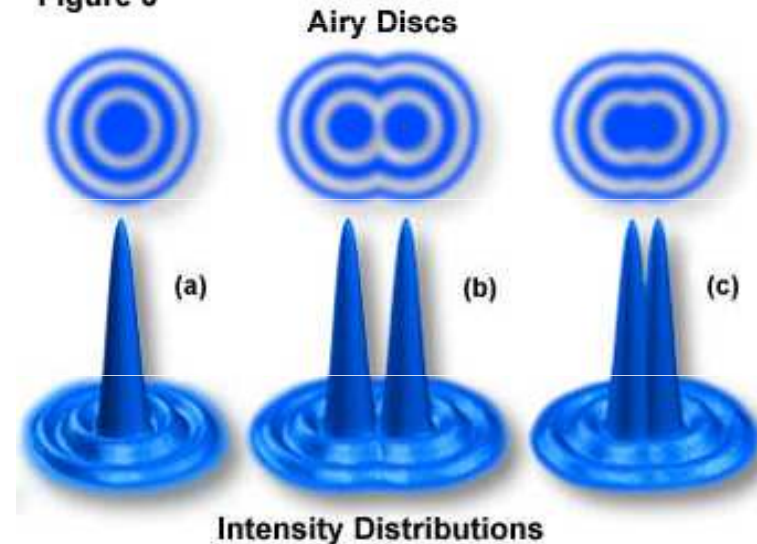
Figure 4

$$\delta = \frac{0.61\lambda}{NA} \quad \text{poloměr prvního difrakčního peaku}$$

NA numerická apertura

$$NA = \sin \vartheta = d / 2\sqrt{h^2 + \frac{1}{4}d^2}$$

Figure 3



Intensity Distributions

Rozlišení:

Kdy ještě dva difrakční obrazce nesplývají

Lidské oko rozliší 0,2 mm  
 Optický mikroskop 0,2  $\mu\text{m}$   
 ... Zkrátit vlnovou délku  
 ... elektronový mikroskop

# *Začátky elektronové mikroskopie*

|      |   |
|------|---|
| 1924 | De Broglie postuluje vlnové vlastnosti částic     |
| 1927 | Busch – teorie magnetické čočky                   |
| 1931 | Knoll a Ruska – první elektronový mikroskop       |
| 1933 | Zvětšení lepší než u optických mikroskopů         |
| 193? | Ruska – patentuje magnetické nastavce čoček       |
| 1936 | Scherzer – teorém o neodstranitelné otvorové vadě |
| 1938 | První komerční TEM -- Siemens                     |
| 1942 | Prototyp SEM (v USA)                              |

**DALŠÍ ROZVOJ AŽ V POVÁLEČNÝCH LETECH**

# Hodně opožděná Nobelova cena



## The Nobel Prize in Physics 1986

"for his fundamental work in electron optics, and for the design of the first electron microscope"

"for their design of the scanning tunneling microscope"



**Ernst Ruska**

🕒 1/2 of the prize

Federal Republic of Germany

Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft  
Berlin, Federal Republic of Germany

b. 1906  
d. 1988



**Gerd Binnig**

🕒 1/4 of the prize

Federal Republic of Germany

IBM Zurich Research Laboratory  
Rüschlikon, Switzerland

b. 1947



**Heinrich Rohrer**

🕒 1/4 of the prize

Switzerland

IBM Zurich Research Laboratory  
Rüschlikon, Switzerland

b. 1933

# Úvodem k vlastní přednášce

- S elektrony lze pracovat v přiblížení geometrické optiky, pokud se pohybují v dostatečně plyných polích
- Na příkladu elektrostatických polí prozkoumáme konstrukci centrovaných soustav v paraxiální aproximaci
- Magnetické čočky jsou ale mnohem zajímavější
- I elektronové optické soustavy trpí vadami zobrazení ...
- ale ty se dnes daří překonat



## *Vlastně několik reklamních obrázků*

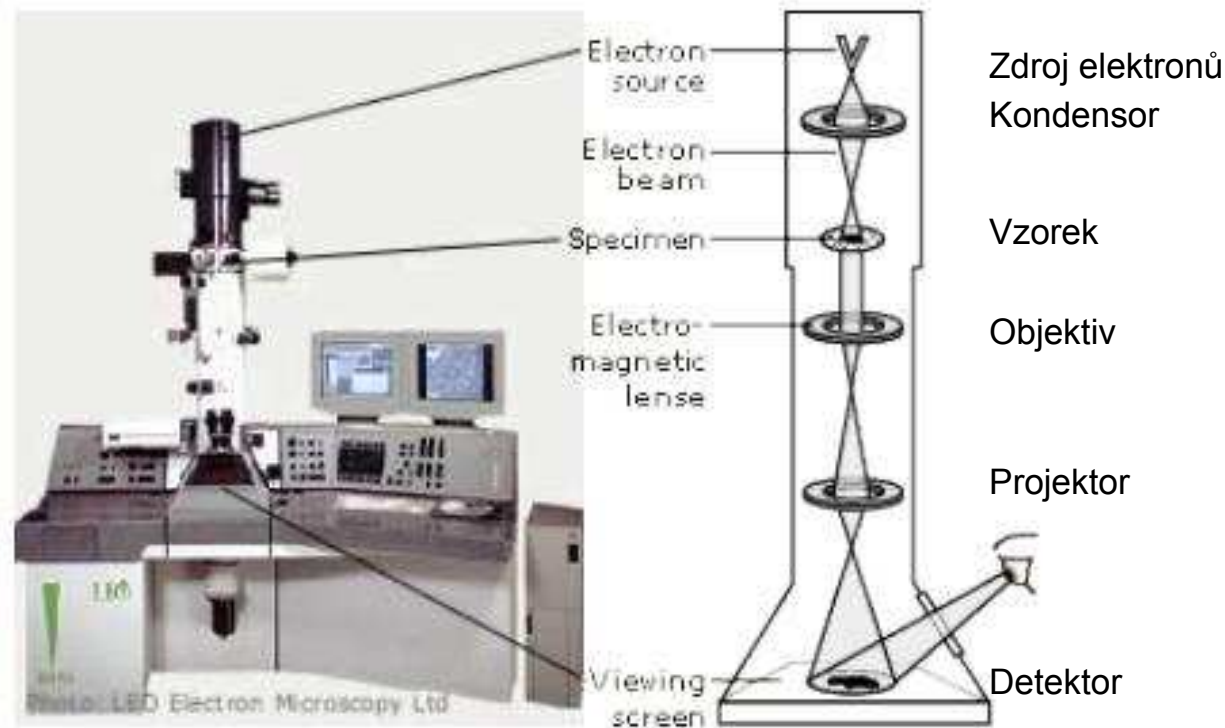
V dnešní době je elektronová mikroskopie standardní a rozšířenou laboratorní technikou.

Variant konstrukce je velký počet.

Celý obor se stále rozvíjí. Elektronové svazky se využívají i v technologii, například pro elektronovou litografii.

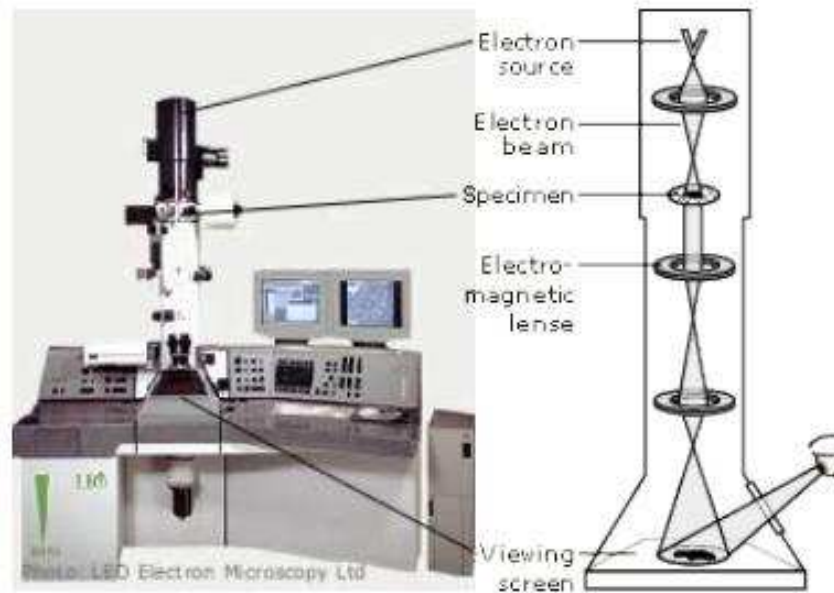
# *Transmisní (prozařovací) elektronový mikroskop*

## transmisní elektronový mikroskop (TEM)

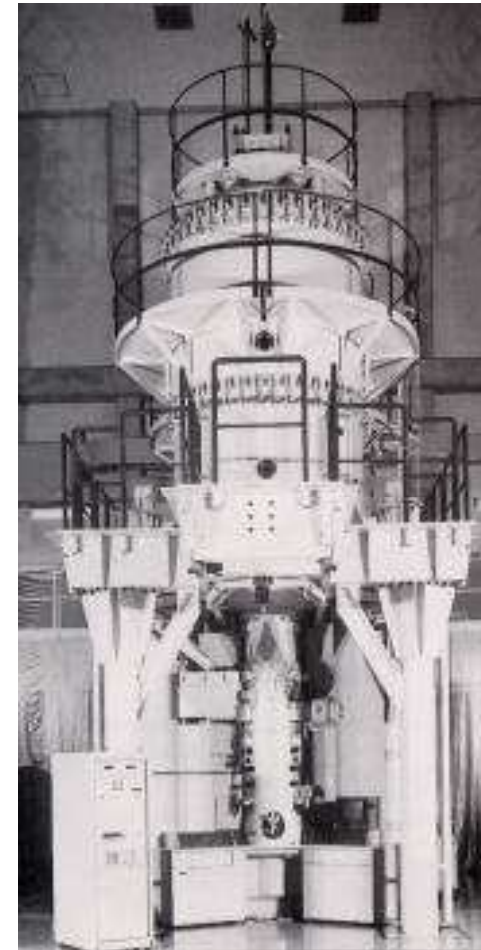


# Transmisní elektronový mikroskop

transmisní elektronový mikroskop (TEM)



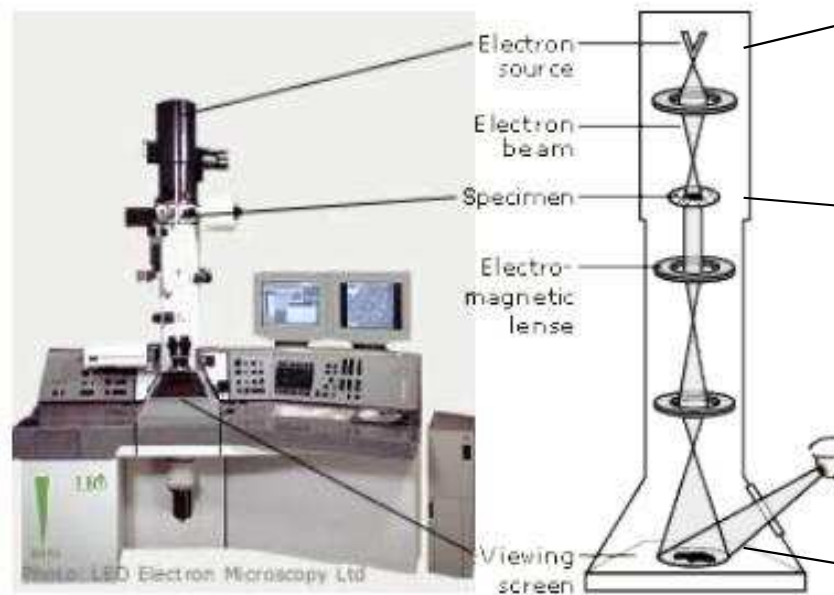
STOLNÍ PŘÍSTROJ  
~ 50 000 eV



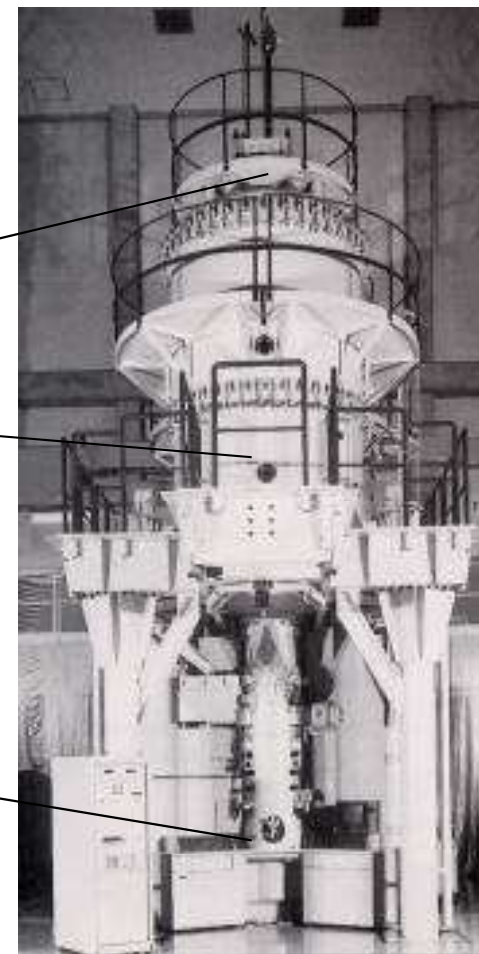
UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJ  
~ 1 000 000 eV

# Transmisní elektronový mikroskop

transmisní elektronový mikroskop (TEM)



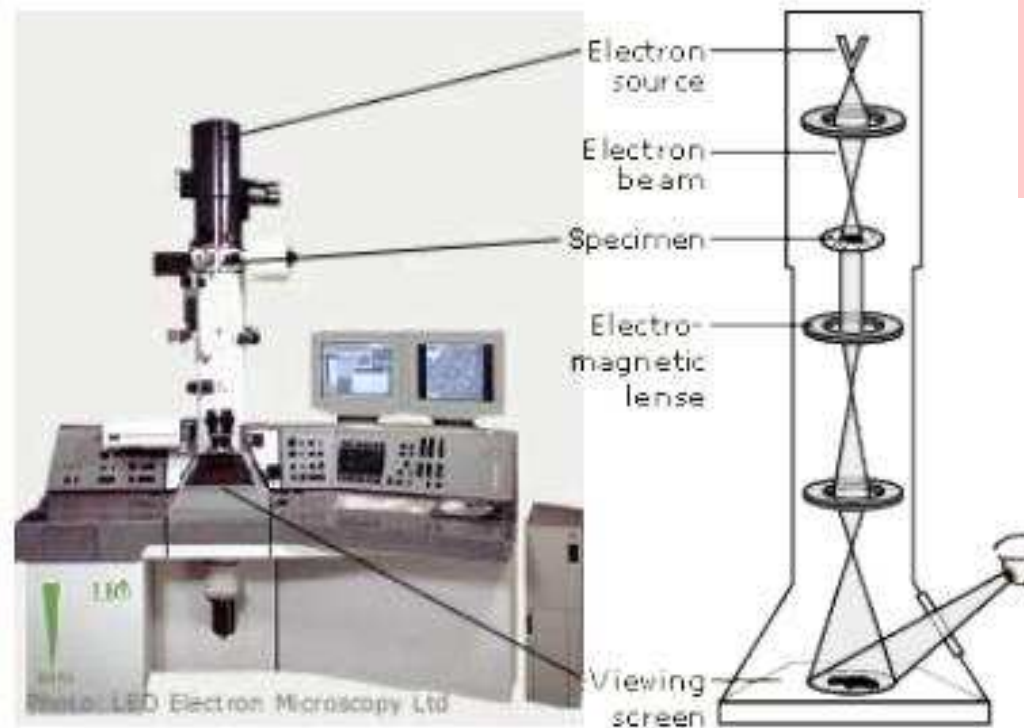
STOLNÍ PŘÍSTROJ  
~ 50 000 eV



UNIKÁTNÍ PŘÍSTROJ  
~ 1 000 000 eV

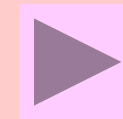
# Transmisní elektronový mikroskop

transmisní elektronový mikroskop (TEM)



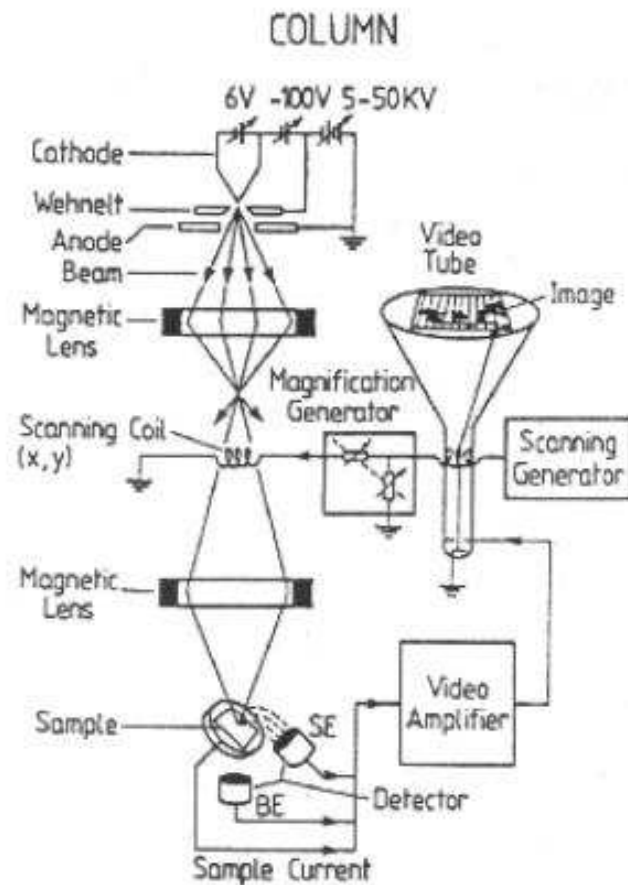
DETAIL

Srovnání s  
optickým  
mikroskopem



# Řádkovací (rastrovací) elektronový mikroskop

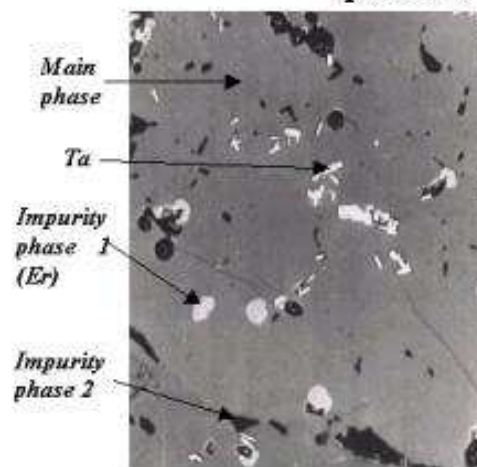
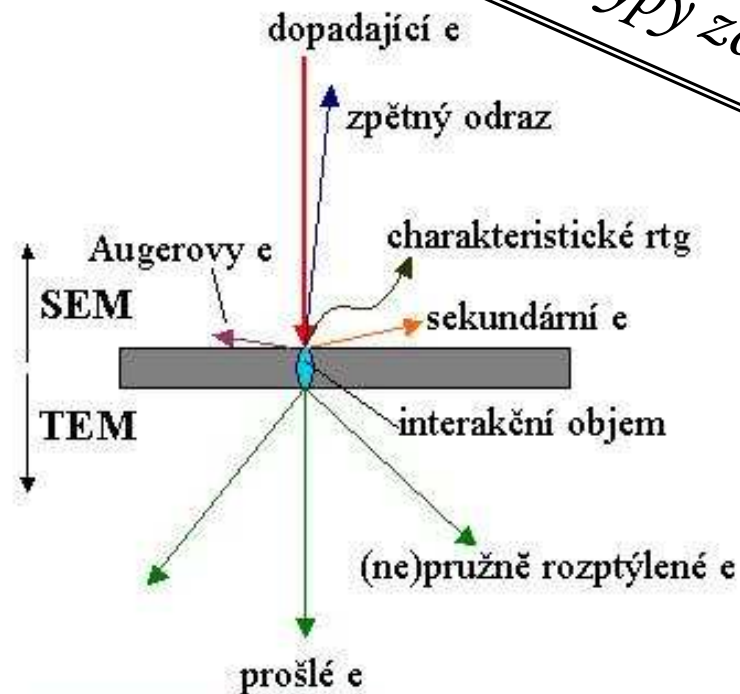
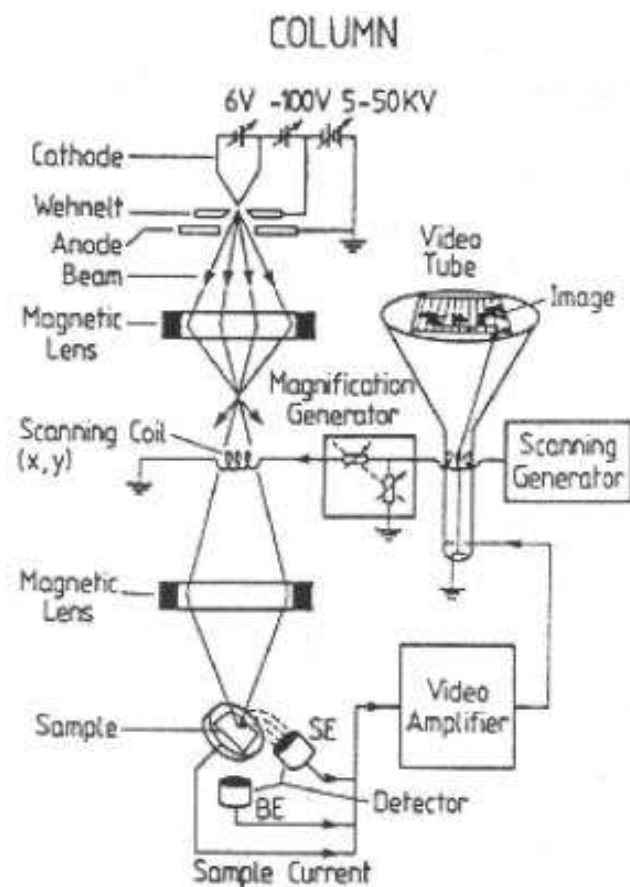
řádkovací elektronový mikroskop  
(SEM .. scanning electron microscope)



# Řádkovací elektronový mikroskop

Typy zobrazení

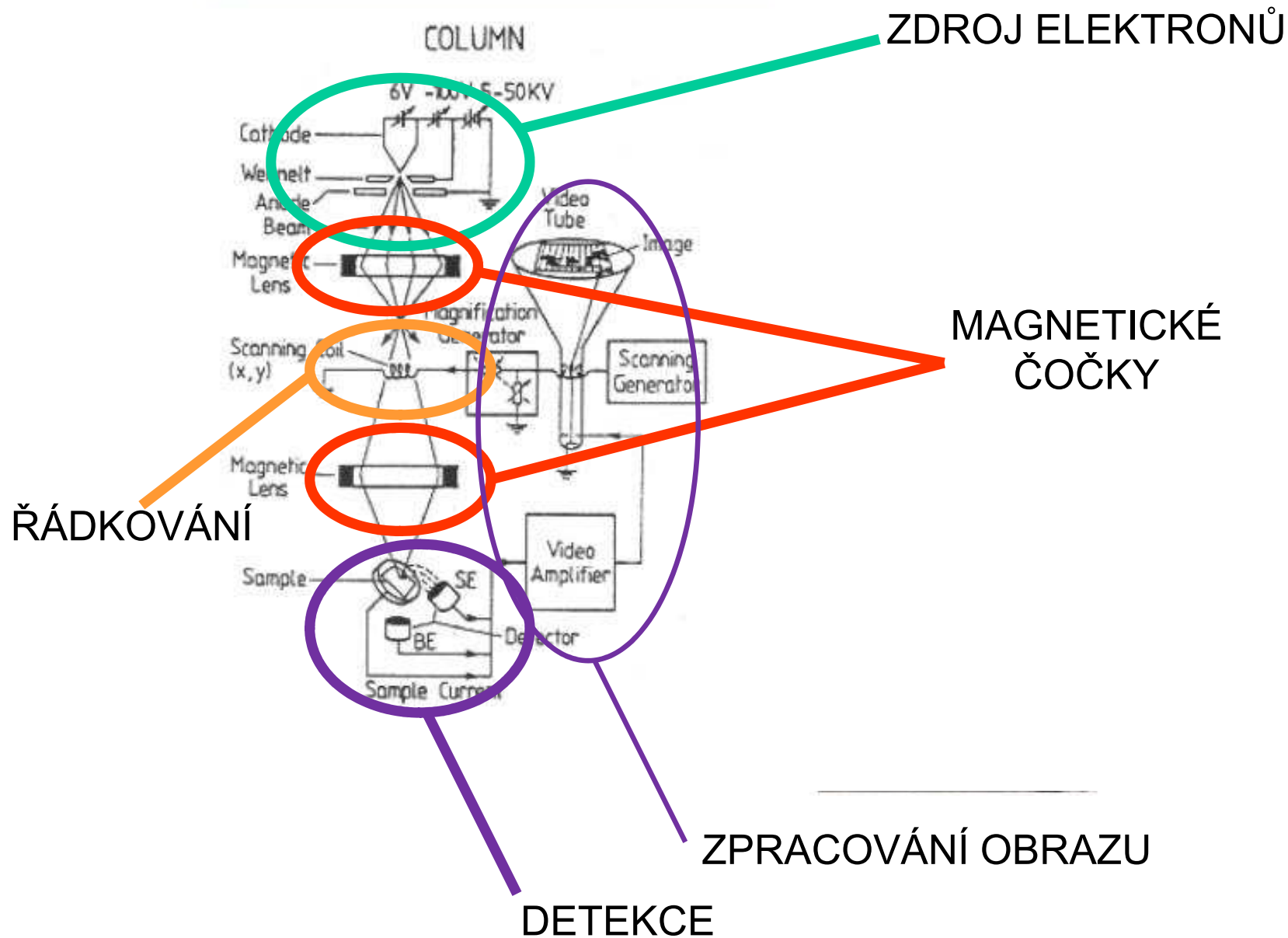
řádkovací elektronový mikroskop  
(SEM .. scanning electron microscope)



slitina Cu-Nb-Fe

# Řádkovací elektronový mikroskop: náš dnešní úhel pohledu

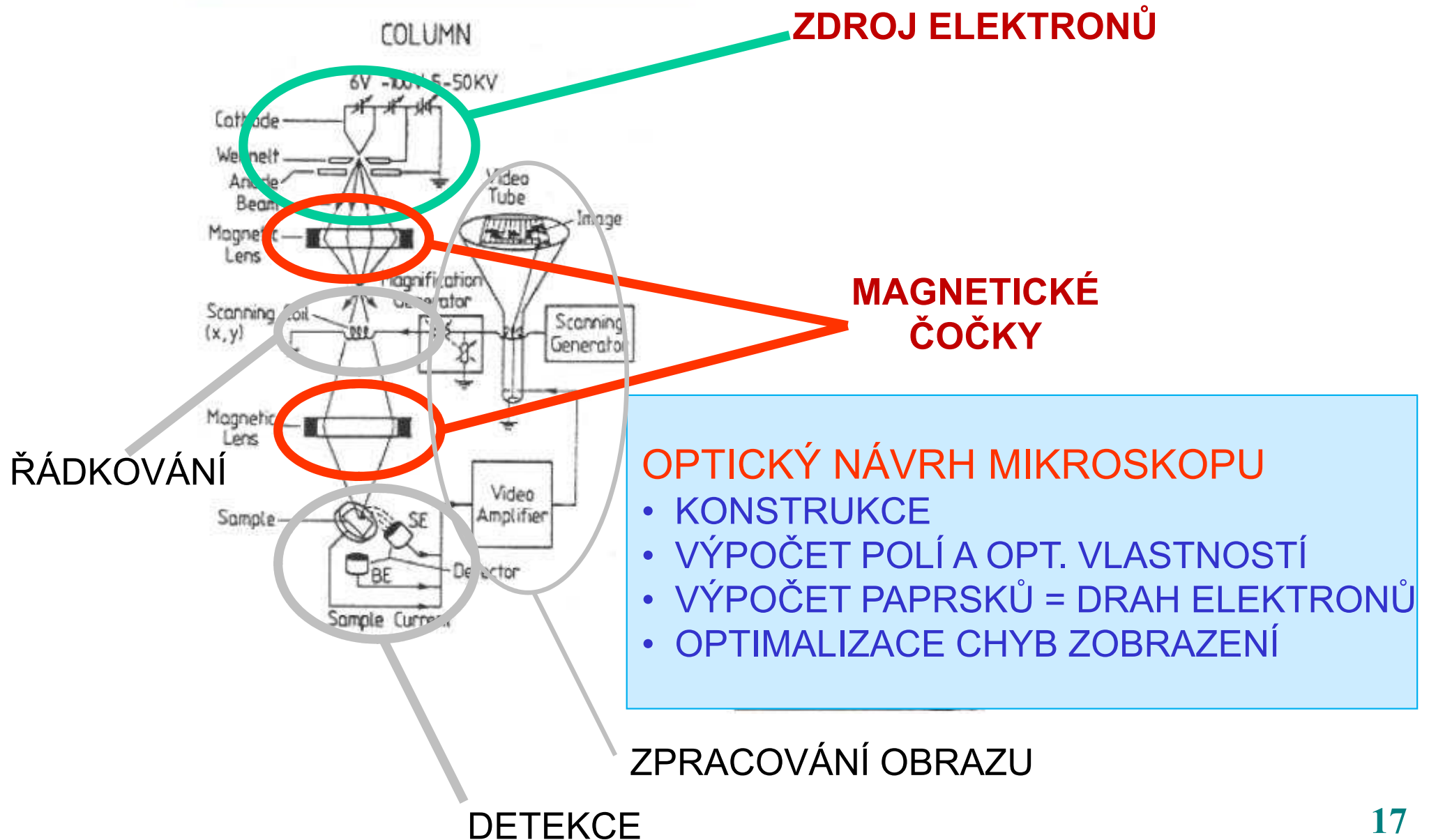
řádkovací elektronový mikroskop  
(SEM .. scanning electron microscope)





# Řádkovací elektronový mikroskop: náš dnešní úhel pohledu

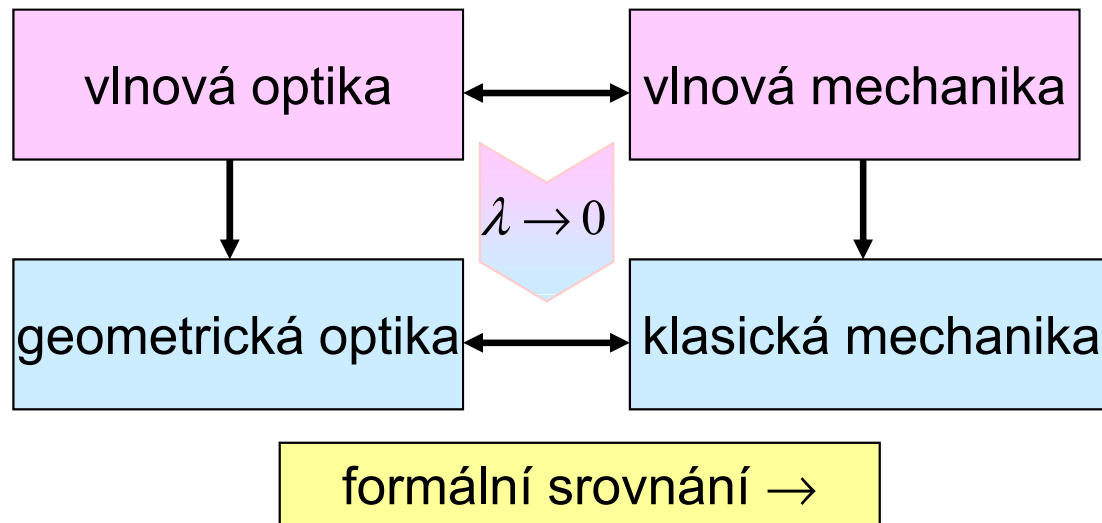
řádkovací elektronový mikroskop  
(SEM .. scanning electron microscope)



## *Částicová paprsková optika*

Využití elektronů pro geometrickou optiku s vysokým rozlišením napadlo lidstvo teprve potom, co vlnové vlastnosti elektronu byly již dobře známy.

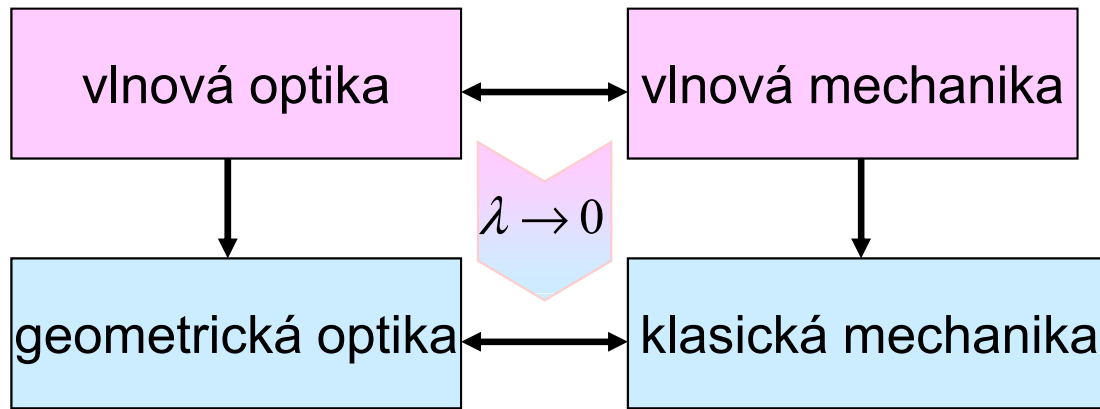
# *Paprsková ( geometrická ) optika částic*



*paprsky*  
*eikonálová*  
*rovnice*  
*sférické čočky*

*trajektorie*  
*Newtonovy*  
*rovnice +*  
*vyloučení času*  
*spojité rozložení*  
*indexu lomu*

# Paprsková (geometrická) optika částic



formální srovnání →

*paprsky*  
*eikonálová rovnice*  
*sférické čočky*

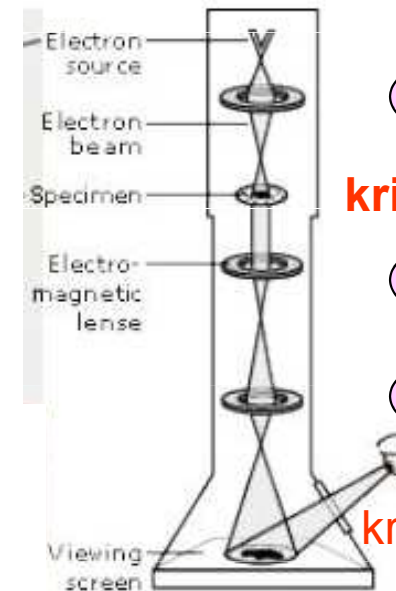
*trajektorie*  
*Newtonovy rovnice + vyločení času*  
*spojité rozložení indexu lomu*

formální podmínka

$$\lambda \rightarrow 0$$

znamená přesně

$$\lambda \ll L \text{ (char. délka)}$$



ano

**kritické místo**

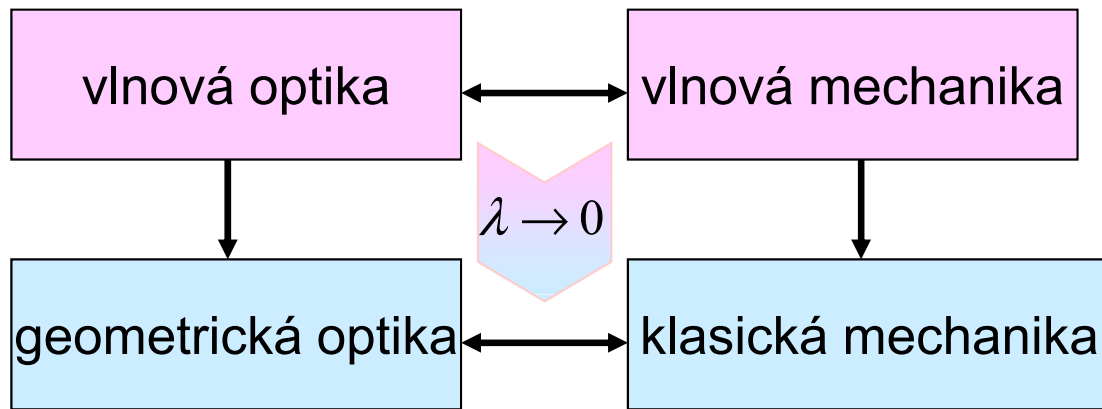
ano

ano

**kritické místo**

$L$   
 mm  
 nm  
 mm  
 mm  
 $\mu\text{m}$

# Paprsková (geometrická) optika částic



formální srovnání →

*paprsky*  
*eikonálová rovnice*  
*sférické čočky*

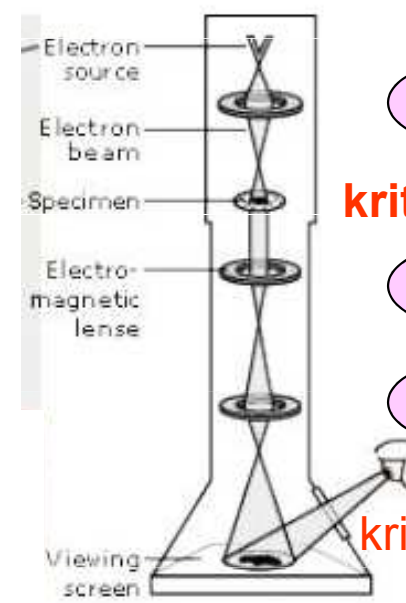
*trajektorie*  
*Newtonovy rovnice + vyločení času*  
*spojité rozložení indexu lomu*

formální podmínka

$$\lambda \rightarrow 0$$

znamená přesně

$$\lambda \ll L \text{ (char. délka)}$$



ano

**kritické místo**

ano

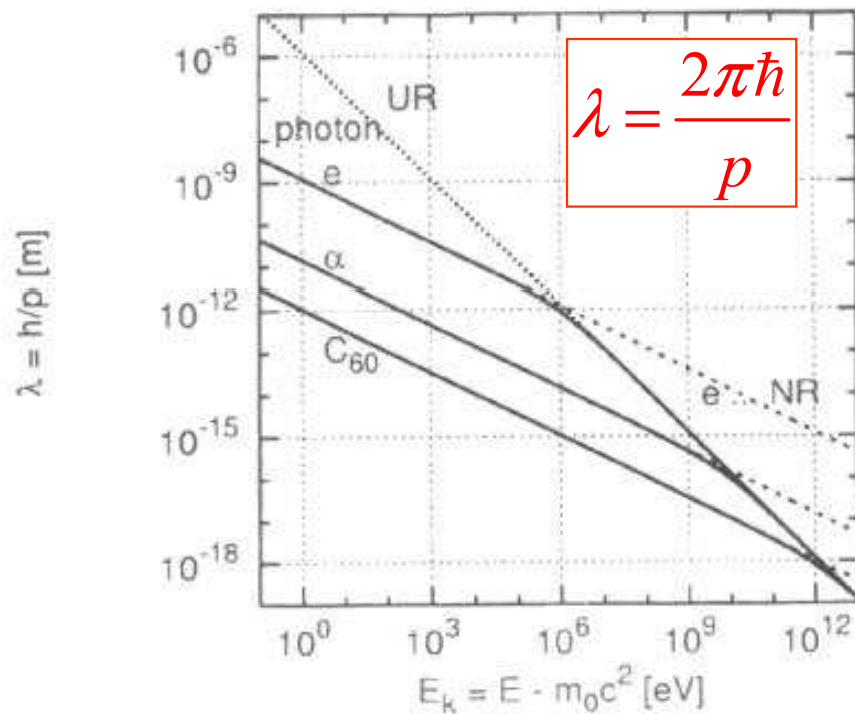
ano

**kritické místo**

*L*  
 mm  
 nm  
 mm  
 mm  
 $\mu\text{m}$

vlňové délky →

# Elektron jako vlna



## ZÁSOBNÍK VZORCŮ

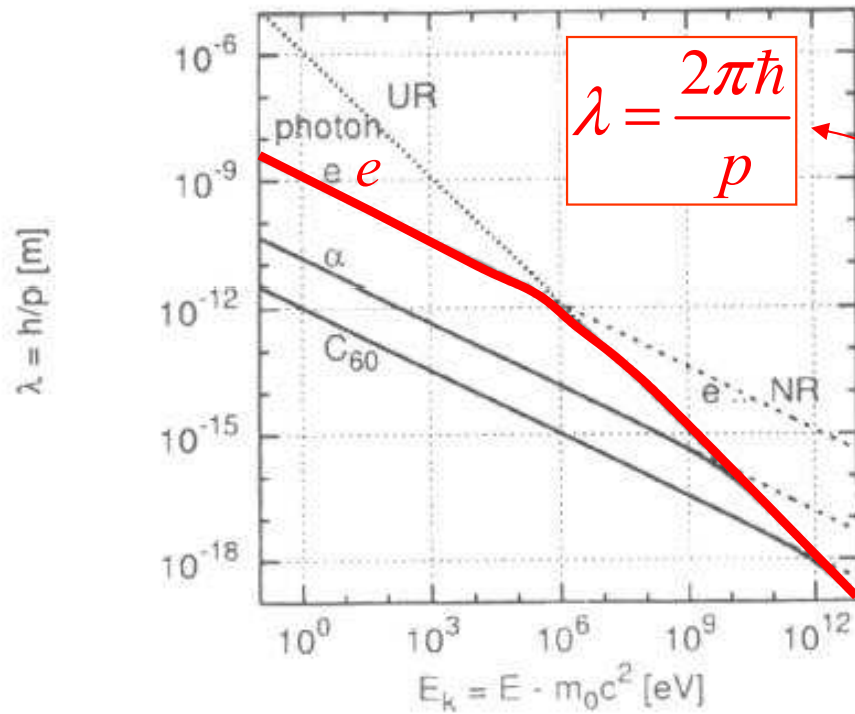
$$E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} c^2, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

$$E = m_0c^2 + E_{\text{kin}}$$

$$p = mv$$

$$p = \sqrt{\frac{E_{\text{kin}}^2}{c^2} + 2m_0E_{\text{kin}}}$$

# Elektron jako vlna



## ZÁSOBNÍK VZORCŮ

$$E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}} c^2, \beta = \frac{v}{c}$$

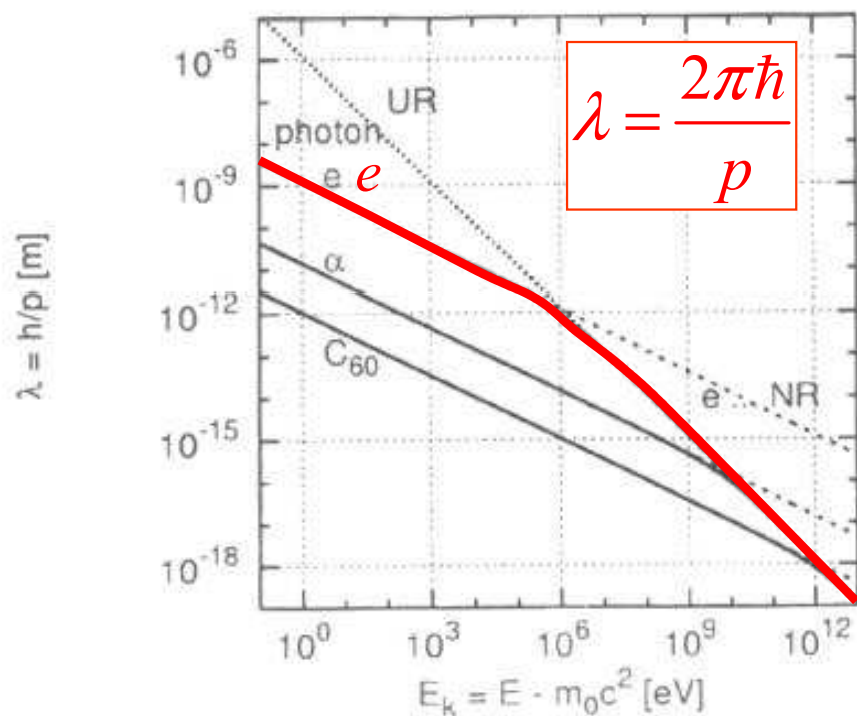
$$E = m_0c^2 + E_{\text{kin}}$$

$$p = mv$$

$$p = \sqrt{\frac{E_{\text{kin}}^2}{c^2} + 2m_0E_{\text{kin}}}$$

VSTUP  
urychlovací napětí

# Elektron jako vlna



## ZÁSOBNÍK VZORCŮ

$$E = mc^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} c^2, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

$$E = m_0 c^2 + E_{\text{kin}}$$

$$p = mv$$

$$p = \sqrt{\frac{E_{\text{kin}}^2}{c^2} + 2m_0 E_{\text{kin}}}$$

## LIMITY (explicitní hodnoty platí pro elektrony)

nerelativistická („naše“)

předěl

ultrarelativistická

$$E_{\text{kin}} \ll m_0 c^2$$

$$E_{\text{kin}} \ll 2m_0 c^2$$

$$E_{\text{kin}} \gg m_0 c^2$$

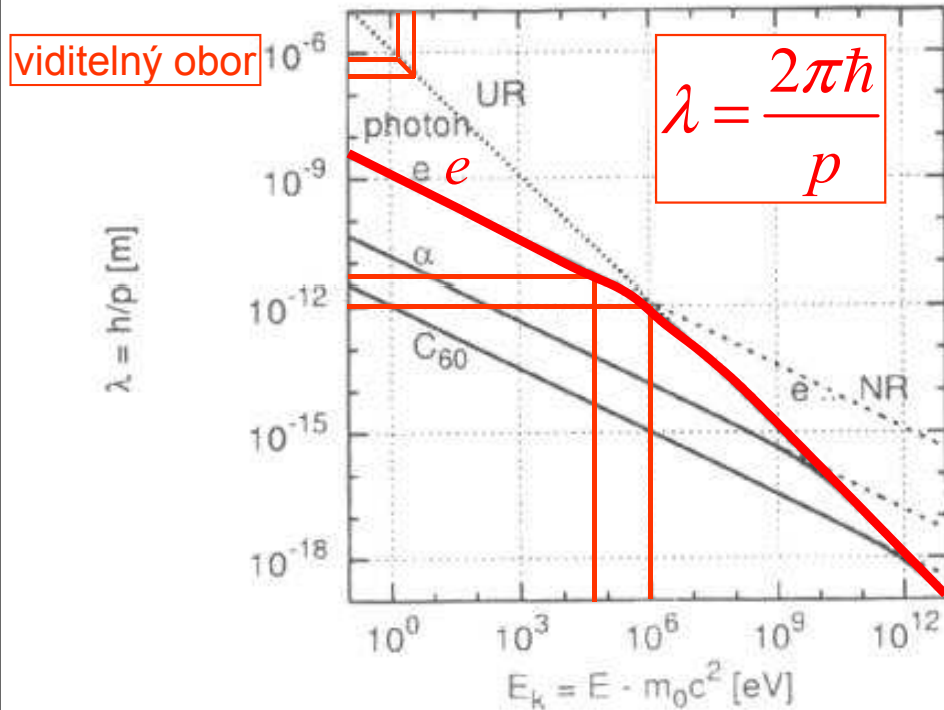
$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m_0 E_{\text{kin}}}} = \frac{1.22}{\sqrt{E_{\text{kin}}}} \text{ (nm, eV)}$$

$$\approx 10^6 \text{ eV}$$

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar c}{E_{\text{kin}}} = \frac{1.24}{E_{\text{kin}}} \text{ (\mu m, eV)}$$



# Realistické vlnové délky elektronů v mikroskopu



vlnové délky v pm  
(1 nm = 1000 pm)

| přístroj   | $U$ keV | $\lambda$ pm |
|------------|---------|--------------|
| stolní TEM | 50      | 5,46         |
| velký TEM  | 1000    | 1,22         |
| SEM        | 5 – 50  | 5,46 – 17.3  |

## LIMITY (explicitní hodnoty platí pro elektrony)

nerelativistická („naše“)

předěl

ultrarelativistická

$$E_{\text{kin}} \ll m_0c^2$$

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m_0E_{\text{kin}}}} = \frac{1.22}{\sqrt{E_{\text{kin}}}} \text{ (nm, eV)}$$

$$E_{\text{kin}} \ll 2m_0c^2$$

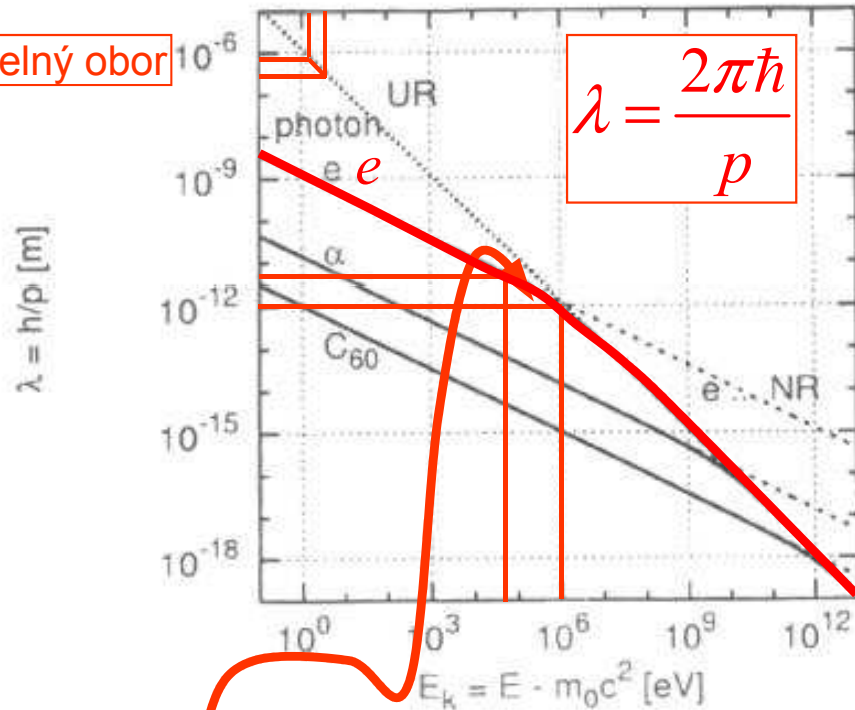
$$\approx 10^6 \text{ eV}$$

$$E_{\text{kin}} \gg m_0c^2$$

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar c}{E_{\text{kin}}} = \frac{1.24}{E_{\text{kin}}} \text{ (\mu m, eV)}$$

# Realistické vlnové délky elektronů v mikroskopu

viditelný obor



vlnové délky v pm  
(1 nm = 1000 pm)

| přístroj   | $U$ keV | $\lambda$ pm |
|------------|---------|--------------|
| stolní TEM | 50      | 5,46         |
| velký TEM  | 1000    | 1,22         |
| SEM        | 5 – 50  | 5,46 – 17.3  |

v podstatě vystačíme s korigovanou NR limitou

LIMITY (explicitní hodnoty platí pro elektrony)

nerelativistická („naše“)

$$E_{\text{kin}} \ll m_0 c^2$$

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m_0 E_{\text{kin}}}} = \frac{1.22}{\sqrt{E_{\text{kin}}}} \text{ (nm, eV)}$$

$$E_{\text{kin}} \ll 2m_0 c^2 \approx 10^6 \text{ eV}$$

předěl

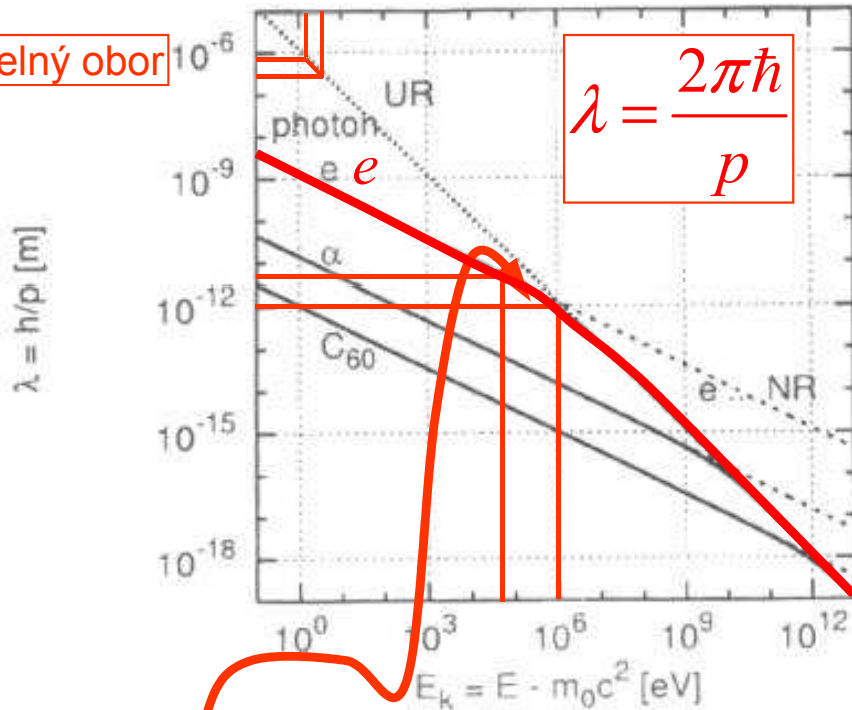
ultrarelativistická

$$E_{\text{kin}} \gg m_0 c^2$$

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar c}{E_{\text{kin}}} = \frac{1.24}{E_{\text{kin}}} \text{ (\mu m, eV)}$$

# Realistické vlnové délky elektronů v mikroskopu

viditelný obor



vlnové délky v pm  
(1 nm = 1000 pm)

| přístroj   | $U$ keV | $\lambda$ pm |
|------------|---------|--------------|
| stolní TEM | 50      | 5,46         |
| velký TEM  | 1000    | 1,22         |
| SEM        | 5 – 50  | 5,46 – 17,3  |

v podstatě vystačíme s konvovanou NR limitou

LIMITY (explicitní hodnoty platí pro elektrony)

nerelativistická („naše“)

$$E_{\text{kin}} \ll m_0 c^2$$

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{\sqrt{2m_0 E_{\text{kin}}}} = \frac{1.22}{\sqrt{E_{\text{kin}}}} \text{ (nm, eV)}$$

předěl

$$E_{\text{kin}} \ll 2m_0 c^2$$

$$\approx 10^6 \text{ eV}$$

ultrarelativistická

PROČ  
PIKOMETRY  
???

$$\lambda = \frac{1.24}{E_{\text{kin}}} \text{ (}\mu\text{m, eV)}$$

## *Trajektorie elektronů ve vnějších polích*

Elektrické či magnetické pole určuje dynamiku elektronů. Od jejich drah (trajektorií) přecházíme k paprskům jako elementům řešení v přiblížení geometrické optiky

## Trajektorie ve vnějších polích

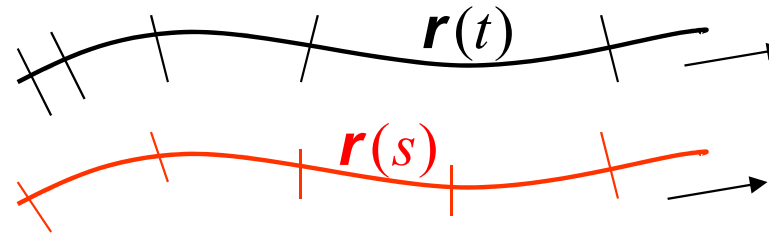
trajektorie (probíhána v čase)

paprsek (křivka parametrizovaná délkou dráhy)

Newtonovy rovnice  
(Lorentzova síla)

$$e < 0$$

náboj elektronu i se znaménkem



$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = \frac{e}{m} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

## Trajektorie ve vnějších polích

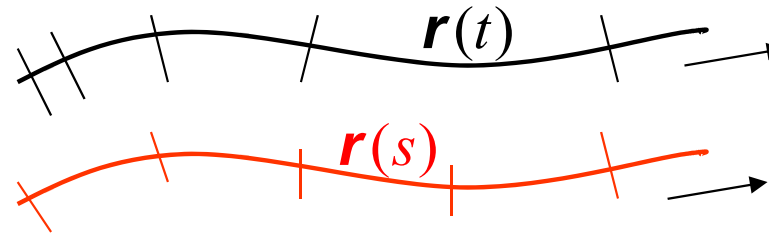
trajektorie (probíhána v čase)

paprsek (křivka parametrizovaná délkou dráhy)

Newtonovy rovnice  
(Lorentzova síla)

$$e < 0$$

náboj elektronu i se znaménkem



$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = \frac{e}{m} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

zatím vynecháme

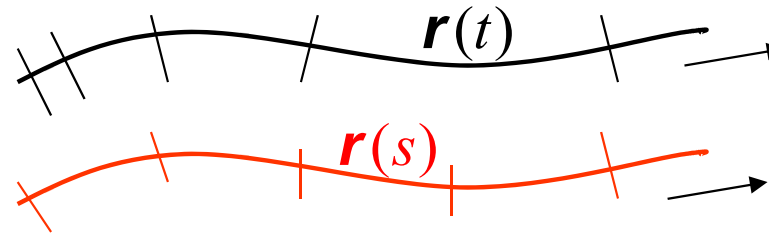
$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = -\frac{e}{m} \nabla \Phi$$

elektrostatický  
potenciál

# Trajektorie ve vnějších polích

trajektorie (probíhána v čase)

paprsek (křivka parametrizovaná délkou dráhy)



Newtonovy rovnice  
(Lorentzova síla)

$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = \frac{e}{m} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad \text{zatím vynecháme}$$

$$e < 0$$

náboj elektronu i se znaménkem

$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = -\frac{e}{m} \nabla \Phi \quad \text{elektrostatický potenciál}$$

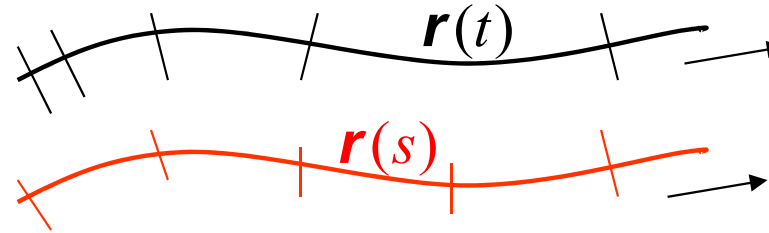
Index lomu pro elektrony

$$\begin{aligned} n(\mathbf{r}) \propto v(\mathbf{r}) &= \sqrt{\frac{2}{m} (E - U(\mathbf{r}))} & v(\mathbf{r}) &= |\dot{\mathbf{r}}(\mathbf{r}, t)| \\ &= \sqrt{\frac{2}{m} E - \frac{2e}{m} \Phi(\mathbf{r})} \end{aligned}$$

# Trajektorie ve vnějších polích

trajektorie (probíhána v čase)

paprsek (křivka parametrizovaná délkou dráhy)



Newtonovy rovnice  
(Lorentzova síla)

$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = \frac{e}{m} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad \text{zatím vynecháme}$$

$$e < 0$$

náboj elektronu i se znaménkem

$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = -\frac{e}{m} \nabla \Phi \quad \text{elektrostatický potenciál}$$

Index lomu pro elektrony

$$n(\mathbf{r}) \propto v(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{2}{m} (E - U(\mathbf{r}))} \quad v(\mathbf{r}) = |\dot{\mathbf{r}}(\mathbf{r}, t)|$$

$$= \sqrt{\frac{2}{m} E - \frac{2e}{m} \Phi(\mathbf{r})}$$

Vyloučení času

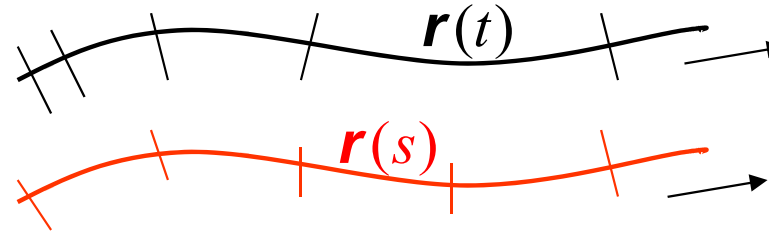
$$\frac{d\mathbf{v}}{ds} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = -\frac{e}{m} \nabla \Phi \cdot \frac{1}{v} = \nabla v$$



# Trajektorie ve vnějších polích

trajektorie (probíhána v čase)

paprsek (křivka parametrizovaná délkou dráhy)



Newtonovy rovnice  
(Lorentzova síla)

$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = \frac{e}{m} (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad \text{zatím vynecháme}$$

$$e < 0$$

náboj elektronu i se znaménkem

$$\ddot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{v}} = -\frac{e}{m} \nabla \Phi \quad \text{elektrostatický potenciál}$$

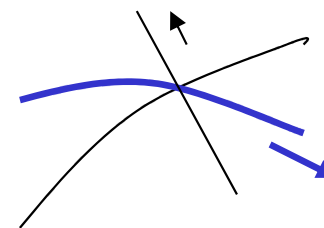
Index lomu pro elektrony

$$n(\mathbf{r}) \propto v(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{2}{m} (E - U(\mathbf{r}))} \quad v(\mathbf{r}) = |\dot{\mathbf{r}}(\mathbf{r}, t)|$$

$$= \sqrt{\frac{2}{m} E - \frac{2e}{m} \Phi(\mathbf{r})}$$

Vyloučení času

$$\frac{d\mathbf{v}}{ds} = \frac{d\mathbf{v}}{dt} \cdot \frac{dt}{ds} = -\frac{e}{m} \nabla \Phi \cdot \frac{1}{v} = \nabla v$$



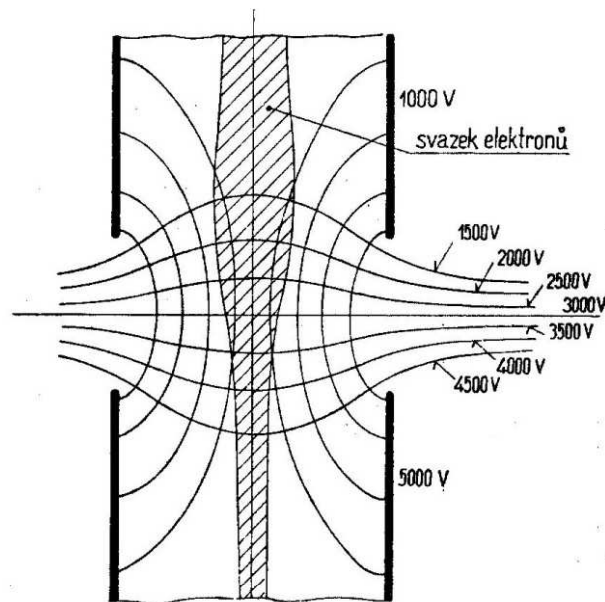
diferenciální  
tvar  
zákona lomu

## *Teoretický návrh dílů pro elektronovou optiku*

Od neurčité představy, že elektrické či magnetické pole vychýlí elektronové paprsky žádoucím směrem přejdeme k návrhu optických elementů.

# Dva kroky ve studiu optického dílu

## PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTEM



Obr. 131. Urychlovací systém.

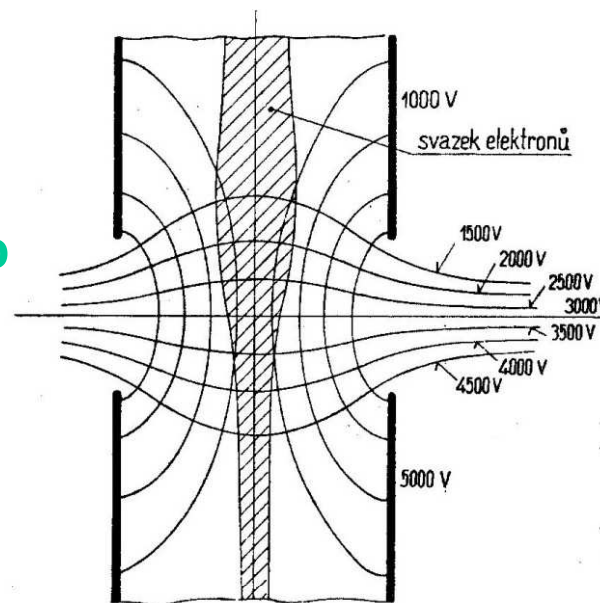
# Dva kroky ve studiu optického dílu

## PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTÉM

### 1. KROK: URČENÍ $\Phi$

- ve vakuu
- geometrie kovových elektrod
- potenciály elektrod

vstup



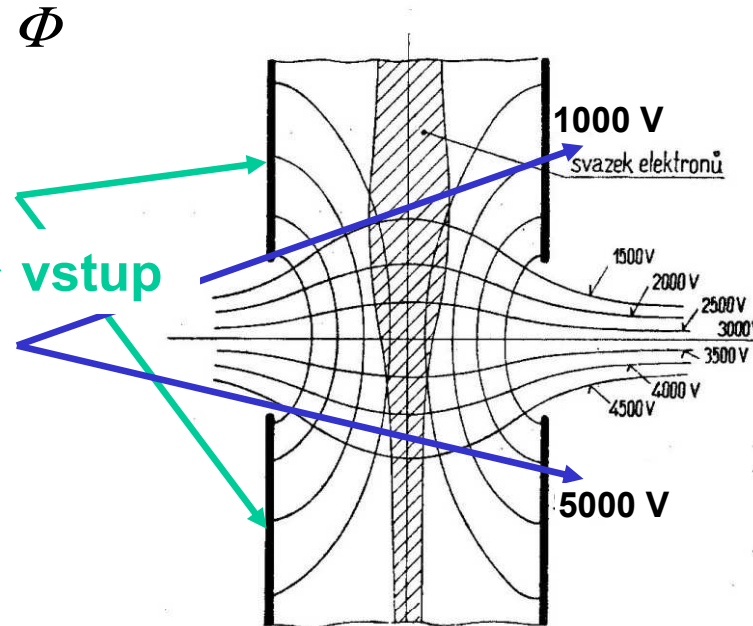
Obr. 131. Urychlovací systém.

# Dva kroky ve studiu optického dílu

## PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTEM

### 1. KROK: URČENÍ $\Phi$

- ve vakuu
- geometrie kovových elektrod
- potenciály elektrod



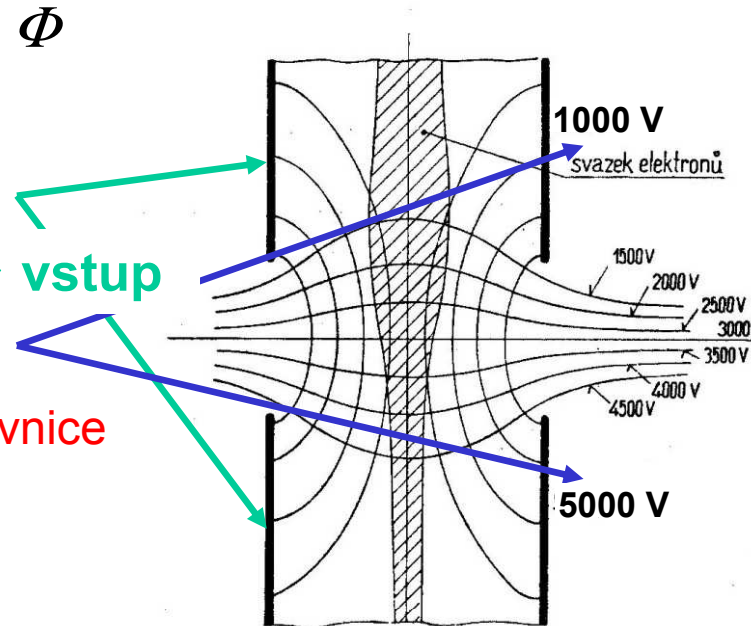
Obr. 131. Urychlovací systém.

# Dva kroky ve studiu optického dílu

## PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTEM

### 1. KROK: URČENÍ $\Phi$

- ve vakuu
- geometrie kovových elektrod
- potenciály elektrod
- řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami



Obr. 131. Urychlovací systém.

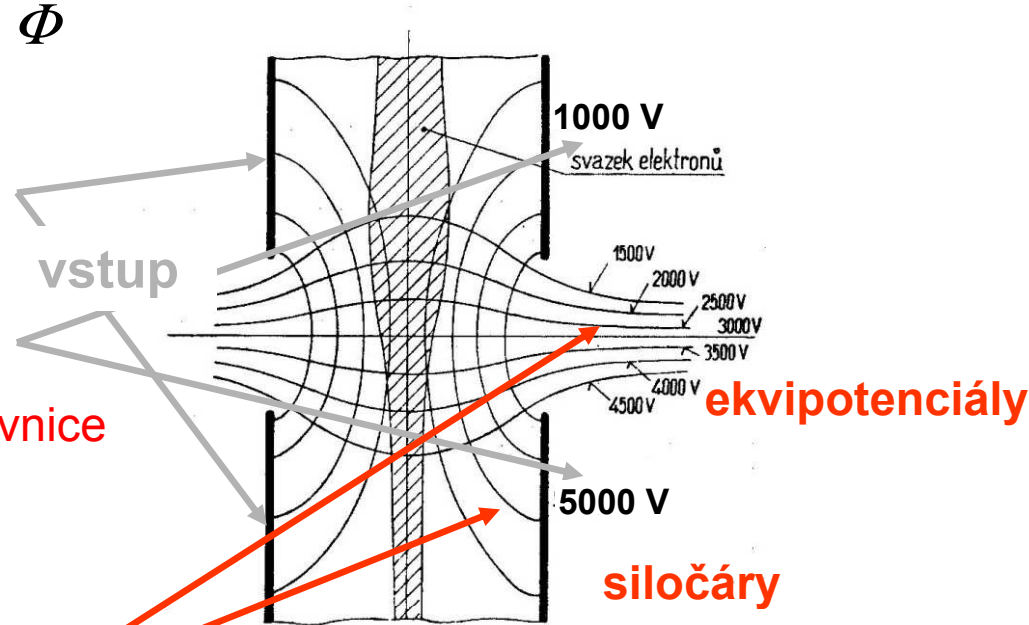
$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$

# Dva kroky ve studiu optického dílu

## PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTEM

### 1. KROK: URČENÍ $\Phi$

- ve vakuu
- geometrie kovových elektrod
- potenciály elektrod
- řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami



$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$

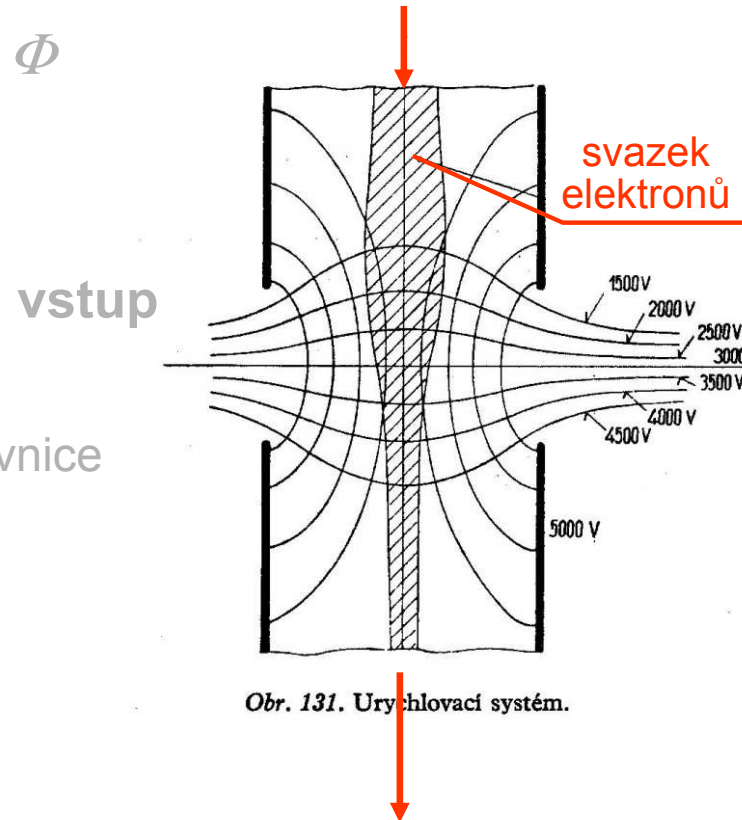
# Dva kroky ve studiu optického dílu

## PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTEM

### 1. KROK: URČENÍ $\Phi$

- ve vakuu
- geometrie kovových elektrod
- potenciály elektrod
- řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$



Obr. 131. Urychlovací systém.

### 2. KROK: PAPRSKY

- blízko osy systému – paraxiální oblast
- vstupní energie  $E$
- výstupní energie  $E + 4000 \text{ eV}$
- zlepšená kolimace



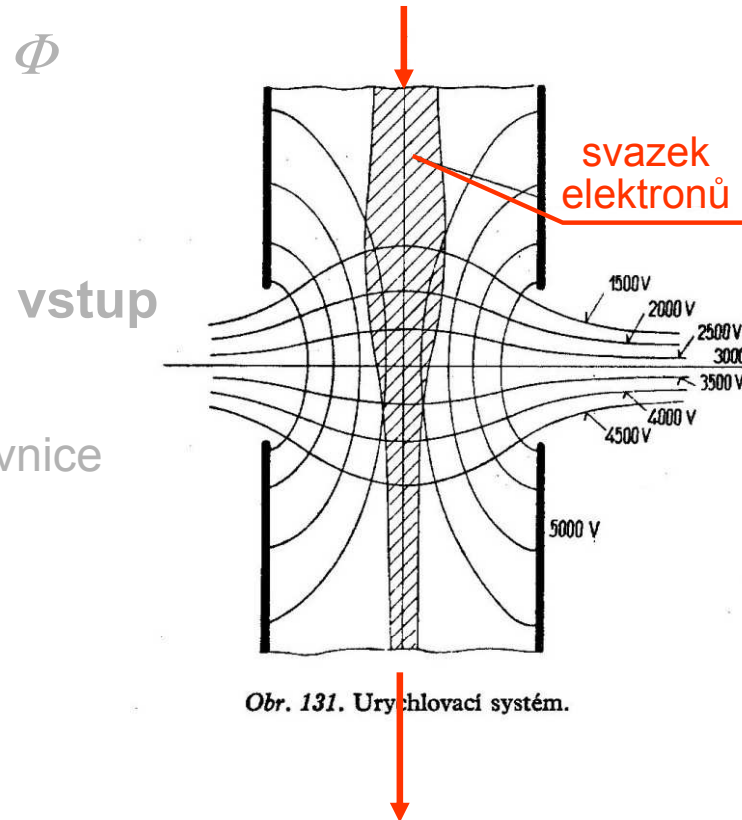
# Dva kroky ve studiu optického dílu

## PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTEM

### 1. KROK: URČENÍ $\Phi$

- ve vakuu
- geometrie kovových elektrod
- potenciály elektrod
- řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$



### 2. KROK: PAPRSKY

- blízko osy systému – paraxiální oblast
- vstupní energie  $E$
- výstupní energie  $E + 4000 \text{ eV}$
- zlepšená kolimace
- hledání trajektorií
  - buď přímo
  - z paraxiální rovnice + korekce na sférickou vadu

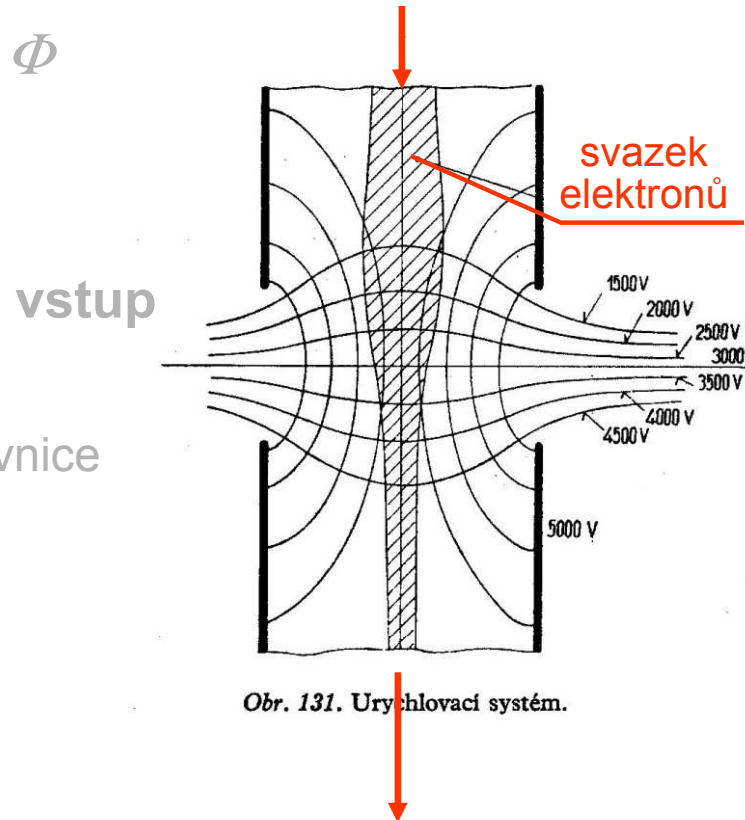
# Dva kroky ve studiu optického dílu

## PŘÍKLAD: URYCHLOVACÍ SYSTEM

### 1. KROK: URČENÍ $\Phi$

- ve vakuu
- geometrie kovových elektrod
- potenciály elektrod
- řešení Laplaceovy rovnice při okrajových podmínkách daných elektrodami

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$



### 2. KROK: PAPRSKY

- blízko osy systému – paraxiální oblast
- vstupní energie  $E$
- výstupní energie  $E + 4000 \text{ eV}$
- zlepšená kolimace
- hledání trajektorií
  - buď přímo
  - z paraxiální rovnice + korekce na sférickou vadu

## *I. Určení průběhu potenciálu*

V principu velmi jednoduchý úkol: vyřešit Laplaceovu rovnici s Dirichletovou okrajovou podmínkou.

Tato část celého postupu však klade největší nároky na použité numerické metody. Bez nich nelze počítat s úspěchem.

# Řešení Laplaceovy rovnice

LAPLACEOVA  
ROVNICE

DIRICHLETOVA  
ÚLOHA

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$
$$\partial_{xx}\Phi(x,y,z)+\partial_{yy}\Phi+\partial_{zz}\Phi=0$$

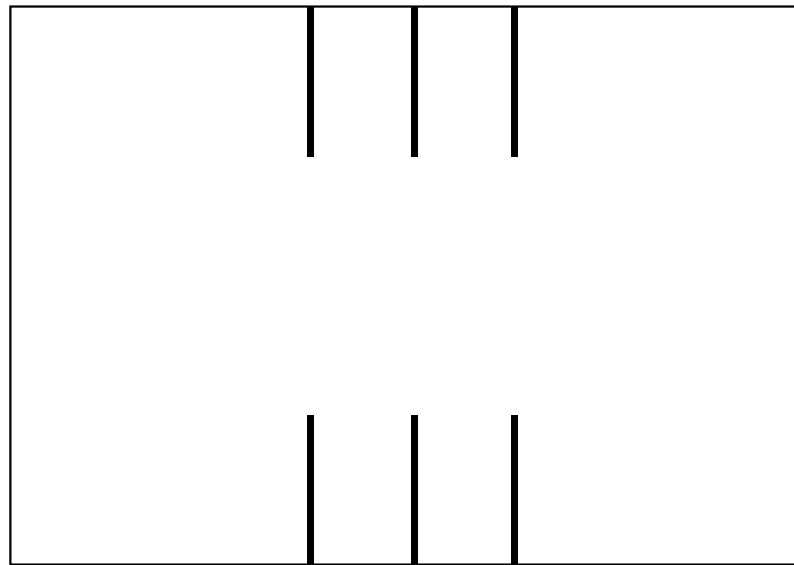
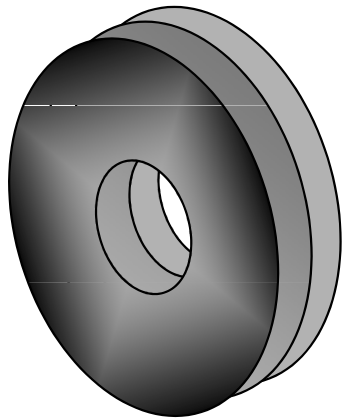
Okrajové podmínky

LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti.

Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:

♠ na povrchu elektrod ♠ na vnější hranici

Příklad čočky



# Řešení Laplaceovy rovnice

LAPLACEOVA  
ROVNICE

DIRICHLETOVA  
ÚLOHA

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$
$$\partial_{xx}\Phi(x,y,z)+\partial_{yy}\Phi+\partial_{zz}\Phi=0$$

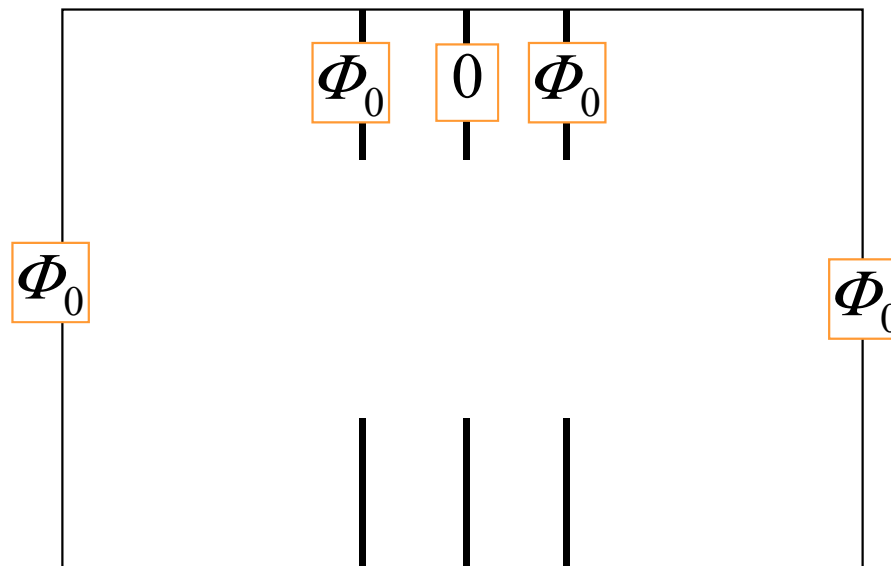
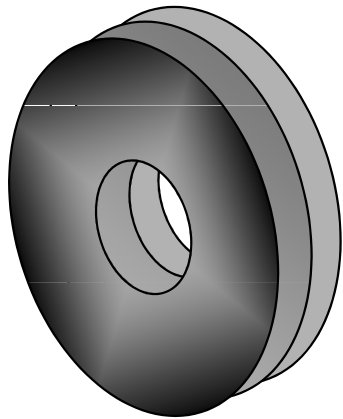
Okrajové podmínky

LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti.

Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:

- ♠ na povrchu elektrod
- ♠ na vnější hranici

Příklad čočky



# Řešení Laplaceovy rovnice

LAPLACEOVA  
ROVNICE

DIRICHLETOVA  
ÚLOHA

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$
$$\partial_{xx}\Phi(x,y,z)+\partial_{yy}\Phi+\partial_{zz}\Phi=0$$

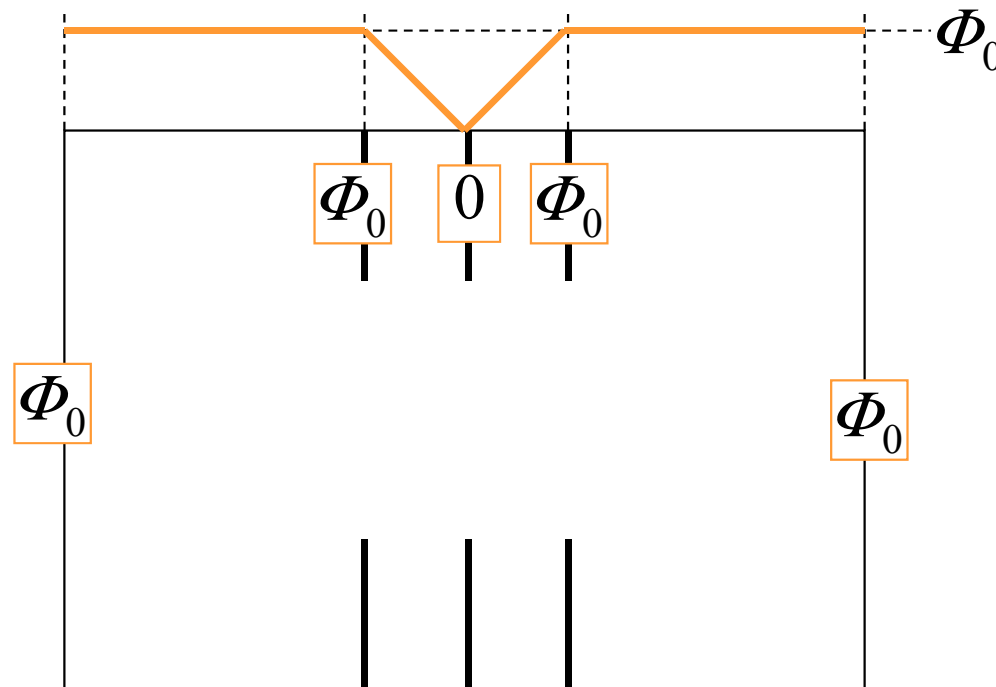
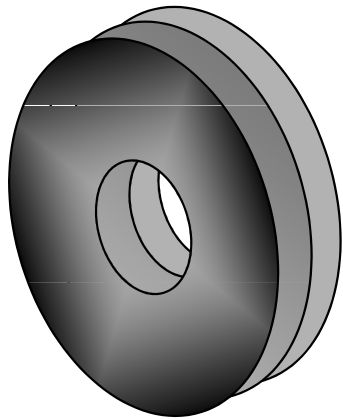
Okrajové podmínky

LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti.

Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:

♣ na povrchu elektrod ♣ na vnější hranici

Příklad čočky



# Řešení Laplaceovy rovnice

LAPLACEOVA  
ROVNICE

DIRICHLETOVA  
ÚLOHA

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$
$$\partial_{xx}\Phi(x,y,z)+\partial_{yy}\Phi+\partial_{zz}\Phi=0$$

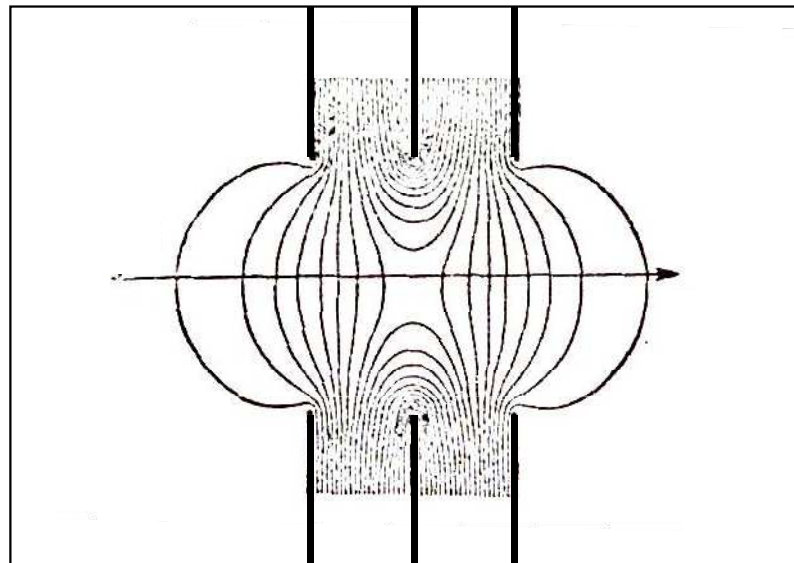
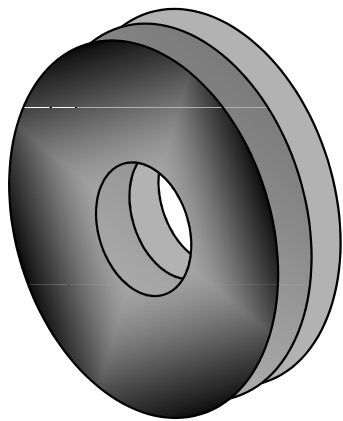
Okrajové podmínky

LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti.

Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:

- ♠ na povrchu elektrod
- ♠ na vnější hranici

Příklad čočky



# Řešení Laplaceovy rovnice

LAPLACEOVA  
ROVNICE

DIRICHLETOVA  
ÚLOHA

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$
$$\partial_{xx}\Phi(x,y,z)+\partial_{yy}\Phi+\partial_{zz}\Phi=0$$

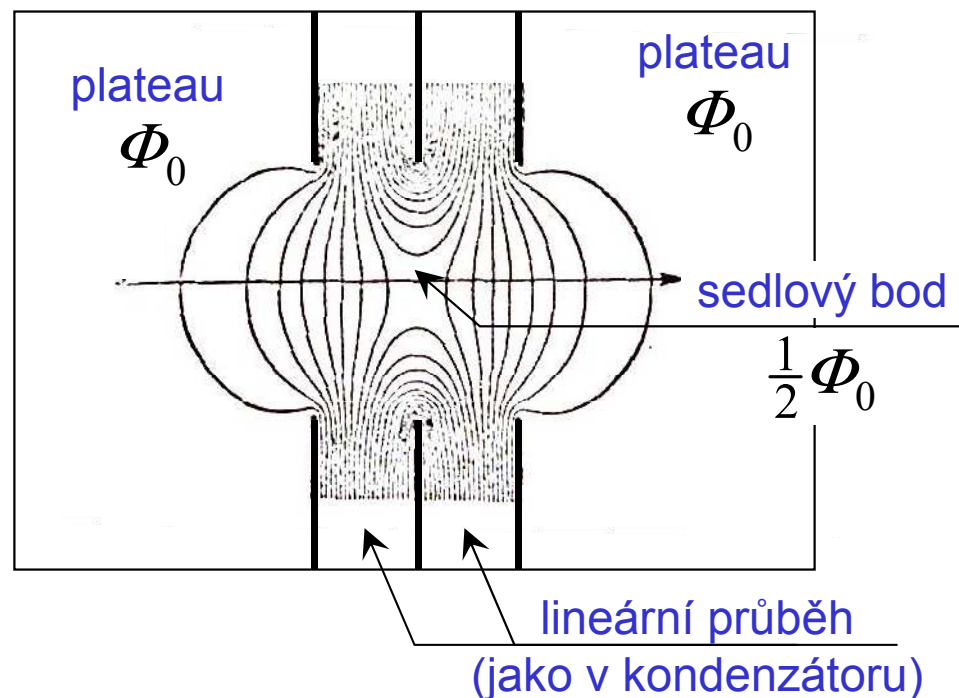
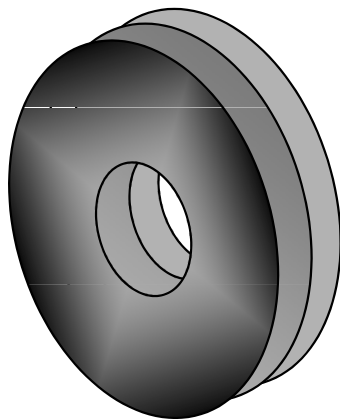
Okrajové podmínky

LR řešíme ve zvolené dostatečně rozsáhlé, ale co nejmenší oblasti.

Předepsány jsou hodnoty neznámé na hranici oblasti:

- ♣ na povrchu elektrod
- ♣ na vnější hranici

Příklad čočky





# Řešení Laplaceovy rovnice

LAPLACEOVA  
ROVNICE

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$
$$\partial_{xx}\Phi(x, y, z) + \partial_{yy}\Phi + \partial_{zz}\Phi = 0$$

NUMERICKÉ ŘEŠENÍ

Obecně 3D úloha.  
Použití osové symetrie

$$\partial_{rr}\Phi(r, z) + \frac{1}{r}\partial_r\Phi + \partial_{zz}\Phi = 0$$

*numerické techniky*

metoda  
sítí

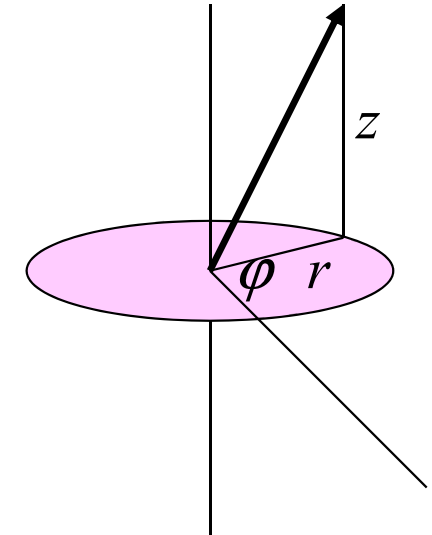
klasický postup:  
derivace nahrazeny  
diferencemi

dnes překonané

metoda  
konečných prvků

triangulace  
lineární interpolace  
variační princip

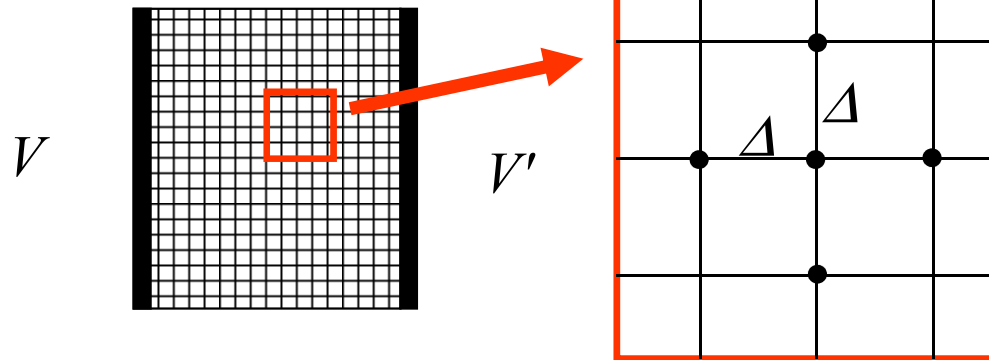
dnes nejrozšířenější



# Numerické metody: Metoda sítí

Základní myšlenka: nahradit diferenciální rovnici diferenční

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$



2D ILUSTRACE

$$x_j = x_0 + j \cdot \Delta$$

$$y_k = y_0 + k \cdot \Delta$$

$$\Phi_{j,k} = \Phi(x_j, y_k)$$

$$\begin{aligned} \Delta\Phi(\mathbf{r}_{jk}) &= \partial_{xx}\Phi(x_j, y_k) + \partial_{yy}\Phi(x_j, y_k) \rightarrow \\ &\approx \frac{\Phi_{j+1,k} - 2\Phi_{j,k} + \Phi_{j-1,k}}{\Delta^2} + \frac{\Phi_{j,k+1} - 2\Phi_{j,k} + \Phi_{j,k-1}}{\Delta^2} \end{aligned}$$

... soustava lineárních rovnic pro  $\Phi_{j,k}$

# Numerické metody: Metoda konečných prvků

Základní myšlenka: nahradit **diferenciální rovnici** **variační úlohou**

$$\left. \begin{array}{l} \Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0 \\ + \text{Dirichletovy okraj. podmínky} \end{array} \right\} \longleftrightarrow \mathcal{J}[\Phi] = \int dV \nabla\Phi \cdot \nabla\Phi = \text{Min}$$

1. Integrace po oblasti řešení
2. Do soutěže vstupují jen funkce  $\Phi$  splňující okrajové podmínky
3. Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních  $\Phi$

# Numerické metody: Metoda konečných prvků

Základní myšlenka: nahradit **diferenciální rovnici** **variační úlohou**

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$

+ Dirichletovy okraj. podmínky

$$\mathcal{J}[\Phi]=\int dV \nabla\Phi\cdot\nabla\Phi = \text{Min}$$

**Motivační úvaha (standardní)**

$$\begin{aligned} & \mathcal{J}[\check{\Phi} \pm g\delta\check{\Phi}] - \mathcal{J}[\check{\Phi}] \\ & = \pm g\delta\mathcal{J} + g^2 O[\delta^2\check{\Phi}] \geq 0 \end{aligned}$$

1. Integrace po oblasti řešení
2. Do soutěže vstupují jen funkce  $\Phi$  splňující okrajové podmínky
3. Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních  $\Phi$

# Numerické metody: Metoda konečných prvků

Základní myšlenka: nahradit **diferenciální rovnici** **variační úlohou**

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$

+ Dirichletovy okraj. podmínky

$$\mathcal{J}[\Phi] = \int dV \nabla\Phi \cdot \nabla\Phi = \text{Min}$$

**Motivační úvaha (standardní)**

$$\begin{aligned} & \mathcal{J}[\check{\Phi} \pm g\delta\Phi] - \mathcal{J}[\check{\Phi}] \\ & = \pm g\delta\mathcal{J} + g^2 O[\delta^2\Phi] \geq 0 \end{aligned}$$

Variační podmínka

$\check{\Phi}$  nechť dává minimum  $\mathcal{J}[\Phi]$

Pak

$$\delta\mathcal{J} = 2 \int dV \nabla\delta\Phi \cdot \nabla\check{\Phi} = 0$$

pro všechna  $\delta\Phi$  splňující homogenní okrajovou podmínku.

1. Integrace po oblasti řešení
2. Do soutěže vstupují jen funkce  $\Phi$  splňující okrajové podmínky
3. Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních  $\Phi$

# Numerické metody: Metoda konečných prvků

Základní myšlenka: nahradit **diferenciální rovnici** **variační úlohou**

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$

+ Dirichletovy okraj. podmínky

$$\mathcal{J}[\Phi] = \int dV \nabla\Phi \cdot \nabla\Phi = \text{Min}$$

Motivační úvaha (standardní)

$$\begin{aligned} \mathcal{J}[\check{\Phi} \pm g\delta\Phi] - \mathcal{J}[\check{\Phi}] \\ = \pm g\delta\mathcal{J} + g^2 O[\delta^2\Phi] \geq 0 \end{aligned}$$

Variační podmínka

$\check{\Phi}$  nechť dává minimum  $\mathcal{J}[\Phi]$

Pak

$$\delta\mathcal{J} = 2 \int dV \nabla\delta\Phi \cdot \nabla\check{\Phi} = 0$$

pro všechna  $\delta\Phi$  splňující homogenní okrajovou podmínku.

1. Integrace po oblasti řešení
2. Do soutěže vstupují jen funkce  $\Phi$  splňující okrajové podmínky
3. Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních  $\Phi$

Gaussova věta

$$0 = \int_{\partial V} d\mathbf{S} \delta\Phi \nabla\check{\Phi} = \int_V dV \nabla \cdot (\delta\Phi \nabla\check{\Phi})$$

$$0 = \int_V dV \nabla\delta\Phi \cdot \nabla\check{\Phi} + \int_V dV \delta\Phi \Delta\check{\Phi}$$

$$\delta\mathcal{J} = 0$$

libovolné

$$\underline{\underline{\Delta\check{\Phi} = 0}}$$

# Numerické metody: Metoda konečných prvků

Základní myšlenka: nahradit **diferenciální rovnici** **variační úlohou**

$$\Delta\Phi(\mathbf{r})=0$$

+ Dirichletovy okraj. podmínky

$$\mathcal{J}[\Phi] = \int dV \nabla\Phi \cdot \nabla\Phi = \text{Min}$$

**Motivační úvaha (standardní)**

$$\begin{aligned} & \mathcal{J}[\check{\Phi} \pm g\delta\Phi] - \mathcal{J}[\check{\Phi}] \\ & = \pm g\delta\mathcal{J} + g^2 O[\delta^2\Phi] \geq 0 \end{aligned}$$

Variační podmínka

$\check{\Phi}$  nechť dává minimum  $\mathcal{J}[\Phi]$

Pak

$$\delta\mathcal{J} = 2 \int dV \nabla\delta\Phi \cdot \nabla\check{\Phi} = 0$$

pro všechna  $\delta\Phi$  splňující homogenní okrajovou podmínku.

1. Integrace po oblasti řešení
2. Do soutěže vstupují jen funkce  $\Phi$  splňující okrajové podmínky
3. Minimum budeme hledat jen ve třídě vhodných aproximativních  $\Phi$

aproximace

## *Numerické metody: Metoda konečných prvků*

**Triangulace** Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků

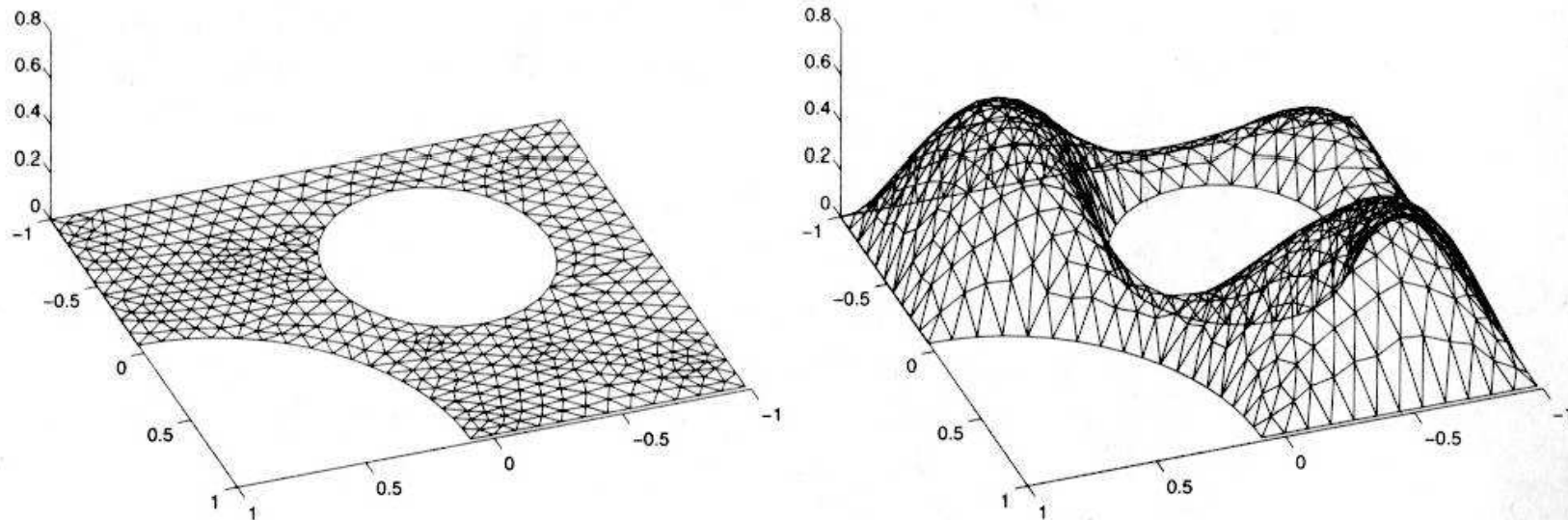
**Interpolace** Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě



# Znázornění triangulace v metodě konečných prvků

Podle Partial Differential Equation Toolbox for use with MATLAB:  
User's Guide

This is like using flat tiles to build a waterproof dome, which is perfectly possible.



**A Triangular Mesh (left) and a Continuous Piecewise Linear Function on That Mesh**

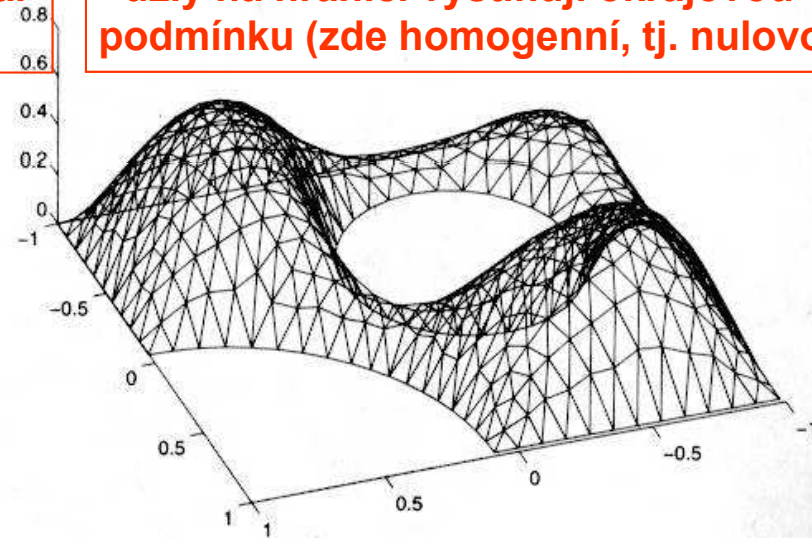
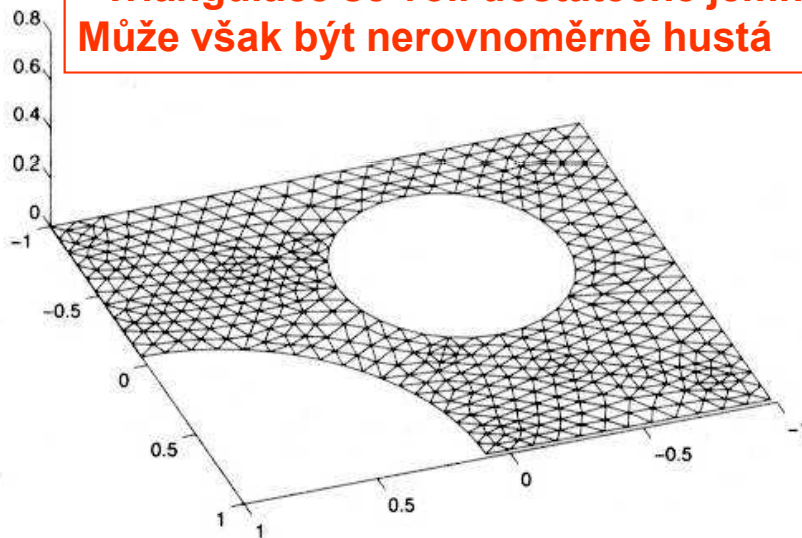
# Znázornění triangulace v metodě konečných prvků

Podle Partial Differential Equation Toolbox for use with MATLAB:  
User's Guide

This is like using flat tiles to build a waterproof dome, which is perfectly possible.

- Definiční obor může být složitá oblast
- Triangulace se volí dostatečně jemná. Může však být nerovnoměrně hustá

- Interpoláční funkce v každé buňce je lineární, u hran jsou zlomy sklonu
- uzly na hranici vystihují okrajovou podmínku (zde homogenní, tj. nulovou)



**A Triangular Mesh (left) and a Continuous Piecewise Linear Function on That Mesh**

## *Numerické metody: Metoda konečných prvků*

**Triangulace** Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků

**Interpolace** Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě

**Variační podmínka** Gradient této interpolace je po částech spojitý ... je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojitě druhé derivace)

# Numerické metody: Metoda konečných prvků

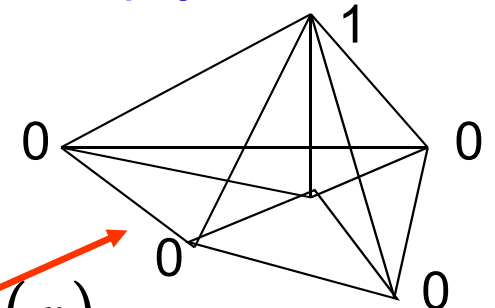
**Triangulace** Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků

**Interpolace** Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě

**Variační podmínka** Gradient této interpolace je po částech spojitý ... je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace)

**Konečné prvky** S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad

$$\Phi \xrightarrow[\text{interpolace}]{\text{triangulace}} \Phi_{\text{var}} \xrightarrow[\text{koneč. prvků}]{\text{rozklad do}} \sum_n \Phi(\mathbf{r}_n) \eta_n(\mathbf{r})$$



# Numerické metody: Metoda konečných prvků

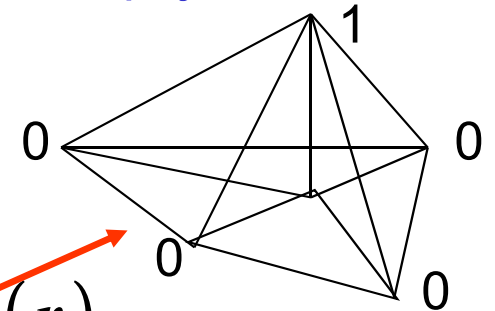
**Triangulace** Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků

**Interpolace** Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě

**Variační podmínka** Gradient této interpolace je po částech spojitý ... je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace)

**Konečné prvky** S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad

$$\Phi \xrightarrow[\text{interpolace}]{\text{triangulace}} \Phi_{\text{var}} \xrightarrow[\text{koneč. prvků}]{\text{rozklad do}} \sum_n \Phi(\mathbf{r}_n) \eta_n(\mathbf{r})$$



**Lineární rovnice** Soustava lineárních rovnic k řešení:

$$\int dV \nabla \delta\Phi \cdot \nabla \check{\Phi} = 0 \quad \text{variační podmínka}$$

# Numerické metody: Metoda konečných prvků

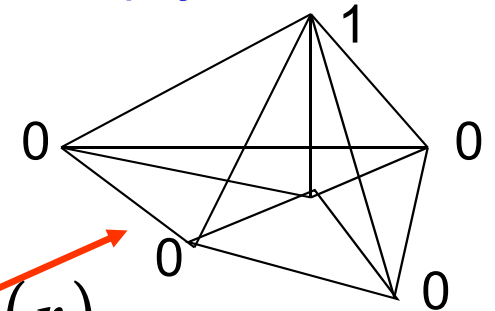
**Triangulace** Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků

**Interpolace** Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě

**Variační podmínka** Gradient této interpolace je po částech spojitý ... je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace)

**Konečné prvky** S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad

$$\Phi \xrightarrow[\text{interpolace}]{\text{triangulace}} \Phi_{\text{var}} \xrightarrow[\text{koneč. prvků}]{\text{rozklad do}} \sum_n \Phi(\mathbf{r}_n) \eta_n(\mathbf{r})$$



**Lineární rovnice** Soustava lineárních rovnic k řešení:

$$\int dV \nabla \eta_n \cdot \nabla \sum_m \eta_m \times \Phi(\mathbf{r}_m) = 0$$

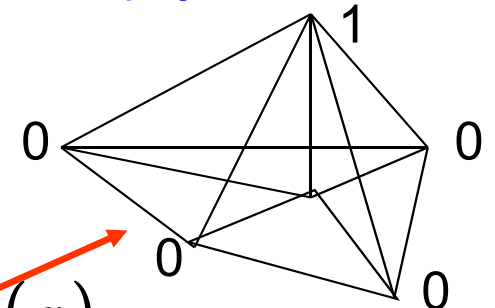
# Numerické metody: Metoda konečných prvků

**Triangulace** Oblast řešení je rozdělena na síť dostatečně malých elementárních oblastí, např. trojúhelníků

**Interpolace** Aproximativní funkce interpoluje polynomiálně, např. lineárně, hodnoty ve vrcholech sítě

**Variační podmínka** Gradient této interpolace je po částech spojitý ... je použitelný ve variačním funkcionálu (hledané řešení má přitom spojité druhé derivace)

**Konečné prvky** S každým vrcholem sítě spojíme jeden „prvek“ podle obrázku. Máme tak rozklad



$$\Phi \xrightarrow[\text{interpolace}]{\text{triangulace}} \Phi_{\text{var}} \xrightarrow[\text{koneč. prvků}]{\text{rozklad do}} \sum_n \Phi(\mathbf{r}_n) \eta_n(\mathbf{r})$$

**Lineární rovnice** Soustava lineárních rovnic k řešení:

$$\sum_m \underbrace{\int dV \nabla \eta_n \cdot \nabla \eta_m}_{A_{nm}} \times \Phi(\mathbf{r}_m) = 0$$

Matice soustavy je řídká, efektivní metody řešení.

## *Metoda konečných elementů*

Na současných paralelních počítačích řešitelné i rozsáhlé problémy založené na parciálních diferenciálních rovnicích

Překvapivě mnoho lze dosáhnout i na výkonných PC nebo pracovních stanicích

... APLIKOVANÁ FUNKCIONÁLNÍ ANALÝSA

BRNO a metoda FEM ✓ prof. M. Zlámal (1924-1997) a jeho škola na VUT

✓ prof. B. Lencová UPT AV ČR a VUT SPOC

<http://www.lencova.com>



## *II. Určení průběhu paprsků*

Omezíme se nejprve na  
osově symetrickou paraxiální oblast.

Tam je všechno plně zvládnuto.  
Zobrazení je tam dokonalé.

# Paraxiální elektronová optika

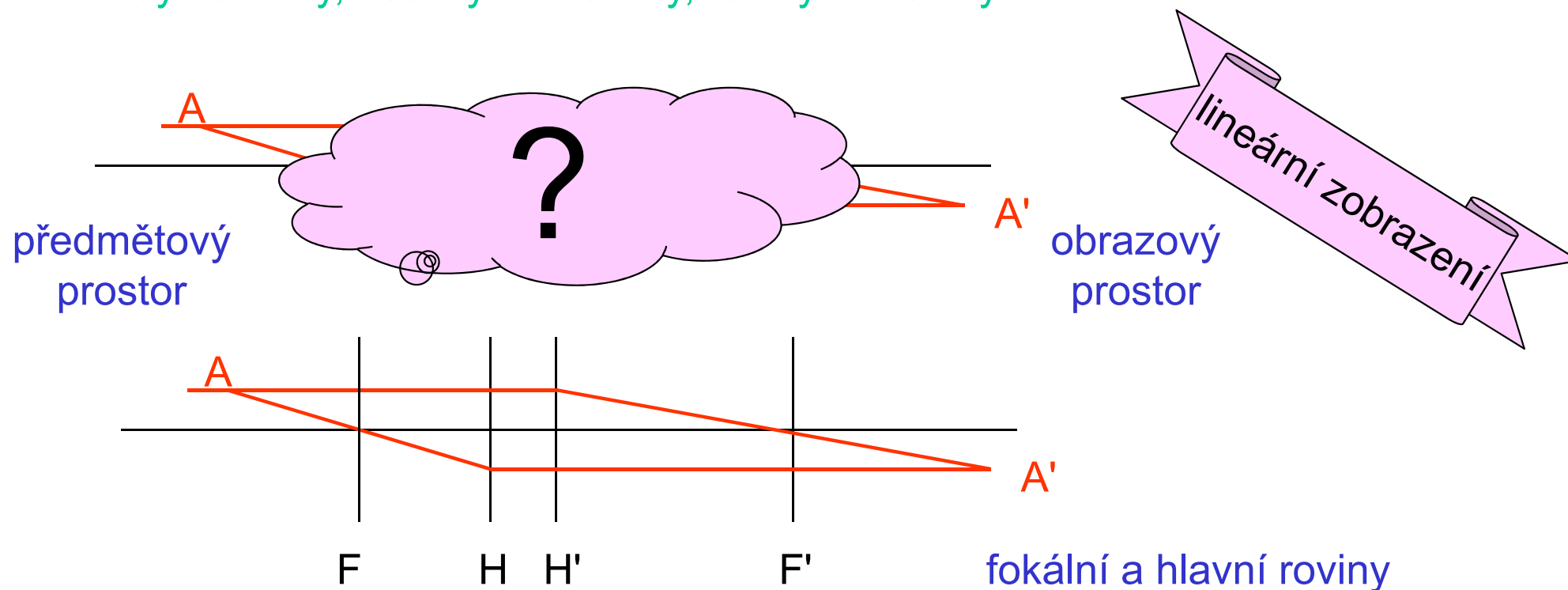
- OSOVĚ SYMETRICKÁ SOUSTAVA ... centrovaná

to byla již r. 1931 idea Rusky a Knolla, od té doby rozpracovávaná

- PARAXIÁLNÍ OBLAST

elektronové svazky jen z úzké oblasti kolem optické osy (*nitkový Gaussův prostor*) ... tam dochází k **ideálnímu zobrazování**:

body na body, úsečky na úsečky, roviny na roviny



# Paraxiální elektronová optika

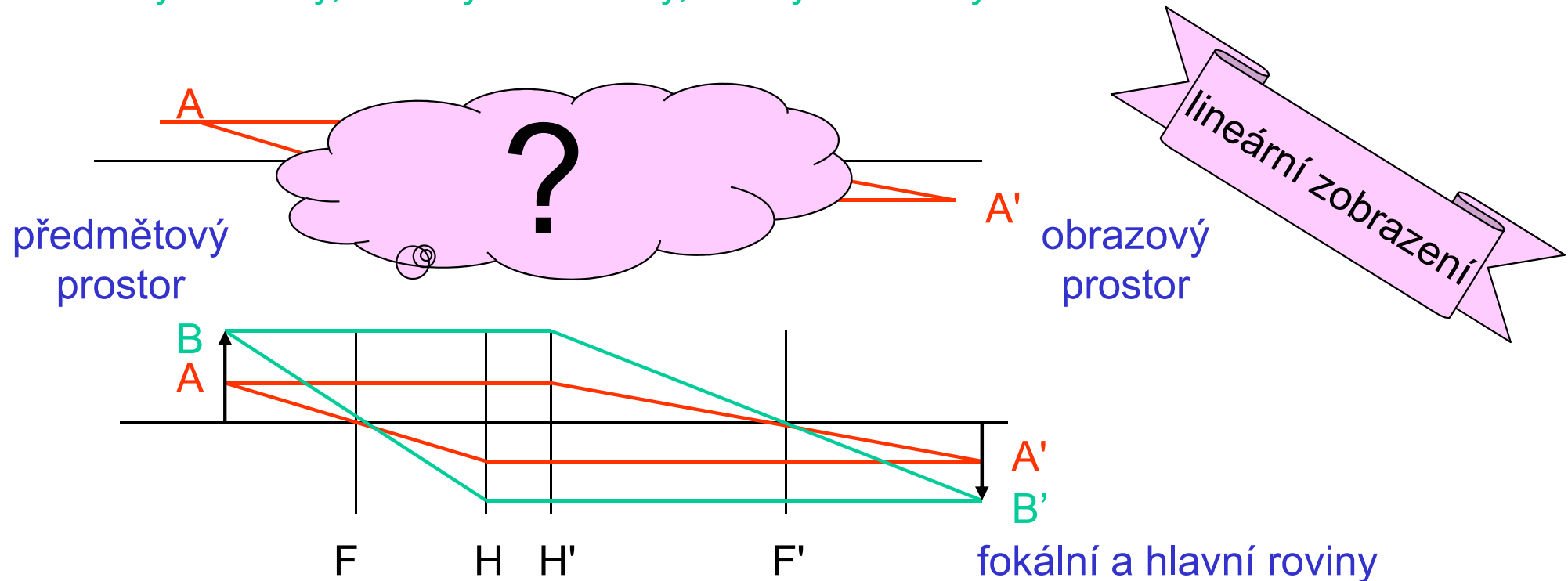
- OSOVĚ SYMETRICKÁ SOUSTAVA ... centovaná

to byla již r. 1931 idea Rusky a Knolla, od té doby rozpracovávaná

- PARAXIÁLNÍ OBLAST

elektronové svazky jen z úzké oblasti kolem optické osy (*nitkový Gaussův prostor*) ... tam dochází k **ideálnímu zobrazování**:

body na body, úsečky na úsečky, roviny na roviny



## Realisace paraxiální oblasti

Kolem optické osy mají elektrony volný průchod  
prostorem bez nábojů

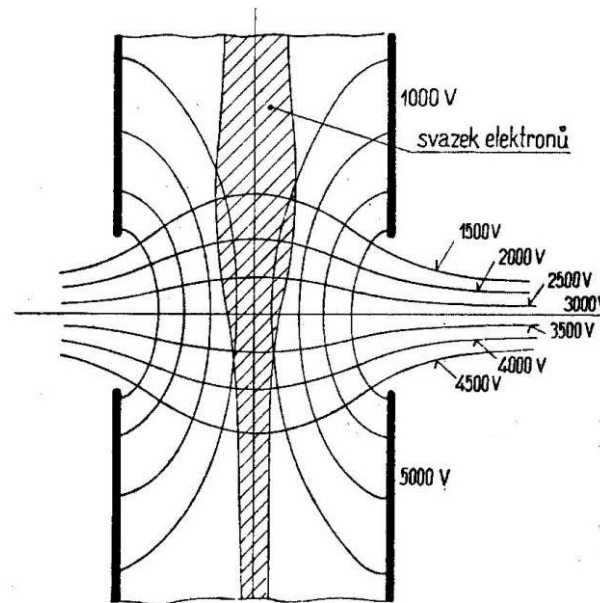
$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$

Laplaceova rovnice



$$\oint d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E} = 0$$

Gaussova věta  
elektrostatiky



Obr. 131. Urychlovací systém.

## Realisace paraxiální oblasti

Kolem optické osy mají elektrony volný průchod  
prostorem bez nábojů

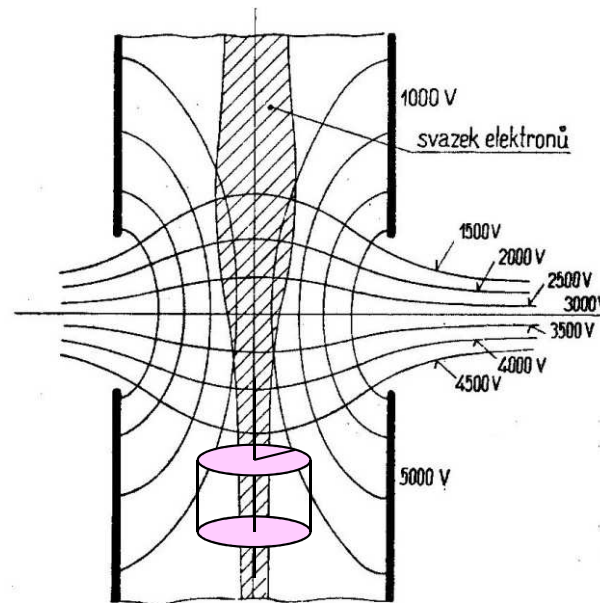
$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$

Laplaceova rovnice



$$\oint d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E} = 0$$

Gaussova věta  
elektrostatiky



Obr. 131. Urychlovací systém.

## Realisace paraxiální oblasti

Kolem optické osy mají elektrony volný průchod  
prostorem bez nábojů

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$

Laplaceova rovnice

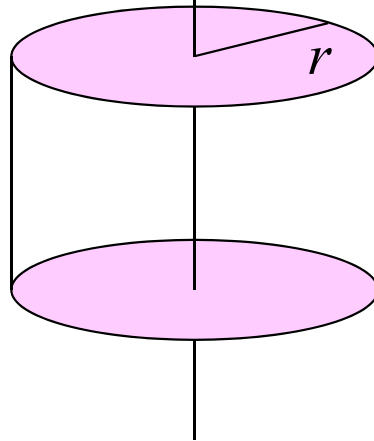


$$\oint d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E} = 0$$

Gaussova věta  
elektrostatiky

tok pláštěm

$$2\pi r d\ell \times E_r$$



$d\ell$

tok podstavami

$$+ \pi r^2 \times \left( E_z + \frac{\partial}{\partial z} E_z \cdot d\ell \right) \\ - \pi r^2 \times E_z$$

# Realisace paraxiální oblasti

Kolem optické osy mají elektrony volný průchod  
prostorem bez nábojů

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$

Laplaceova rovnice

tok pláštěm

$$2\pi r \, d\ell \times E_r$$

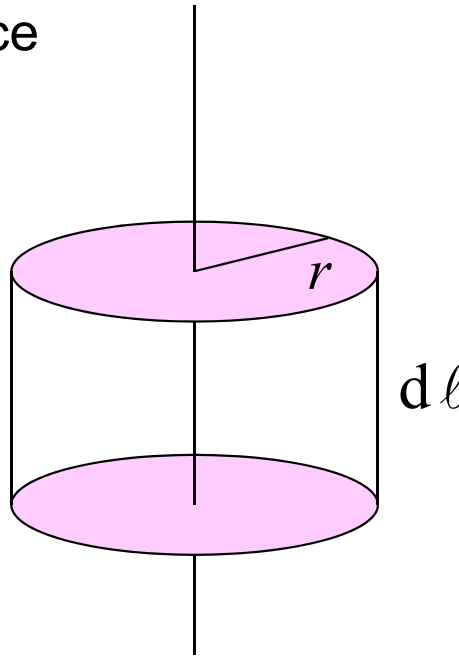


$$\oint d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E} = 0$$

Gaussova věta  
elektrostatiky

tok podstavami

$$+ \pi r^2 \times \left( E_z + \frac{\partial}{\partial z} E_z \cdot d\ell \right) \\ - \pi r^2 \times E_z$$



# Realisace paraxiální oblasti

Kolem optické osy mají elektrony volný průchod  
prostorem bez nábojů

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$

Laplaceova rovnice

tok pláštěm

$$2\pi r \, d\ell \times E_r$$

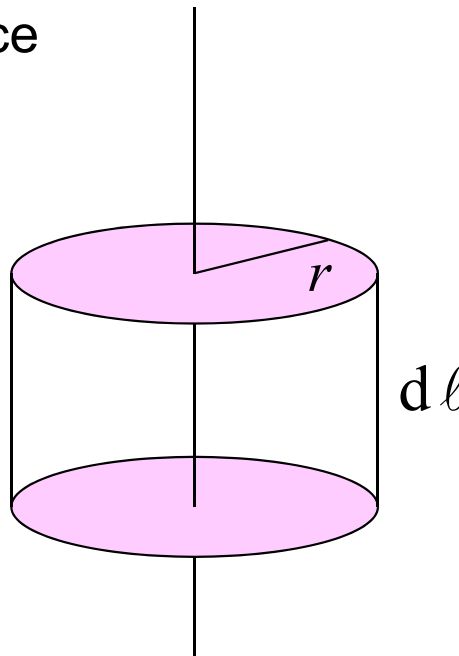


$$\oint d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E} = 0$$

Gaussova věta  
elektrostatiky

tok podstavami

$$+ \pi r^2 \times \left( E_z + \frac{\partial}{\partial z} E_z \cdot d\ell \right) \\ - \pi r^2 \times E_z$$



$$E_r = -\frac{r}{2} \times \frac{\partial}{\partial z} E_z(0, z)$$

lineární závislost na  $r$   
znamená linearitu  
zobrazení



# Realisace paraxiální oblasti

Kolem optické osy mají elektrony volný průchod  
prostorem bez nábojů

$$\Delta\Phi(\mathbf{r}) = 0$$

Laplaceova rovnice

tok pláštěm

$$2\pi r \, d\ell \times E_r$$

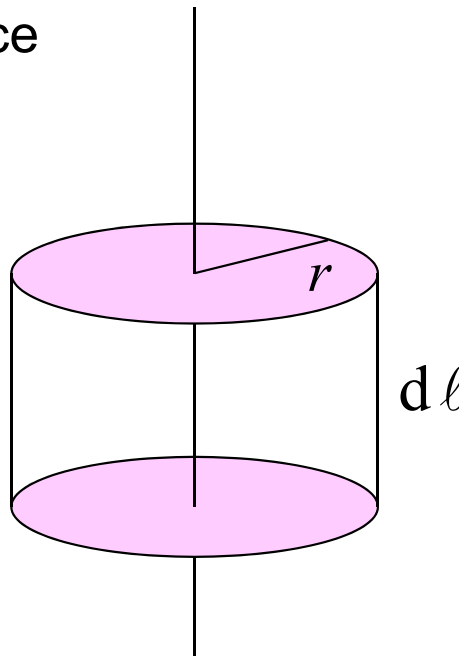


$$\oint d\mathbf{S} \cdot \mathbf{E} = 0$$

Gaussova věta  
elektrostatiky

tok podstavami

$$+ \pi r^2 \times \left( E_z + \frac{\partial}{\partial z} E_z \cdot d\ell \right) - \pi r^2 \times E_z$$



Tato lineární aproximace  
vymezuje  
paraxiální oblast

$$E_r = -\frac{r}{2} \times \frac{\partial}{\partial z} E_z(0, z)$$

lineární závislost na  $r$   
znamená linearitu  
zobrazení

# Paraxiální paprsková rovnice

① Pohybová rovnice

$$\ddot{\mathbf{r}} = \frac{e}{m} \mathbf{E}$$

② Osová symetrie+  
paraxiální aproximace

$$\ddot{z} = \frac{e}{m} E_z(r=0, z(t))$$

$$\ddot{r} = \frac{e}{m} E_r(r(t), z(t))$$

$$\ddot{r} = -\frac{e}{m} \cdot \frac{r}{2} \times \frac{\partial}{\partial z} E_z(0, z)$$

... paraxiálnost  
pole bereme na ose!!  
lineární aproximace!!

# Paraxiální paprsková rovnice

❶ Pohybová rovnice

$$\ddot{\mathbf{r}} = \frac{e}{m} \mathbf{E}$$

❷ Osová symetrie+  
paraxiální aproximace

$$\ddot{z} = \frac{e}{m} E_z(r=0, z(t))$$

$$\ddot{r} = \frac{e}{m} E_r(r(t), z(t))$$

... paraxiálnost  
pole bereme na ose!!  
lineární aproximace!!

❸ Od trajektorie k paprsku

$$\ddot{r} = -\frac{e}{m} \cdot \frac{r}{2} \times \frac{\partial}{\partial z} E_z(0, z)$$

$$\frac{d}{dt} = \frac{d}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} \equiv v(z) \cdot (\dots)' \longrightarrow v(z) \cdot \frac{d}{dz} \left( v(z) \cdot \frac{dr}{dz} \right) + \frac{e}{m} \cdot \frac{r}{2} \times E'_z(0, z) = 0$$

# Paraxiální paprsková rovnice

1 Pohybová rovnice

$$\ddot{\mathbf{r}} = \frac{e}{m} \mathbf{E}$$

2 Osová symetrie+  
paraxiální aproximace

$$\ddot{z} = \frac{e}{m} E_z(r=0, z(t))$$

$$\ddot{r} = \frac{e}{m} E_r(r(t), z(t))$$

... paraxiálnost  
pole bereme na ose!!  
lineární aproximace!!

3 Od trajektorie k paprsku

$$\ddot{r} = -\frac{e}{m} \cdot \frac{r}{2} \times \frac{\partial}{\partial z} E_z(0, z)$$

$$\frac{d}{dt} = \frac{d}{dz} \cdot \frac{dz}{dt} \equiv v(z) \cdot (\dots)' \longrightarrow v(z) \cdot \frac{d}{dz} \left( v(z) \cdot \frac{dr}{dz} \right) + \frac{e}{m} \cdot \frac{r}{2} \times E'_z(0, z) = 0$$

4 Potenciál ke katodě

$$n(\mathbf{r}) \propto v(\mathbf{r}) = \sqrt{\frac{2}{m} (E - U(\mathbf{r}))}$$

$$\equiv \sqrt{-\frac{2e}{m} \Phi(\mathbf{r})}$$

$$\Phi \cdot r'' + \frac{1}{2} \Phi' \cdot r' + \frac{1}{4} \Phi'' \cdot r = 0$$

vstup

$$\Phi(z) \longrightarrow r(z)$$

výstup

PARAXIÁLNÍ ROVNICE

*Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení*

PARAXIÁLNÍ ROVNICE

$$\Phi \cdot r'' + \frac{1}{2} \Phi' \cdot r' + \frac{1}{4} \Phi'' \cdot r = 0$$

vstup  $\Phi(z)$   $\longrightarrow$   $r(z)$  výstup

## Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení

### PARAXIÁLNÍ ROVNICE

$$\Phi \cdot r'' + \frac{1}{2} \Phi' \cdot r' + \frac{1}{4} \Phi'' \cdot r = 0$$

**vstup**  $\Phi(z)$   $\longrightarrow$   $r(z)$  **výstup**

Tvar paprsku v elektrostatické čočce  
**nezávisí**  
na náboji ani hmotnosti částice  
*vlnová délka, energie atp. je ovšem něco jiného*

## Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení

### PARAXIÁLNÍ ROVNICE

$$\Phi \cdot r'' + \frac{1}{2} \Phi' \cdot r' + \frac{1}{4} \Phi'' \cdot r = 0$$

$$\boxed{\text{vstup}} \quad \Phi(z) \quad \longrightarrow \quad r(z) \quad \boxed{\text{výstup}}$$

### SROVNÁNÍ OPTICKÝCH SOUSTAV

#### elektronová

- spojitý index lomu
- určující: pouze průběh indexu lomu na ose. Flexibilita v průběhu elast. polí je tak jen zdánlivá výhoda, pokud ...

#### světelná

- po částech konstantní index lomu
- hodnoty indexu lomu a poloměry křivosti oddělujících optických ploch nezávisle volitelné parametry

## Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení

### PARAXIÁLNÍ ROVNICE

$$\Phi \cdot r'' + \frac{1}{2} \Phi' \cdot r' + \frac{1}{4} \Phi'' \cdot r = 0$$

$$\boxed{\text{vstup}} \quad \Phi(z) \quad \longrightarrow \quad r(z) \quad \boxed{\text{výstup}}$$

### SROVNÁNÍ OPTICKÝCH SOUSTAV

#### elektronová

- spojitý index lomu
- určující: pouze průběh indexu lomu na ose. Flexibilita v průběhu elst. polí je tak jen zdánlivá výhoda, pokud ... nepřekonáme Gaussovu větu elst.

#### světelná

- po částech konstantní index lomu
- hodnoty indexu lomu a poloměry křivosti oddělujících optických ploch nezávisle volitelné parametry



## Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení

### PARAXIÁLNÍ ROVNICE

$$\Phi \cdot r'' + \frac{1}{2} \Phi' \cdot r' + \frac{1}{4} \Phi'' \cdot r = 0$$

$$\boxed{\text{vstup}} \quad \Phi(z) \quad \longrightarrow \quad r(z) \quad \boxed{\text{výstup}}$$

### SROVNÁNÍ OPTICKÝCH SOUSTAV

#### elektronová

- spojitý index lomu
- určující: pouze průběh indexu lomu na ose. Flexibilita v průběhu elst. polí je tak jen zdánlivá výhoda, pokud ...  
**nepřekonáme Gaussovu větu elst.**

#### světelná

- po částech konstantní index lomu
- hodnoty indexu lomu a poloměry křivosti oddělujících optických ploch nezávisle volitelné parametry

## Paraxiální rovnice: vlastnosti paraxiálního zobrazení

### PARAXIÁLNÍ ROVNICE

$$\Phi \cdot r'' + \frac{1}{2} \Phi' \cdot r' + \frac{1}{4} \Phi'' \cdot r = 0$$

$$\boxed{\text{vstup}} \quad \Phi(z) \quad \longrightarrow \quad r(z) \quad \boxed{\text{výstup}}$$

### SROVNÁNÍ OPTICKÝCH SOUSTAV

#### elektronová

- spojitý index lomu
- určující: pouze průběh indexu lomu na ose. Flexibilita v průběhu elst. polí je tak jen zdánlivá výhoda, pokud ... nepřekonáme **Gaussovou větu elst.**

#### Dva důsledky

1. elektronové čočky jsou vždy spojky
2. otvorová vada vždy kladná **Scherzerova věta 1936**

#### světelná

- po částech konstantní index lomu
- hodnoty indexu lomu a poloměry křivosti oddělujících optických ploch nezávisle volitelné parametry

# Elektronové čočky jsou vždy spojky

Substituce v paraxiální rovnici

$$r = R\Phi^{-\frac{1}{4}}$$

$$R'' = -\frac{3}{16} \left( \frac{\Phi'}{\Phi} \right)^2 R$$

$$|e\Phi(\mathbf{r})| = E - U(\mathbf{r})$$

1.  $R$  je konkávní, obrací se vždy **k ose**  $\Rightarrow$

libovolný systém, kde pole  $\Phi'$  je nenulové jen v konečné oblasti se chová jako spojka

2. Optická mohutnost závisí jen na poměru  $\Phi'/\Phi$

3. Pro rychlé elektrony je proto malá

# Elektronové čočky jsou vždy spojky

Substituce v paraxiální rovnici

$$r = R\Phi^{-\frac{1}{4}}$$

$$R'' = -\frac{3}{16}\left(\frac{\Phi'}{\Phi}\right)^2 R$$

$$|e\Phi(\mathbf{r})| = E - U(\mathbf{r})$$

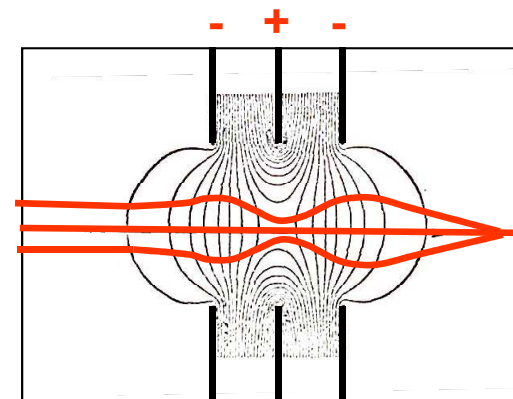
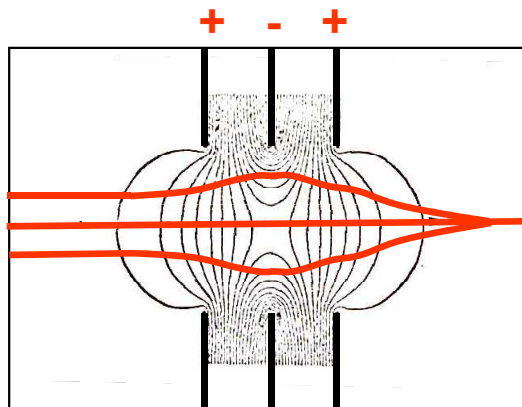
1.  $R$  je konkávní, obrací se vždy **k ose**  $\Rightarrow$

libovolný systém, kde pole  $\Phi'$  je nenulové jen v konečné oblasti se chová jako spojka

2. Optická mohutnost závisí jen na poměru  $\Phi'/\Phi$

3. Pro rychlé elektrony je proto malá

4. Ve skutečnosti závisí na  $(\Phi'/\Phi)^2$ .  $R$  je proto stejné pro obojí polaritu. Samotné trajektorie jsou ovšem různé; ohnisko však zůstává.

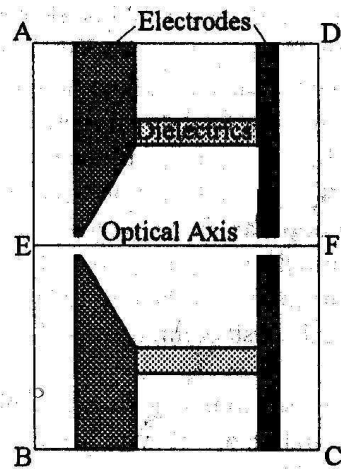


## *Ukázky skutečných výpočtů*

Kvalita současného zpracování je plně profesionální.

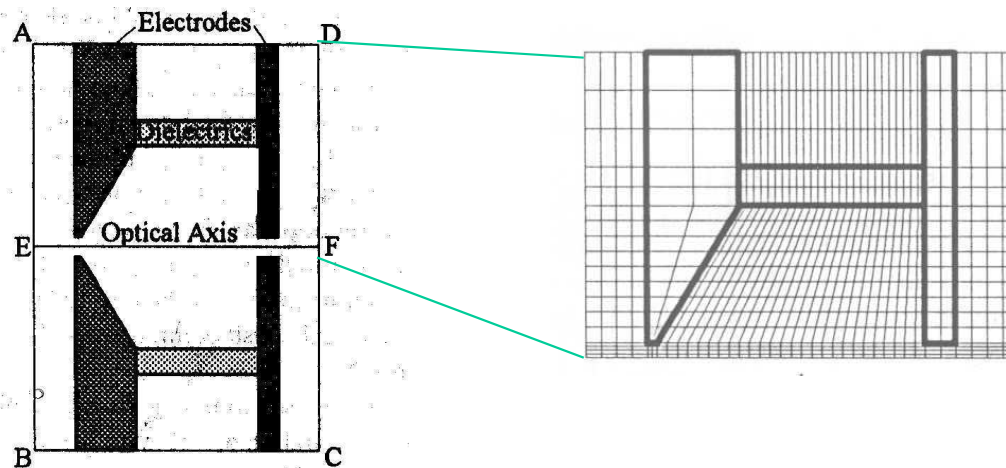
Výpočty tohoto typu zrychlují o řády konstrukční práce.

# Ukázka výpočtu elektrostatické čočky



design čočky

# Ukázka výpočtu elektrostatické čočky

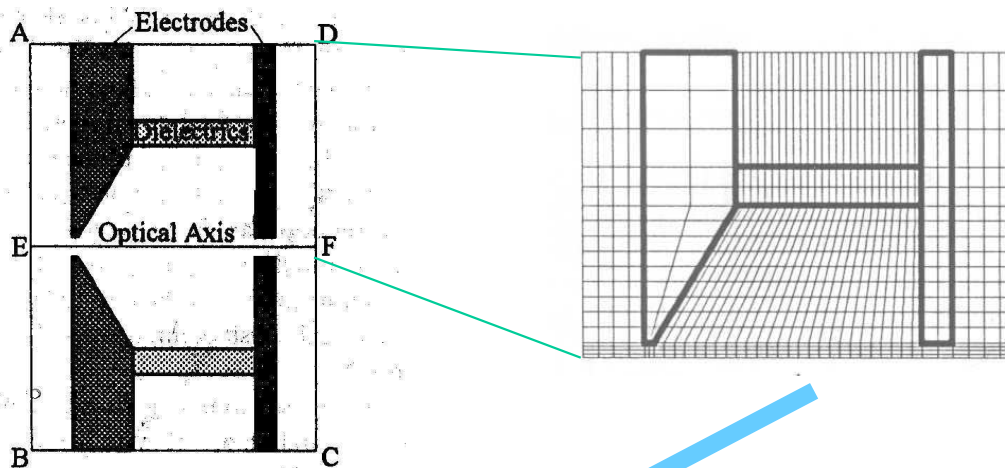


design čočky

grid pro výpočet metodou  
konečných elementů:

velké oblasti,  
jemné dělení

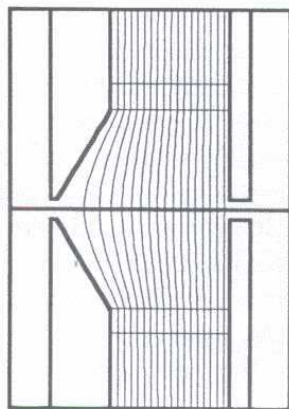
# Ukázka výpočtu elektrostatické čočky



design čočky

grid pro výpočet metodou  
konečných elementů:  
velké oblasti,  
jemné dělení

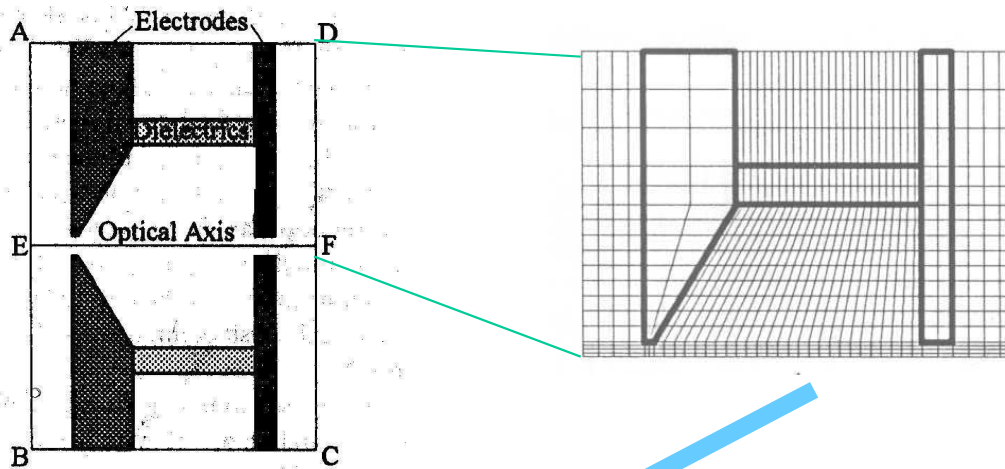
výsledný  
potenciál



a



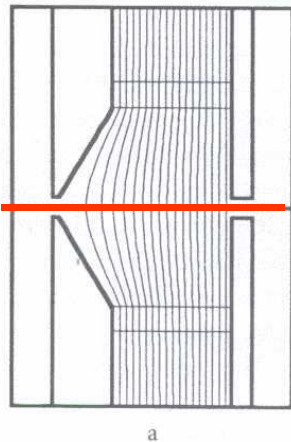
# Ukázka výpočtu elektrostatické čočky



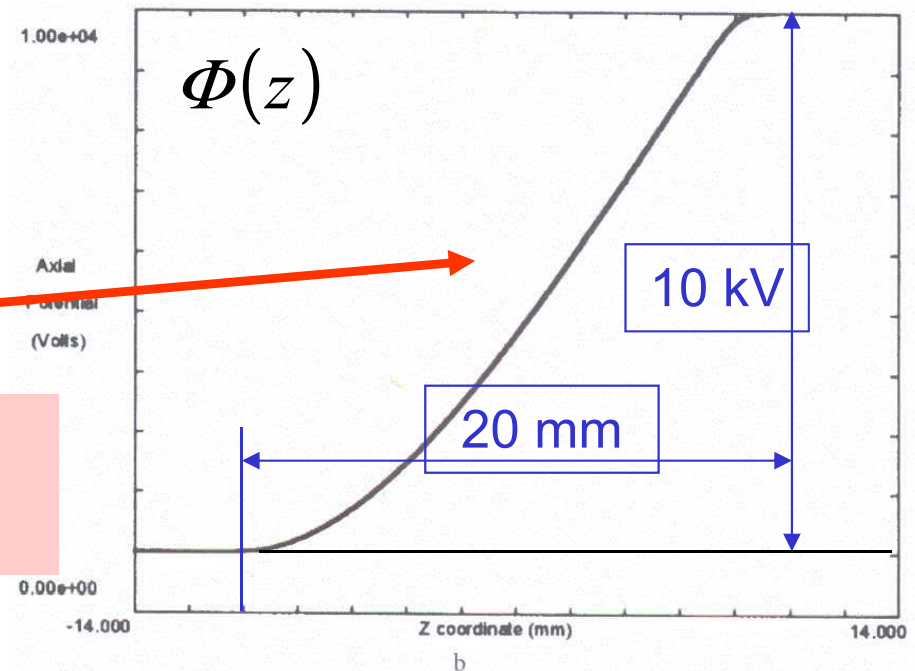
design čočky

grid pro výpočet metodou konečných elementů:  
velké oblasti,  
jemné dělení

výsledný potenciál

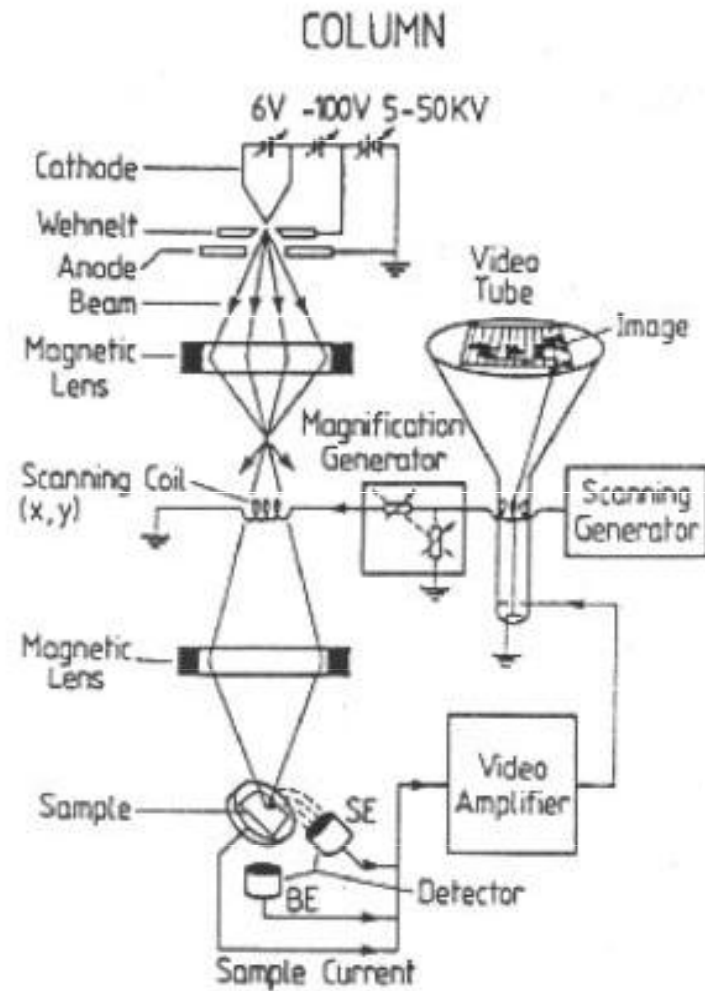


axiální průběh  
potenciálu



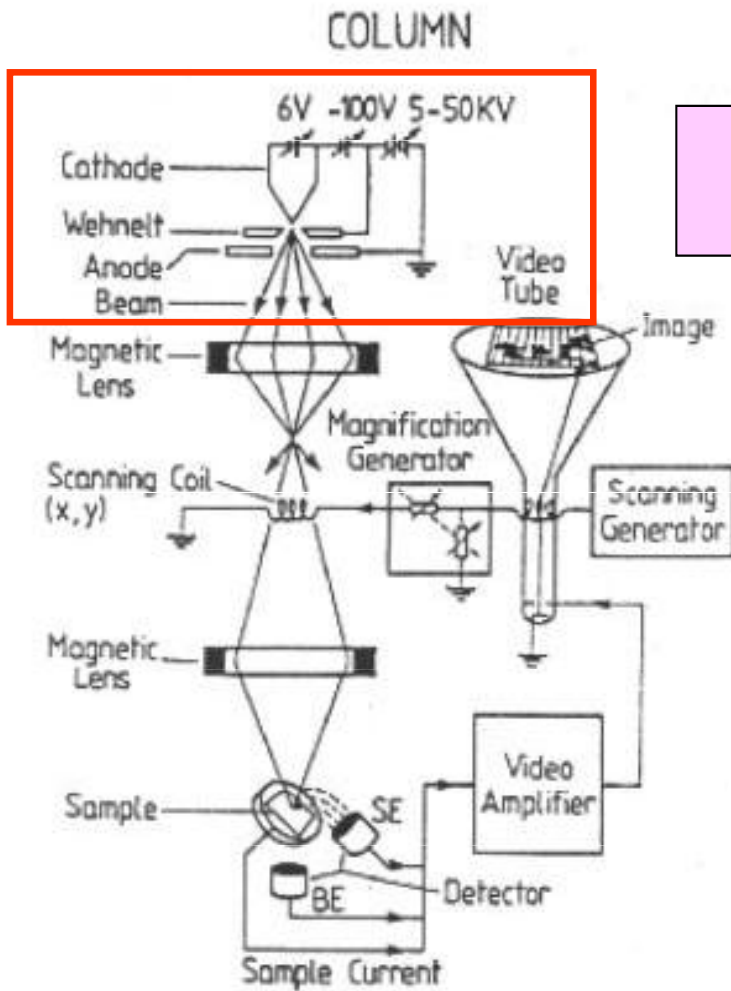
# Termoemisní zdroj $LaB_6$

řádkovací elektronový mikroskop  
(SEM .. scanning electron microscope)



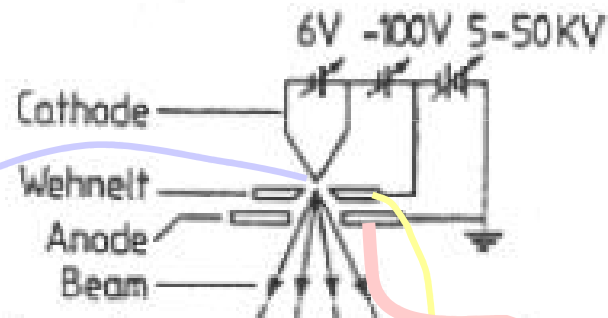
# Termoemisní zdroj $LaB_6$

řádkovací elektronový mikroskop  
(SEM .. scanning electron microscope)

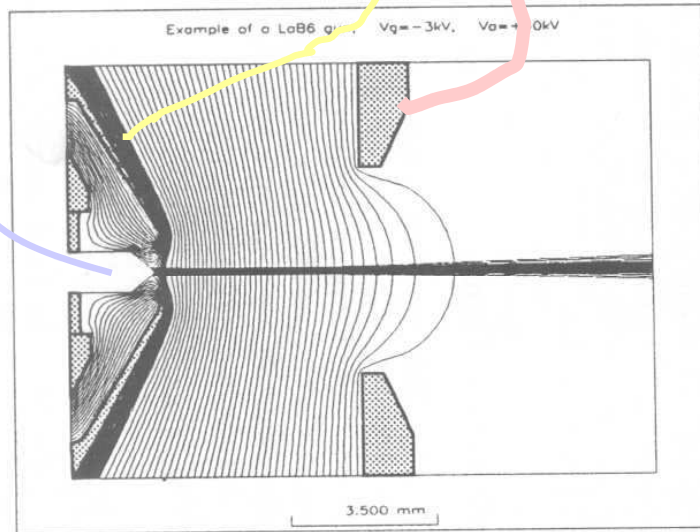


výsek ze schematu SEM

# Termoemisní zdroj $\text{LaB}_6$



výsek ze schematu SEM



a

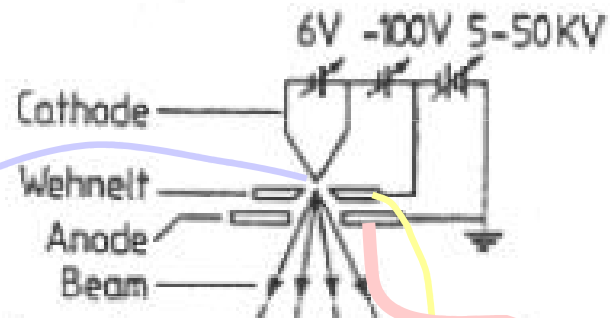
FIGURE 73  $\text{LaB}_6$  gun. (a) Overall view. (b) Enlarg

Monokrystal  $\text{LaB}_6$   
("Lab six")

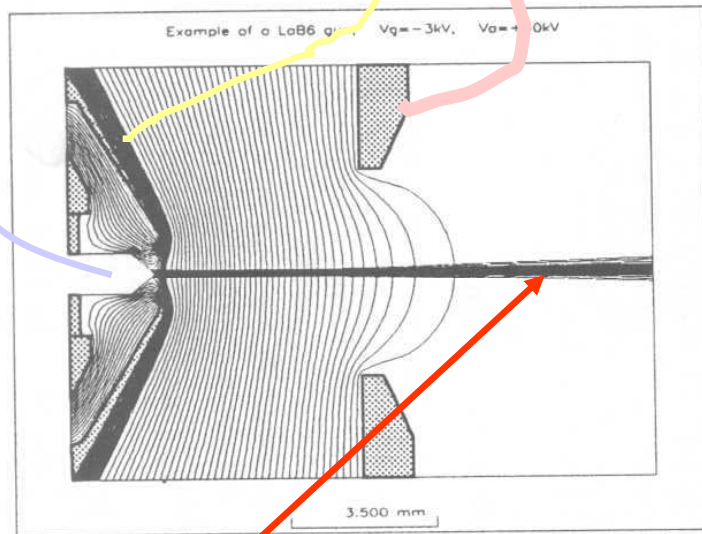
zespodu ohříváný žhaveným  
wolframovým vláknem

jeho emisní schopnost je  
tisíckrát vyšší  
než má wolfram sám

# Termoemisní zdroj $\text{LaB}_6$



výsek ze schematu SEM

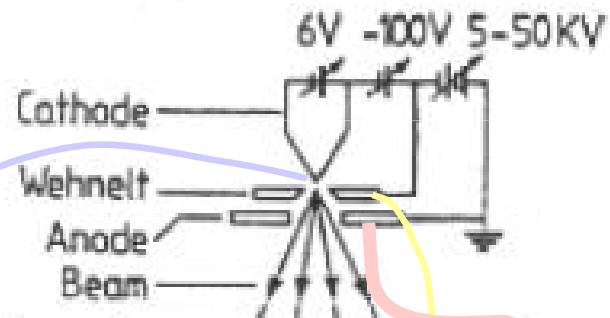


a

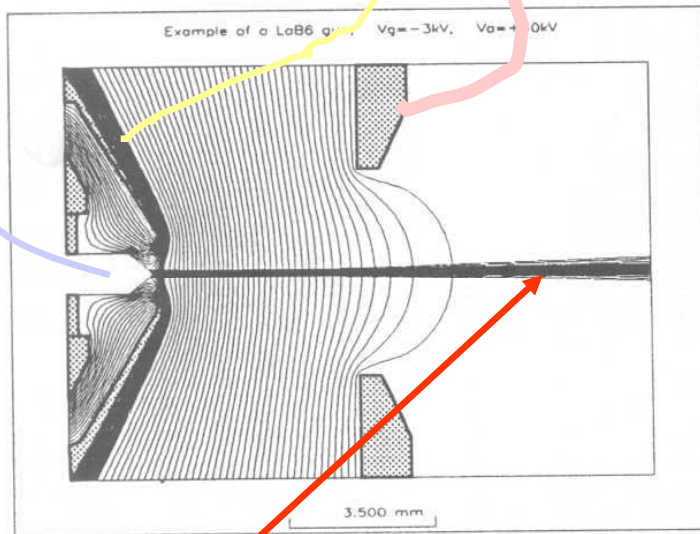
FIGURE 73  $\text{LaB}_6$  gun. (a) Overall view. (b) Enlarged view of tip region.

trajektorie

# Termoemisní zdroj $\text{LaB}_6$



výsek ze schematu SEM

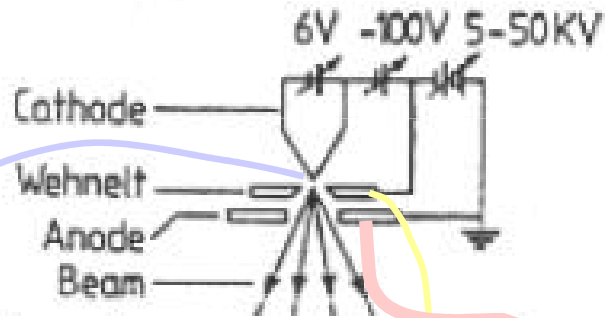


a

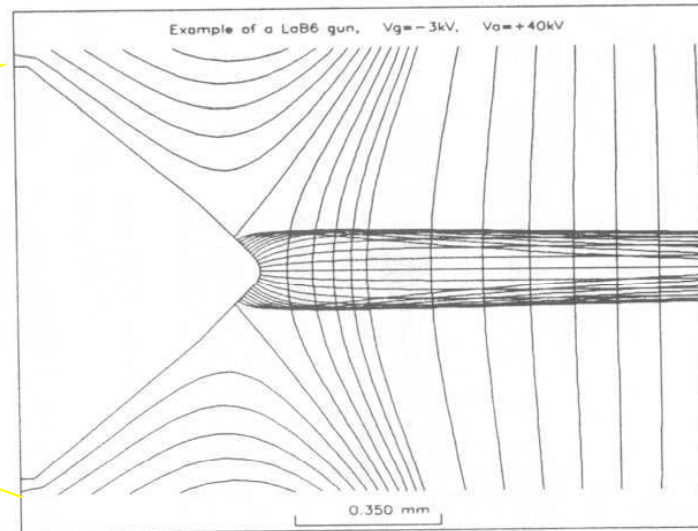
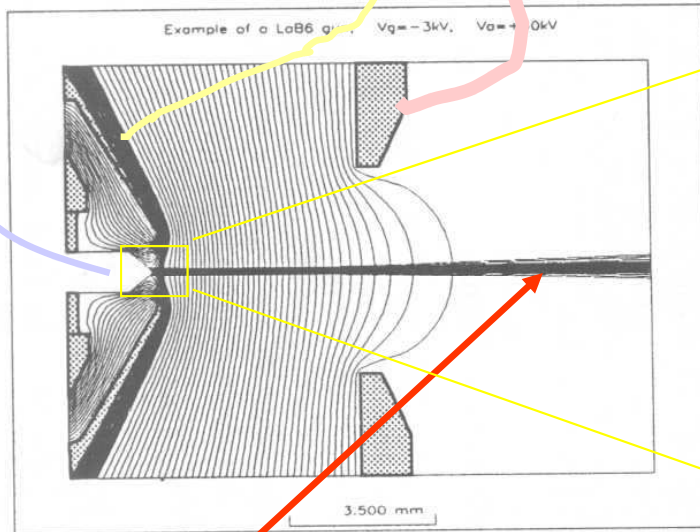
FIGURE 73  $\text{LaB}_6$  gun. (a) Overall view. (b) Enlarged view of tip region.

trajektorie

# Termoemisní zdroj $\text{LaB}_6$



výsek ze schematu SEM



a

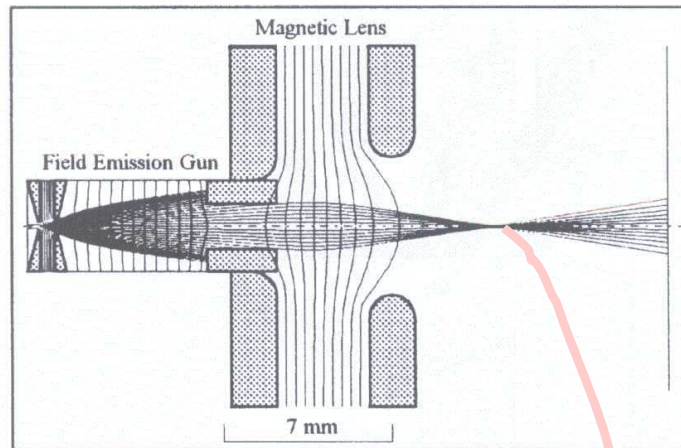
FIGURE 73  $\text{LaB}_6$  gun. (a) Overall view

detail

trajektorie

## TFE zdroj

TFE (thermofield emission) kombinuje termickou emisi ...  $T=1800\text{ K}$   
se studenou emisí vyvolanou polem řádu  $10\text{ keV}$



kombinace elst. zdroje a  
magnetické čočky

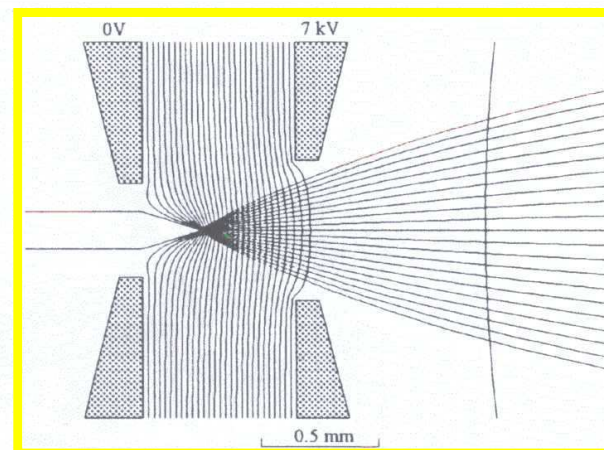
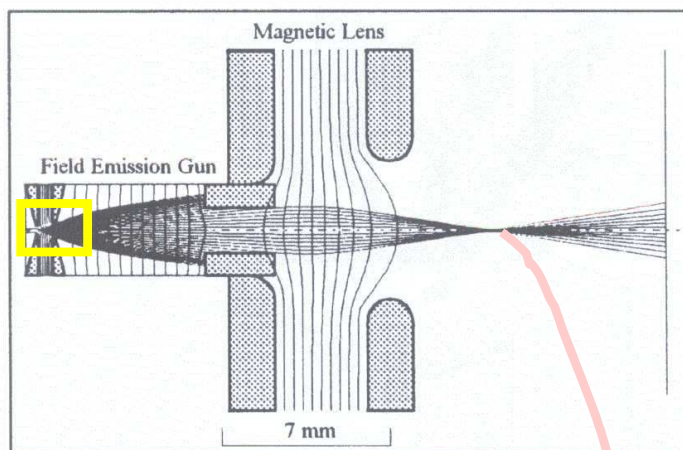
a magnetic lens.

toto je téměř bodový zdroj  
kolimovaných elektronů



# TFE zdroj

TFE (thermofield emission) kombinuje termickou emisi ...  $T=1800\text{ K}$   
se studenou emisí vyvolanou polem řádu  $10\text{ keV}$



kombinace elst. zdroje a  
magnetické čočky

detail

toto je téměř bodový zdroj  
kolimovaných elektronů

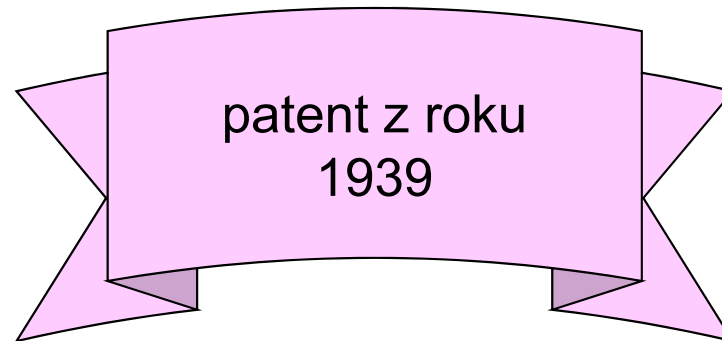
## *Magnetické čočky*

Magnetické čočky a jiné součásti převládají v  
praxi.

Jejich pochopení je ale obtížnější.  
Zde jen několik poznámek.

## Magnetická čočka

- má širší použití, než elektrostatická
- přesnější konstrukce, lepší korekce optických vad
- musí se ovšem chladit, atd.
- hlavní výhoda je možnost pólových nástavců z měkkých magnetických materiálů
- to právě vymysleli již praotcové Ruska a Knoll ... *Ernst Ruska* NP 1986



# Magnetická čočka

DEUTSCHES REICH



AUSGEBEN AM  
25. AUGUST 1939

REICHSPATENTAMT  
PATENTSCHRIFT

№ 680 284

KLASSE 21g GRUPPE 25 37/20

*B 154916 VIII c/21 g*

---

Dr.-Ing. Bodo von Borries in Berlin-Halensee  
und Dr.-Ing. Ernst Ruska in Berlin-Zehlendorf  
Magnetische Sammellinse kurzer Feldlänge

Patentiert im Deutschen Reiche vom 17. März 1932 ab  
Patenterteilung bekanntgemacht am 3. August 1939

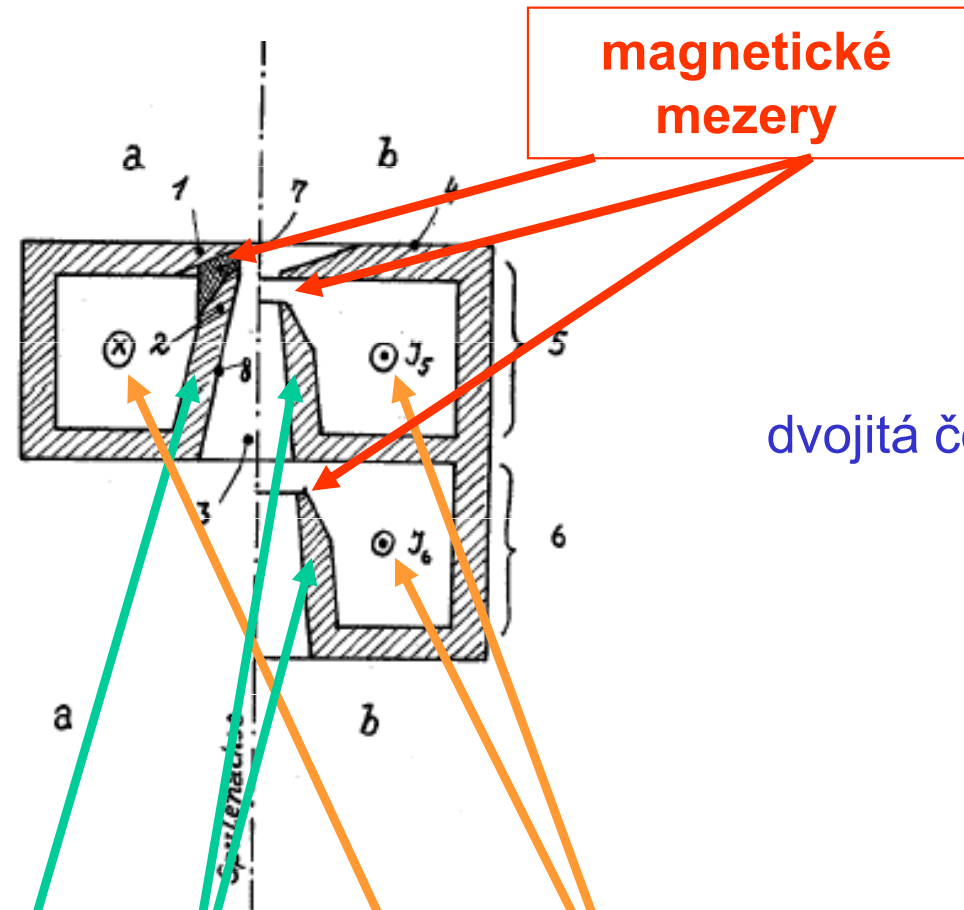
## Magnetická čočka

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine magnetische Linse extrem kurzer Brennweite zu schaffen, deren Feld trotz seiner Stärke (kleine Brennweite) dennoch in axialer Richtung so kurz wie möglich ist. Diese Aufgabe wird mit Hilfe einer Sammellinse gelöst, die aus einer Sammelspule besteht, die in einen sie vollständig umgebenden, aus hochpermeablem Stoff bestehenden Mantel eingehüllt ist, der einen ringförmigen Spalt in seinem Innenteil aufweist. Gemäß der Erfindung sind die die Ränder des im Verhältnis zur Längsausdehnung der Spule schmalen Spaltes bildenden Mantelteile nach der Achse zu polschuhartig verjüngt, und die lichte Weite des Polschuhringes liegt in der Größenordnung der Spalthöhe. Es ist zweckmäßig, die Spalthöhe nahezu gleich dem Halbmesser der lichten Weite der Polschuhrinne zu machen.

Vynález se zakládá na úloze vytvořit magnetickou čočku s extrémně krátkou ohniskovou vzdáleností, jejíž pole přes svou intenzitu (krátkou ohniskovou vzdálenost) je v axiálním směru co možno nejkratší.

# Magnetická čočka (Ruskýv náčrtek)

jednoduchá  
čočka



dvojitá čočka

pólové  
nástavce

cívky

## *Magnetická čočka: jak funguje*

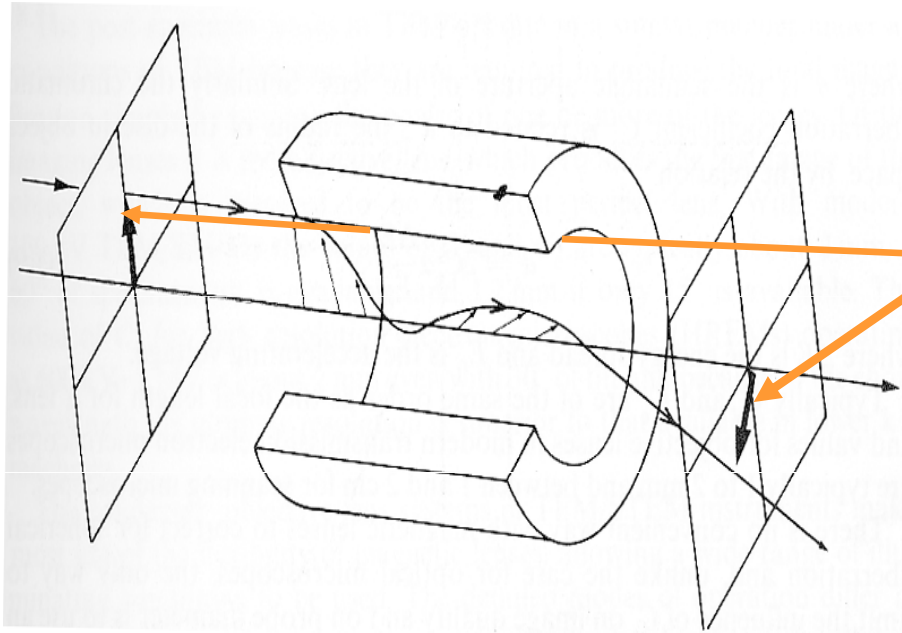
$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow B_r = -\frac{r}{2} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{r}{2} \cdot B'_z$$

paraxiální oblast

# Magnetická čočka: jak funguje

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow B_r = -\frac{r}{2} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{r}{2} \cdot B'_z$$

paraxiální oblast



paprsek v paraxiální oblasti

- rovina pohybu se otáčí  
nezávisle na průvodiči  $r$

$$\dot{\phi} = \frac{e}{2m} B_z(z)$$



# Magnetická čočka: jak funguje

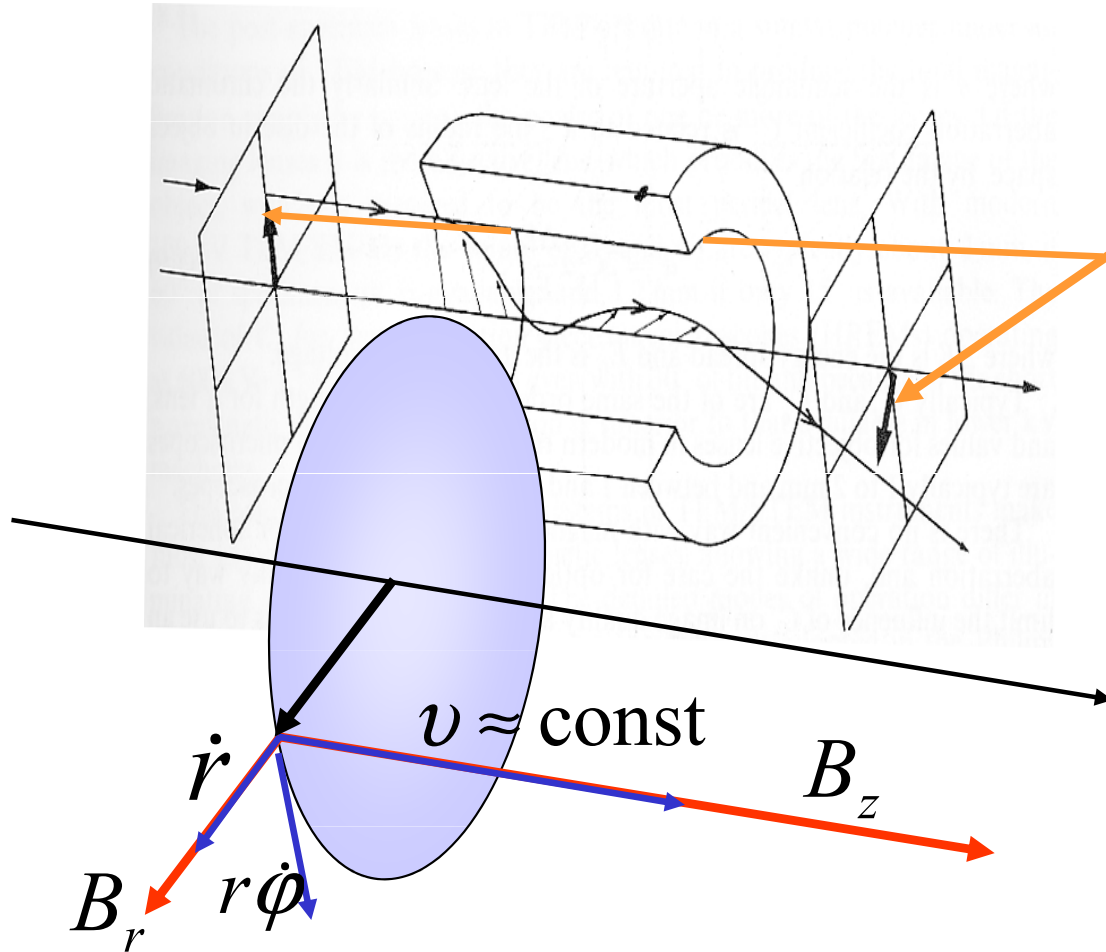
$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow B_r = -\frac{r}{2} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{r}{2} \cdot B'_z$$

paraxiální oblast

paprsek v paraxiální oblasti

- rovina pohybu se otáčí  
nezávisle na průvodiči  $r$

$$\dot{\phi} = \frac{e}{2m} B_z(z)$$



# Magnetická čočka: jak funguje

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow B_r = -\frac{r}{2} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{r}{2} \cdot B'_z$$

paraxiální oblast

## paprsek v paraxiální oblasti

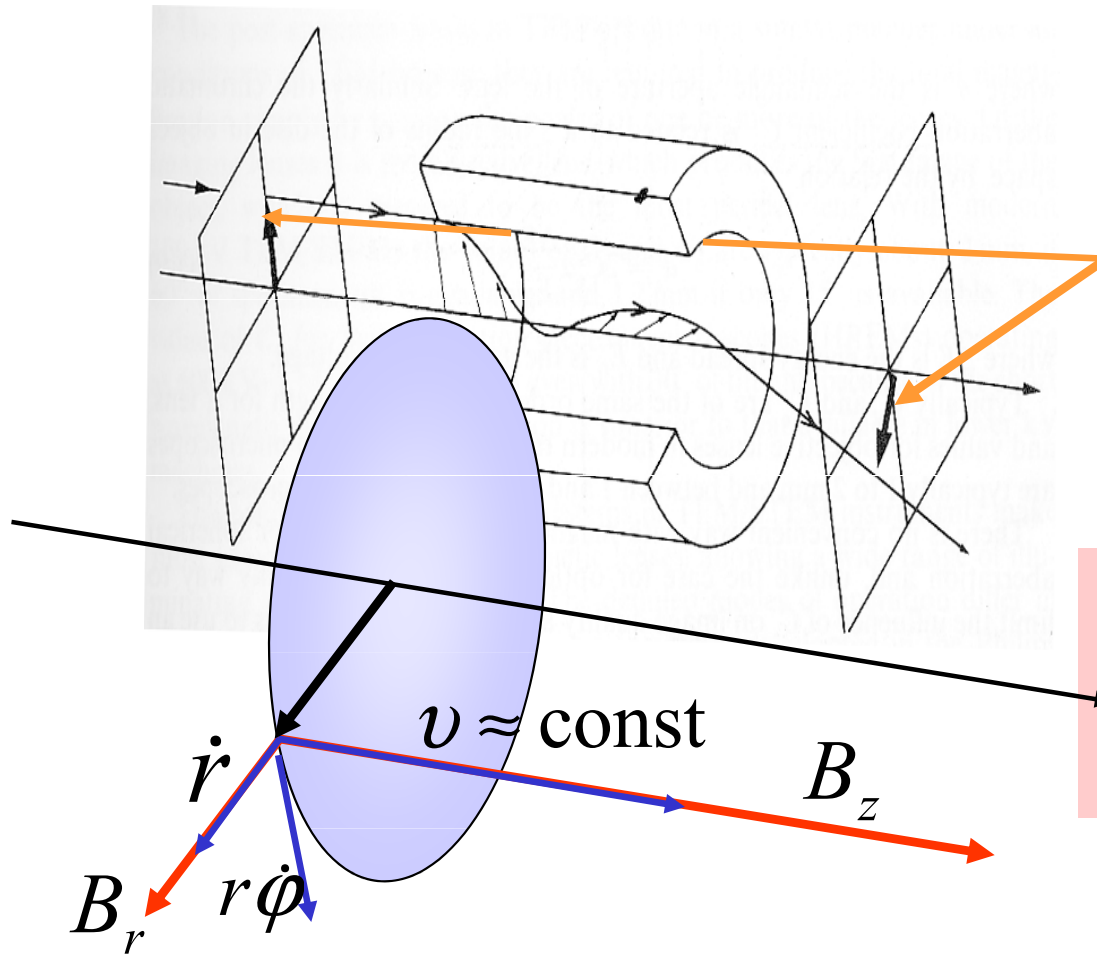
- rovina pohybu se otáčí  
nezávisle na průvodiči  $r$

$$\dot{\phi} = \frac{e}{2m} B_z(z)$$

- to ovlivní radiální pohyb

$$r'' + \left( \frac{e}{2m} \cdot \frac{B_z(z)}{v(z)} \right)^2 \times r = 0$$

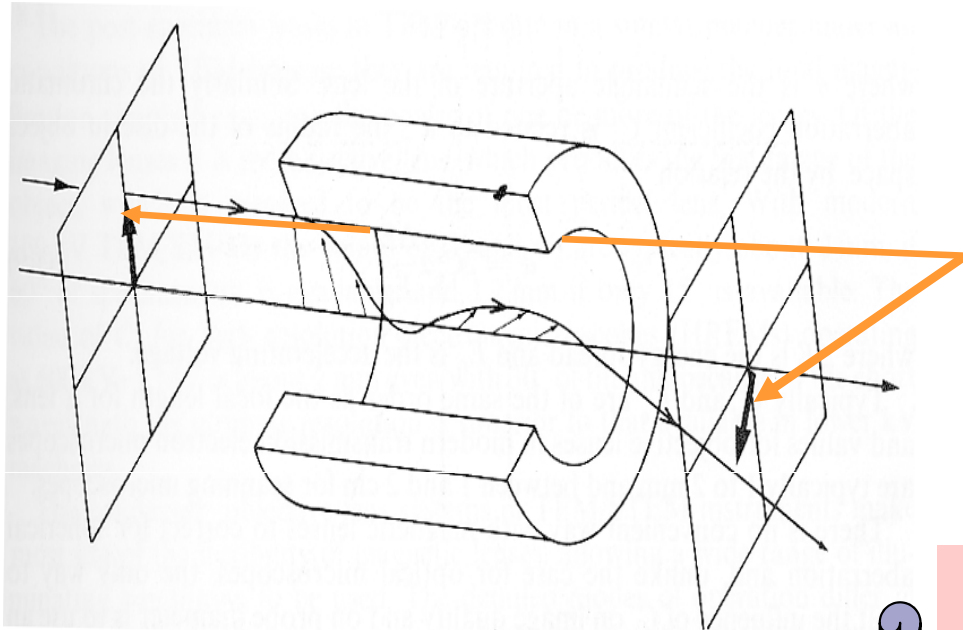
PARAXIÁLNÍ ROVNICE PAPRSKU



# Magnetická čočka: jak funguje

$$\operatorname{div} \mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow B_r = -\frac{r}{2} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial z} = -\frac{r}{2} \cdot B'_z$$

paraxiální oblast



paprsek v paraxiální oblasti

- rovina pohybu se otáčí  
nezávisle na průvodiči  $r$

$$\dot{\phi} = \frac{e}{2m} B_z(z)$$

- to ovlivní radiální pohyb

$$r'' + \left( \frac{e}{2m} \cdot \frac{B_z(z)}{v(z)} \right)^2 \times r = 0$$

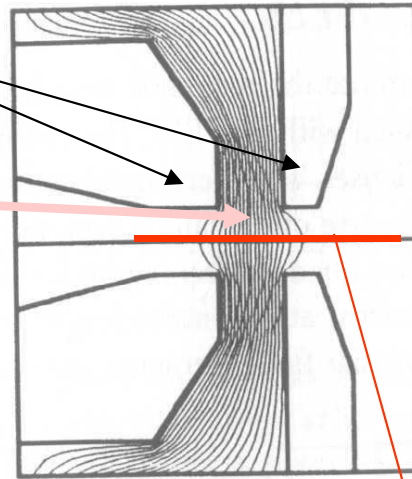
PARAXIÁLNÍ ROVNICE PAPRSKU

- I v magn. čočce vždy dochází k fokusaci
- Rozhoduje jen osový průběh podélné složky pole
- Pro rychlé elektrony je lámavá síla menší
- Obrazový prostor se potočí jako celek, věrnost zobrazení není narušena

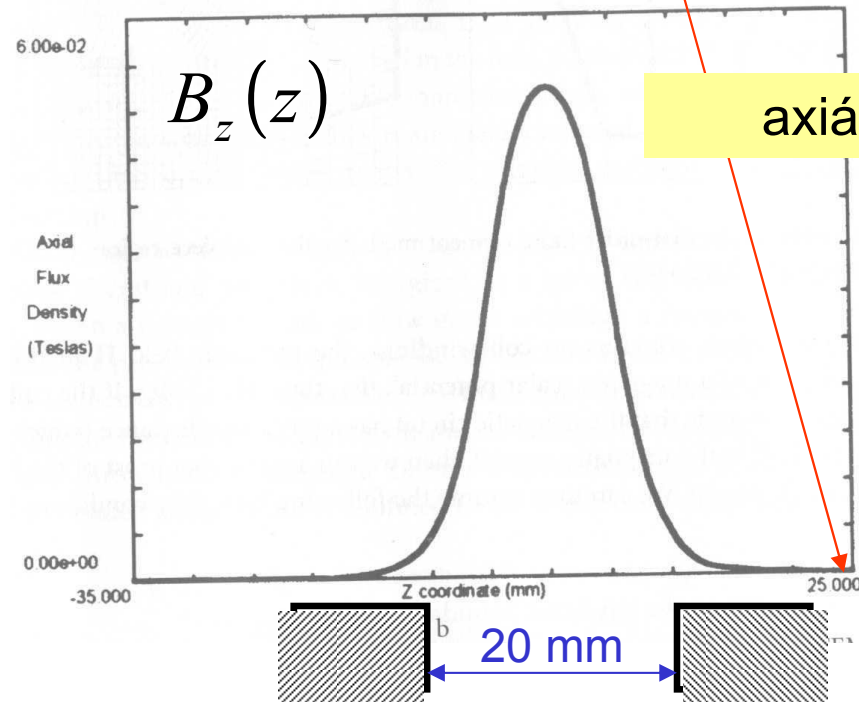
# Moderní magnetická čočka

nástavce

pole v dutině



a



axiální průběh pole

## *Mez rozlišení pro elektronový mikroskop*

... také  
elektronový mikroskop strádá  
vadami optického zobrazení,  
dokonce hůře, než světelné přístroje

## *Scherzerova věta (1936)*

Otto Scherzer  
(Mar. 9, 1909 -  
Nov. 15, 1982)



V elektronově optické soustavě, kde

- ❖ pohyb elektronů je řízen elektromagnetickými poli
- ❖ tato pole jsou statická
- ❖ a mají osovou symetrii
- ❖ v paprskovém prostoru nejsou prostorové náboje

trpí zobrazení jak **chromatickou**  
tak kladnou **sférickou aberací**

# Chromatická a otvorová vada elektronové čočky

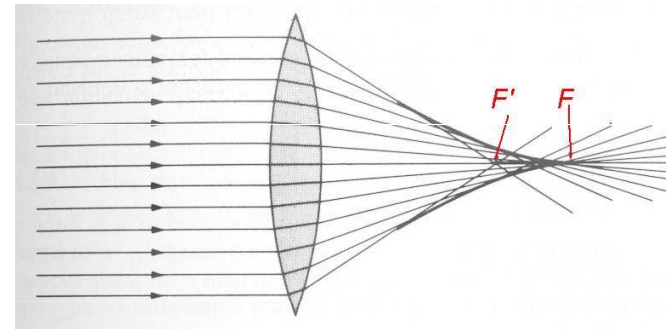
- Elektronová optika ... tytéž vady zobrazení, jako světelná **astigmatismus, koma ...**
- V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně

vada chromatická

vada sférická (otvorová)

**Podstata** rychlejší elektrony se zalomí méně ... analogie červeného světla

**Podstata** paprsky dále od osy se zalomí více ... vzniká kaustická plocha



# Vady zobrazení elektronové čočky: chromatická vada

- Elektronová optika ... tytéž vady zobrazení, jako světelná **astigmatismus, koma ...**
- V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně

vada chromatická

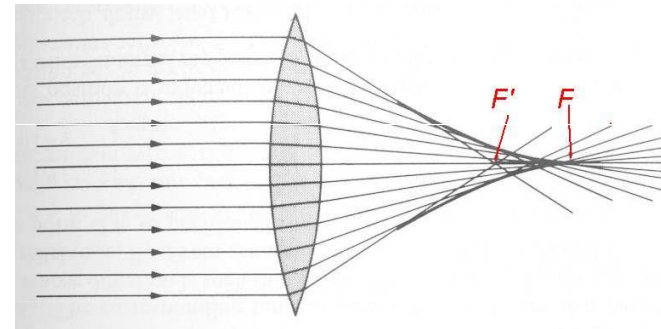
vada sférická (otvorová)

**Podstata** rychlejší elektrony se zalomí méně ... analogie červeného světla

**Podstata** paprsky dále od osy se zalomí více ... vzniká kaustická plocha

## Odpomoc

- kvalitní monochromatický zdroj elektronů ... studená emise
- použití zkřížených Wienových filtrů ( o těch viz přednáška VI)





# Vady zobrazení elektronové čočky: otvorová vada

- Elektronová optika ... tytéž vady zobrazení, jako světelná **astigmatismus, koma ...**
- V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně

vada chromatická

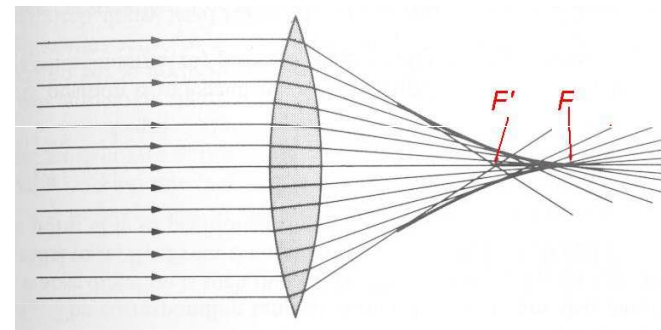
vada sférická (otvorová)

**Podstata** rychlejší elektrony se zalomí méně ... analogie červeného světla

**Podstata** paprsky dále od osy se zalomí více ... vzniká kaustická plocha

## Odpomoc

- kvalitní monochromatický zdroj elektronů ... studená emise
- použití zkřížených Wienových filtrů ( o těch viz přednáška VI)



Otvorová vada v elektronové optice je **neodstranitelná**

**viník:** Gaussova věta elektrostatiky, nedovolí korekce indexu lomu

# Vady zobrazení elektronové čočky: otvorová vada

- Elektronová optika ... tytéž vady zobrazení, jako světelná **astigmatismus, koma ...**
- V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně

vada chromatická

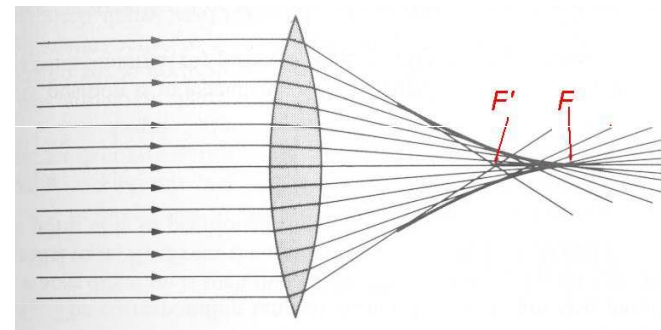
vada sférická (otvorová)

**Podstata** rychlejší elektrony se zalomí méně ... analogie červeného světla

**Podstata** paprsky dále od osy se zalomí více ... vzniká kaustická plocha

## Odpomoc

- kvalitní monochromatický zdroj elektronů ... studená emise
- použití zkřížených Wienových filtrů (o těch viz přednáška VI)



**Odpomoc z nouze** vyclonit dostatečně úzký svazek

Otvorová vada v elektronové optice je **neodstranitelná**

**viník:** Gaussova věta elektrostatiky, nedovolí korekce indexu lomu

# Vady zobrazení elektronové čočky: otvorová vada

- Elektronová optika ... tytéž vady zobrazení, jako světelná **astigmatismus, koma ...**
- V oblasti obklopující paraxiální (malé úhly s osou) hlavně

vada chromatická

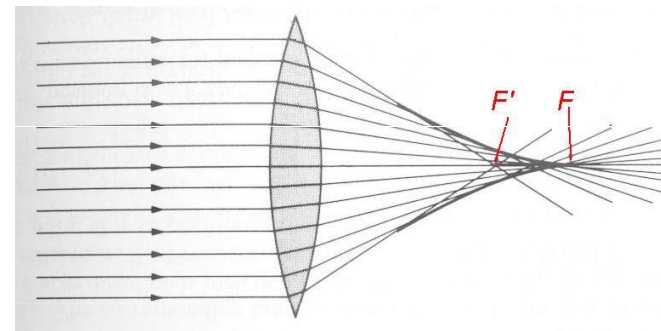
vada sférická (otvorová)

**Podstata** rychlejší elektrony se zalomí méně ... analogie červeného světla

**Podstata** paprsky dále od osy se zalomí více ... vzniká kaustická plocha

## Odpomoc

- kvalitní monochromatický zdroj elektronů ... studená emise
- použití zkřížených Wienových filtrů (o těch viz přednáška VI)



**Odpomoc z nouze** vyclonit dostatečně úzký svazek

Problémy ♠ malá světelnost

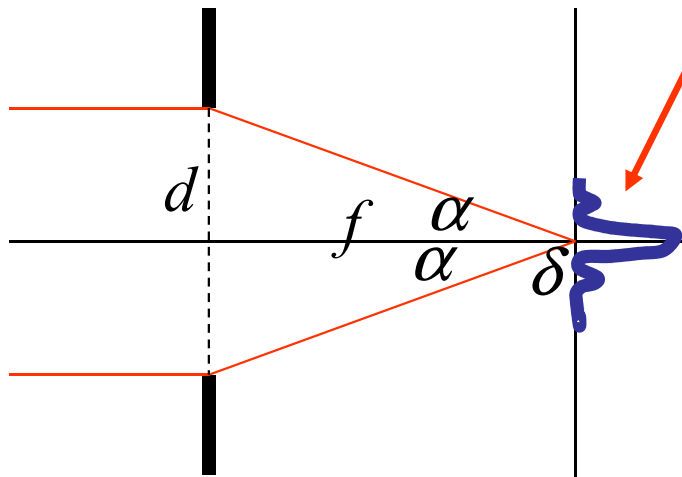
♠ difrakce na cloně

Otvorová vada v elektronové optice je **neodstranitelná**

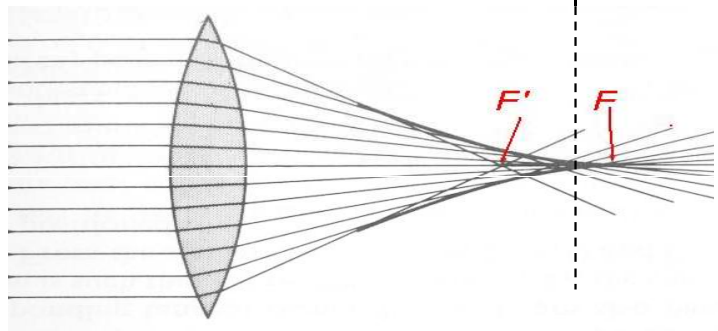
**viník:** Gaussova věta elektrostatiky, nedovolí korekce indexu lomu

– ohybová vada **115**

# Ohybová vada (jako u světelné optiky)

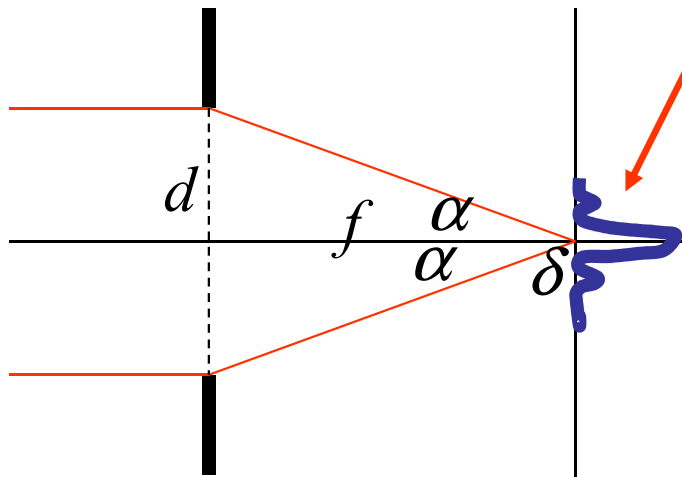


$$\delta \approx \frac{\lambda}{\sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{\alpha} \quad \text{průměr hlav. maxima}$$



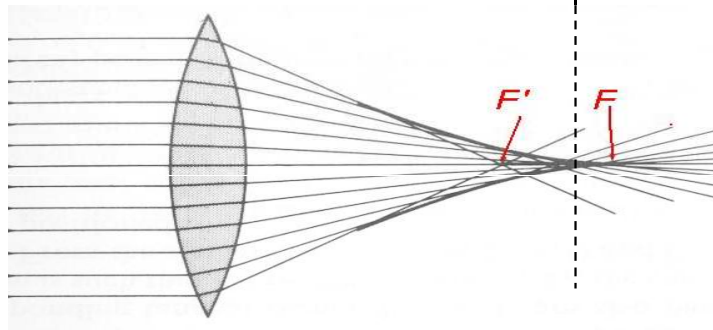
$$\rho_{sf} \approx C_s \alpha^3 \quad \text{průměr obraz. kroužku}$$

# Ohybová a otvorová vada



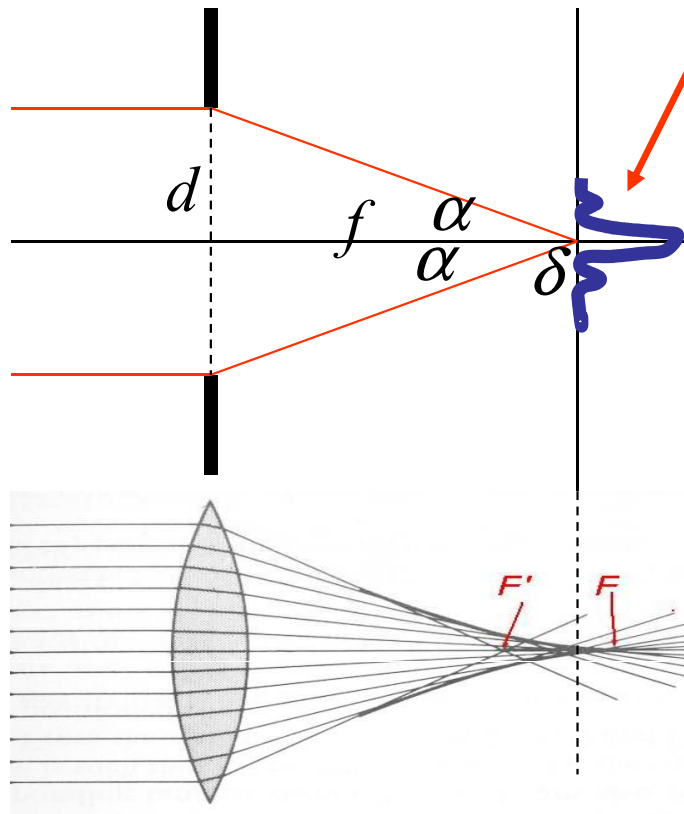
$$\delta \approx \frac{\lambda}{\sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{\alpha} \quad \text{průměr hlav. maxima}$$

Také tento koef. 3. řádu lze určit výpočtem



$$\rho_{sf} \approx C_s \alpha^3 \quad \text{průměr obraz. kroužku}$$

# Ohybová a otvorová vada



$$\delta \approx \frac{\lambda}{\sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{\alpha} \quad \text{průměr hlav. maxima}$$

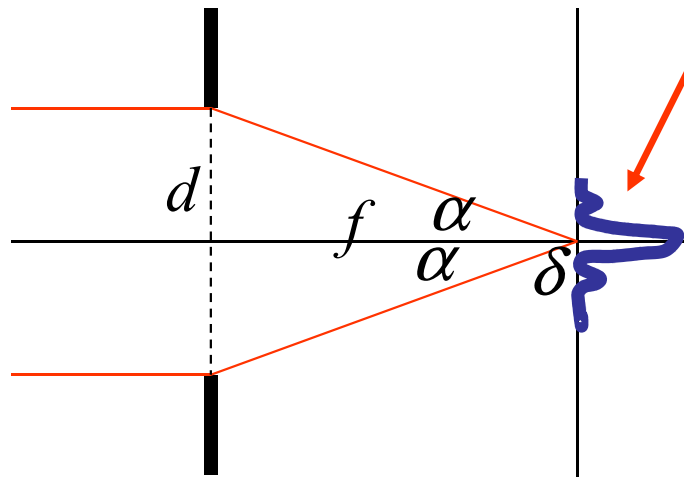
$$\rho_{sf} \approx C_s \alpha^3 \quad \text{průměr obraz. kroužku}$$

... hledáme kompromisní hodnotu aperturního úhlu z podmínky

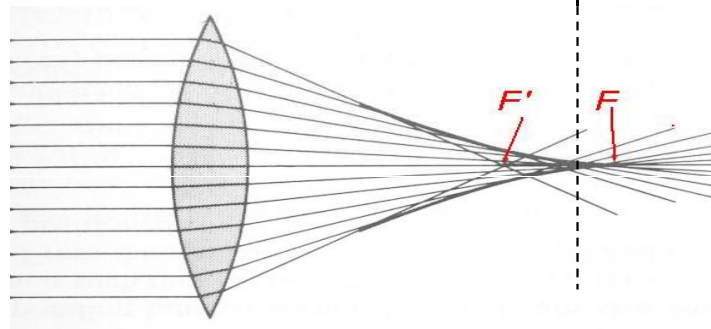
$$\rho_{sf} \approx \delta$$

$$\alpha_{opt} \approx (\lambda / C_s)^{1/4} \quad \delta_{opt} \approx (\lambda^3 C_s)^{1/4} \approx \lambda$$

# Ohybová a otvorová vada: mez rozlišení



$$\delta \approx \frac{\lambda}{\sin \alpha} \approx \frac{\lambda}{\alpha} \quad \text{průměr hlav. maxima}$$



$$\rho_{sf} \approx C_s \alpha^3 \quad \text{průměr obraz. kroužku}$$

... hledáme kompromisní hodnotu aperturního úhlu z podmínky

$$\rho_{sf} \approx \delta$$

$$\alpha_{\text{opt}} \approx (\lambda / C_s)^{\frac{1}{4}} \quad \delta_{\text{opt}} \approx (\lambda^3 C_s)^{\frac{1}{4}} \approx \lambda$$

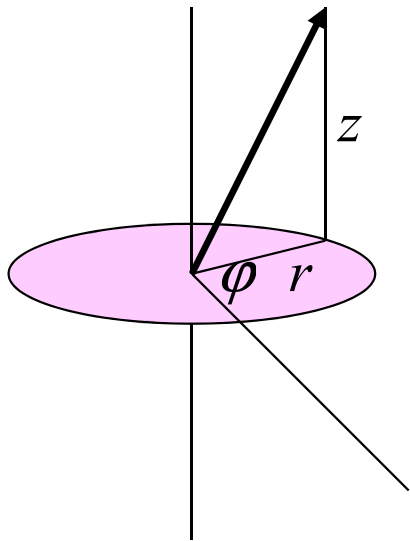
... pro rozlišení v řádu nm se tak vlnové délky volí v řádu 1 – 10 pm

## *Nadchází éra korigovaných elektronových mikroskopů*

... idea tu byla už dávno,  
posledních několik let jsou  
mikroskopy s korektory  
komerčně dostupné



# *Je tedy otvorová vada nepřekonatelná?*



Na těsném propojení axiální a radiální složky pole se účastní dvě okolnosti: ❶ Laplaceova rovnice  
❷ axiální symetrie pole (nezávislost na azimutu)  
Dohromady to dá jednoznačné propojení

$$\partial_r E_r + \frac{1}{r} E_r + \partial_z E_z = 0$$

# *Po válce Scherzer navrhl korektory ...*

## **The Theoretical Resolution Limit of the Electron Microscope**

O. SCHERZER

*Signal Corps Engineering Laboratories, Fort Monmouth, New Jersey*

(Received June 14, 1948)

The resolving power of the electron microscope and the contrast in the image are calculated for different conditions of focusing, illumination and aperture. These conditions can change the limit of resolution by a factor of about 3. The contrast in the image of an atom is appreciably increased by defocusing and spherical aberration. Nevertheless, the contrast improves when the numerical value of the aberration constant is diminished. The effect of different methods of spherical correction is discussed briefly.

# *Po válce Scherzer navrhl korektory ...*

## **The Theoretical Resolution Limit of the Electron Microscope**

O. SCHERZER

*Signal Corps Engineering Laboratories, Fort Monmouth, New Jersey*

(Received June 14, 1948)

The resolving power of the electron microscope and the contrast in the image are calculated for different conditions of focusing, illumination and aperture. These conditions can change the limit of resolution by a factor of about 3. The contrast in the image of an atom is appreciably increased by defocusing and spherical aberration. Nevertheless, the contrast improves when the numerical value of the aberration constant is diminished. The effect of different methods of spherical correction is discussed briefly.

## *Po válce Scherzer navrhl korektory ...*

### **The Theoretical Resolution Limit of the Electron Microscope**

O. SCHERZER

*Signal Corps Engineering Laboratories, Fort Monmouth, New Jersey*

(Received June 14, 1948)

The resolving power of the electron microscope and the contrast in the image are calculated for different conditions of focusing, illumination and aperture. These conditions can change the limit of resolution by a factor of about 3. The contrast in the image of an atom is appreciably increased by defocusing and spherical aberration. Nevertheless, the contrast improves when the numerical value of the aberration constant is diminished. The effect of different methods of spherical correction is discussed briefly.

... ALE PAK TO TRVALO JEŠTĚ PADESÁT LET, NEŽ  
DOŠLO K JEJICH KOMERCIALIZACI

# Scherzerova návrhy na překonání sférické vady

Otto Scherzer  
(Mar. 9, 1909 -  
Nov. 15, 1982)



## Scherzerova věta (1936)

V elektronově optické soustavě, kde

- ❖ pohyb elektronů je řízen elektromagnetickými poli
- ❖ tato pole jsou statická
- ❖ a mají osovou symetrii
- ❖ v paprskovém prostoru nejsou prostorové náboje

trpí zobrazení jak **chromatickou**

tak kladnou **sférickou aberací**

## Scherzerovy návrhy (1948)

V elektronově optické soustavě provést jednu z čtyř možných změn

- ❖ k elektromagnetickým polím přidat zrcadlo
- ❖ použít rychle oscilující pole
- ❖ narušit osovou symetrii (kvadrupóly a oktupóly)
- ❖ do paprskového prostoru vložit prostorové náboje

a tím překonat jak **chromatickou**

tak kladnou **sférickou aberací**

# Scherzerova návrhy na překonání sférické vady

Otto Scherzer  
(Mar. 9, 1909 -  
Nov. 15, 1982)



## Scherzerova věta (1936)

V elektronově optické soustavě, kde

- ❖ pohyb elektronů je řízen elektromagnetickými poli
- ❖ tato pole jsou statická
- ❖ a mají osovou symetrii
- ❖ v paprskovém prostoru nejsou prostorové náboje

trpí zobrazení jak **chromatickou**

tak kladnou **sférickou aberací**

## Scherzerovy návrhy (1948)

V elektronově optické soustavě provést jednu z čtyř možných změn

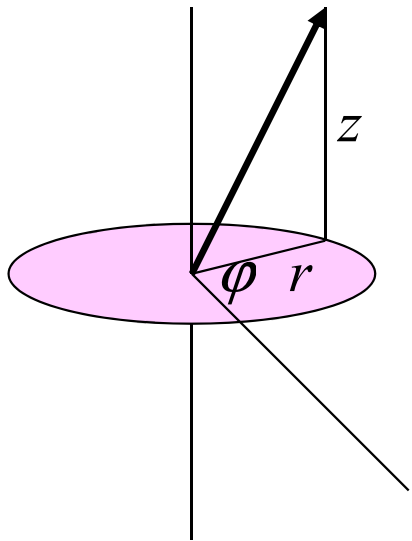
- ❖ k elektromagnetickým polím přidat zrcadlo
- ❖ použít rychle oscilující pole
- ❖ **narušit osovou symetrii (kvadrupóly a oktopóly)**
- ❖ do paprskového prostoru vložit prostorové náboje

a tím překonat jak **chromatickou**

tak kladnou **sférickou aberací**

# Otvorová vada je překonatelná

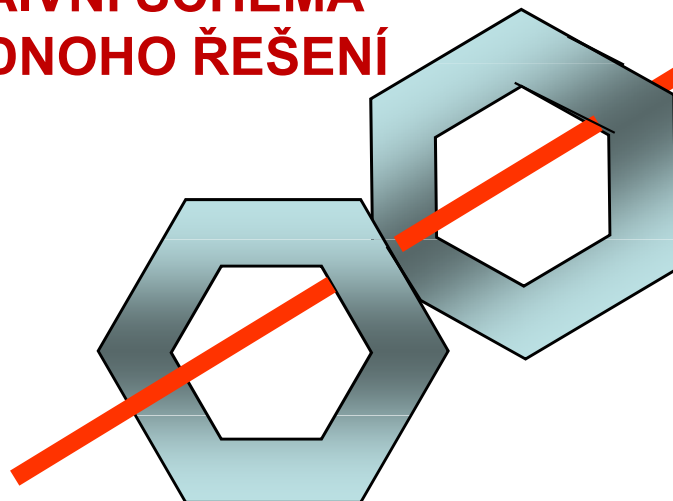
Jednoduchá, ale radikální myšlenka – opustit axiální symetrii



Na těsném propojení axiální a radiální složky pole se účastní dvě okolnosti: ❶ Laplaceova rovnice  
❷ axiální symetrie pole (nezávislost na azimutu)  
Dohromady to dá jednoznačné propojení

**VÝCHODISKO – OPUSTIT AXIÁLNÍ SYMETRII**

**NAIVNÍ SCHEMA  
JEDNOHO ŘEŠENÍ**



Dva navzájem pootočené  
hexapóly  
dávají téměř dokonalou  
kompensaci otvorové vady  
při mizivé azimutální distorsi

# Přehled vyzkoušených korektorů

## Correction of Aberrations

|                                   | SEM | STEM | TEM | LEEM |
|-----------------------------------|-----|------|-----|------|
| Spherical $C_3$                   | -   | +    | +   | -    |
| Spherical & Chromatic $C_3 + C_c$ | +   | +    | ?   | +    |

## Type of Corrector

|                            |           | SEM | STEM | TEM | LEEM |
|----------------------------|-----------|-----|------|-----|------|
| Hexapole                   | $C_3$     | -   | +    | +   | -    |
| Quadrupole                 | $C_3$     | -   | +    | +   | -    |
| Electrostatic Mirror       | $C_3 C_c$ | +   | -    | -   | +    |
| Purely Electrostatic Quad. | $C_3 C_c$ | +   | -    | -   | ?    |
| Quadrupole Electr./Magn.   | $C_3 C_c$ | +   | +    | -?  | -    |

**Key:** + = effective and already demonstrated;  
 + = feasible, but not yet demonstrated;  
 - = not feasible or not useful;  
 ? or ? = questionable or very questionable



# Pokusy zavést korektor byly dlouho nepřesvědčivé

**Table 4. Brief history of aberration correction**

| <u>Corrector Type</u>                                   | <u>First Proposed</u>         | <u>Subsequent Versions</u>  | <u>Proof-of-Principle</u>    | <u>Improves Resolution of Its Microscope</u> | <u>Improves Resolution of Any Microscope (at its kV)</u> |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|--|--|
| Cs only:<br>2 cylindrical lenses /<br>3 octupoles       | Scherzer<br>1947              |   | Seeliger<br>1951-54          | Mollenstedt<br>1954-56                       |  |
| Cs only:<br>4 quads /<br>3 octupoles<br>(combined)      | Archard<br>1955               |   | Deltrap 1964                 | Krivaznek+Dell<br>by<br>1997                 |  |
| Cs only:<br>4 quads /<br>3 octupoles<br>(separate)      | Thomson<br>1967               | Beck+Crewe<br>1972-75   | Krivaznek+Dell<br>by<br>1999 | Dellby +<br>Krivaznek<br>2000                | Dellby +<br>Krivaznek<br>2000                            |
| Cs only:<br>2 sextupoles /<br>2 (4) round<br>lenses     | Beck<br>1979                  | Crewe 1980<br>Rose 1981<br>Shao 1988<br>Rose 1990                         | Chen and Mu<br>1990          | Haider 1997                                  | Haider 1998  |
| Cs + Ce:<br>4 mag. quads /<br>2 el. quads<br>3 octs     | Hardy<br>1967                 | Rose 1971   | Hardy 1967                   | Zach + Haider<br>1995                        | Zach 1997  |
| Cs + Ce:<br>5 el. quads /<br>5 mag. quads<br>3 el. octs | Hardy<br>1967<br>Rose<br>1971 | Pohner 1976<br>Koops 1978<br>Bernhard<br>1980<br>Hely 1981<br>Haider 1984 | Koops 1978                   | Hely 1981                                    |  |

*Až v posledních cca 5 – 8 letech komercializováno*

**Table 4. Brief history of aberration correction**

| <u>Corrector Type</u>                                   | <u>First Proposed</u>         | <u>Subsequent Versions</u>  | <u>Proof-of-Principle</u>   | <u>Improves Resolution of Its Microscope</u> | <u>Improves Resolution of Any Microscope (at its kV)</u> |
|---|-------------------------------|---|-----------------------------|--|--|
| Cs only:<br>2 cylindrical lenses /<br>3 octupoles       | Scherzer<br>1947              |   | Seeliger<br>1951–54         | Mollenstedt<br>1954–56                       |  |
| Cs only:<br>4 quads /<br>3 octupoles<br>(combined)      | Archard<br>1955               |   | Deltrap 1964                | Krivanek+Dell<br>by<br>1997                  |  |
| Cs only:<br>4 quads /<br>3 octupoles<br>(separate)      | Thomson<br>1967               | Beck+Crewe<br>1972–75   | Krivanek+Dell<br>by<br>1999 | Dellby +<br>Krivanek<br>2000                 | Dellby +<br>Krivanek<br>2000                             |
| Cs only:<br>2 sextupoles /<br>2 (4) round<br>lenses     | Beck<br>1979                  | Crewe 1980<br>Rose 1981<br>Shao 1988<br>Rose 1990                         | Chen and Mu<br>1990         | Haider 1997                                  | Haider 1998  |
| Cs + Ce:<br>4 mag. quads /<br>2 el. quads<br>3 octs     | Hardy<br>1967                 | Rose 1971   | Hardy 1967                  | Zach + Haider<br>1995                        | Zach 1997  |
| Cs + Ce:<br>5 el. quads /<br>5 mag. quads<br>3 el. octs | Hardy<br>1967<br>Rose<br>1971 | Pohner 1976<br>Koops 1978<br>Bernhard<br>1980<br>Hely 1981<br>Haider 1984 | Koops 1978                  | Hely 1981                                    |  |

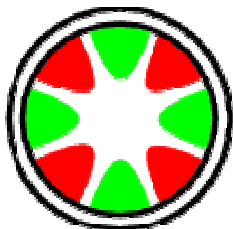
Fa Nion  
Arizona, USA

Fa CEOS  
Německo

# *12ti pólový korektor*



Guru: Maximilian Haider  
Joachim Zach



**CEOS**

Corrected Electron Optical Systems GmbH

# *Do existujících mikroskopů se vloží korektor*

~~TEM~~ STEM ~~SEM~~

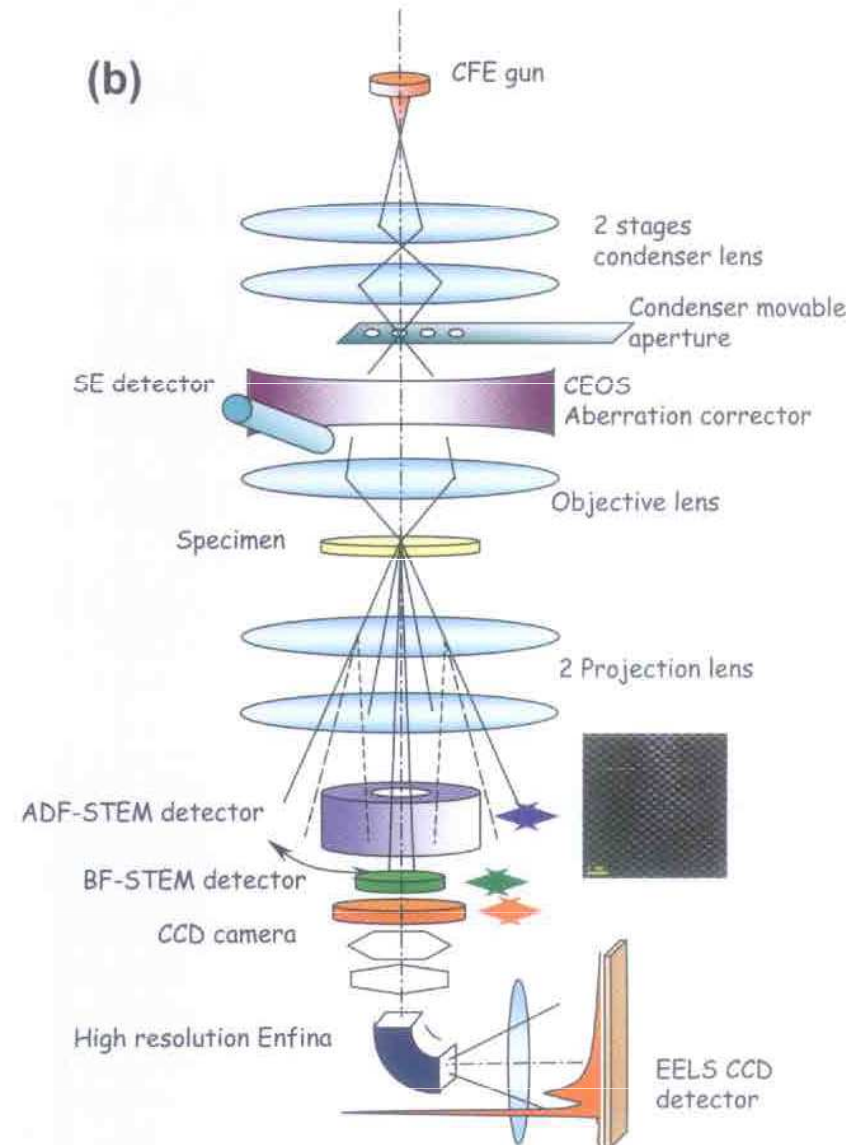
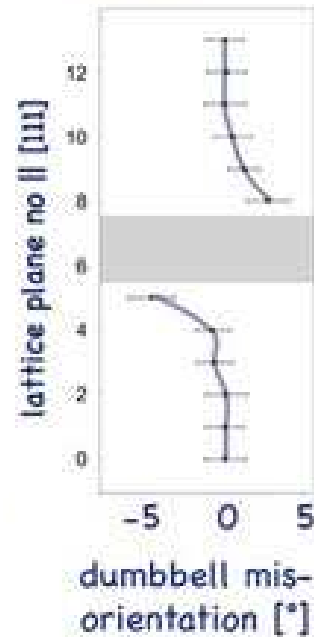
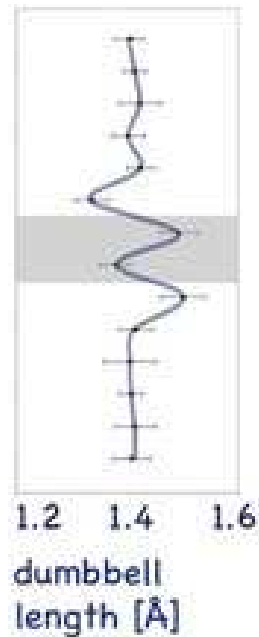
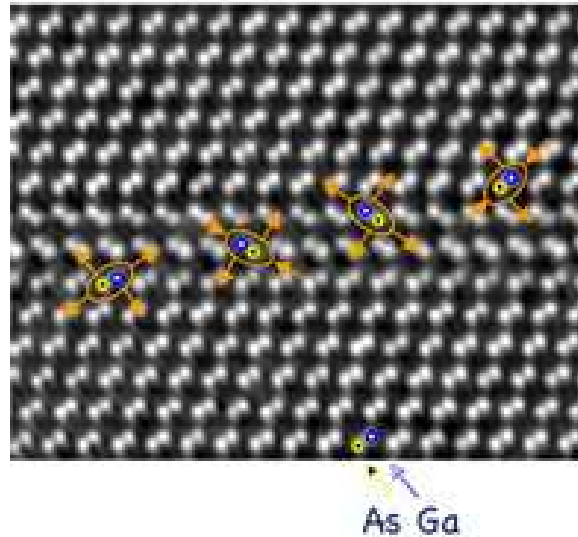


Fig.1(a) The Hitachi aberration corrected HD2700C STEM at BNL. (b) The schematics of the lens and detector assignment of the instrument.

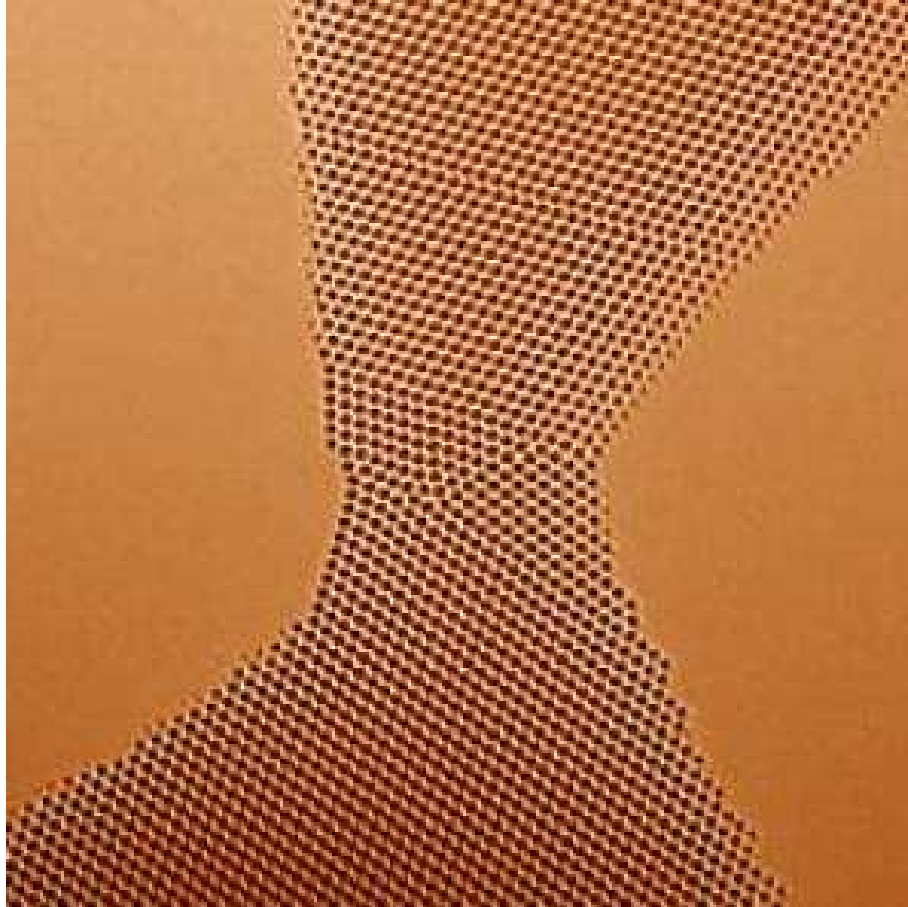
# Vrstevná chyba v GaAs (ERC – Champion)

Ernst Ruska Center  
(CEOS)



# *Zlatá folie (TEAM 0.5)*

TEAM  
Berkeley  
(CEOS)

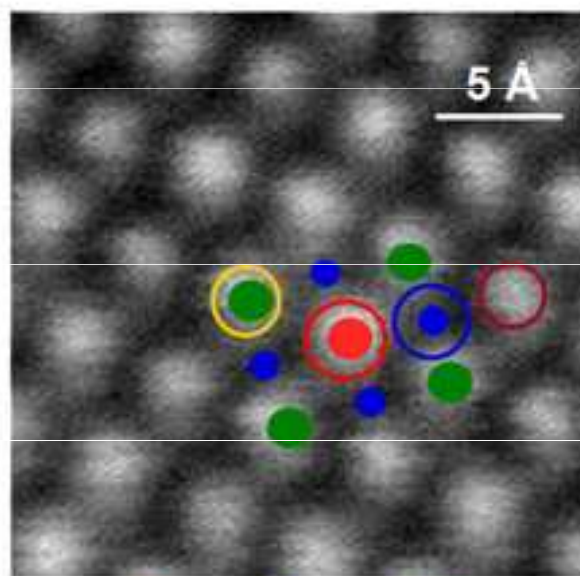


*Prof. Křivánek je českého původu*



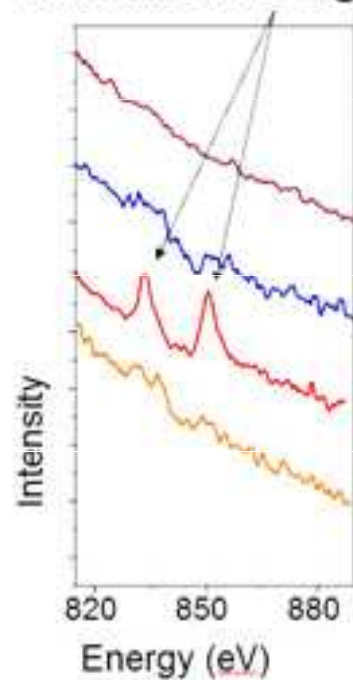
Guru: Ondřej Křivánek FRS

# Identifikace jednotlivých atomů (Nion)



Ca O Ti

La M4/5 EELS signal



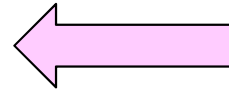


# *SuperSTEM Daresbury*

11 January 2012

Launch Day of the EPSRC National Facility for  
Aberration Corrected STEM

superSTEM1



*VG HB 501 with Mark II  
Nion C<sub>s</sub> corrector*

C<sub>3</sub> Nion QO corrector for  
sub-1.0Å probes with 80pA  
current

40-100kV cold FEG emitter  
with 0.3eV energy spread

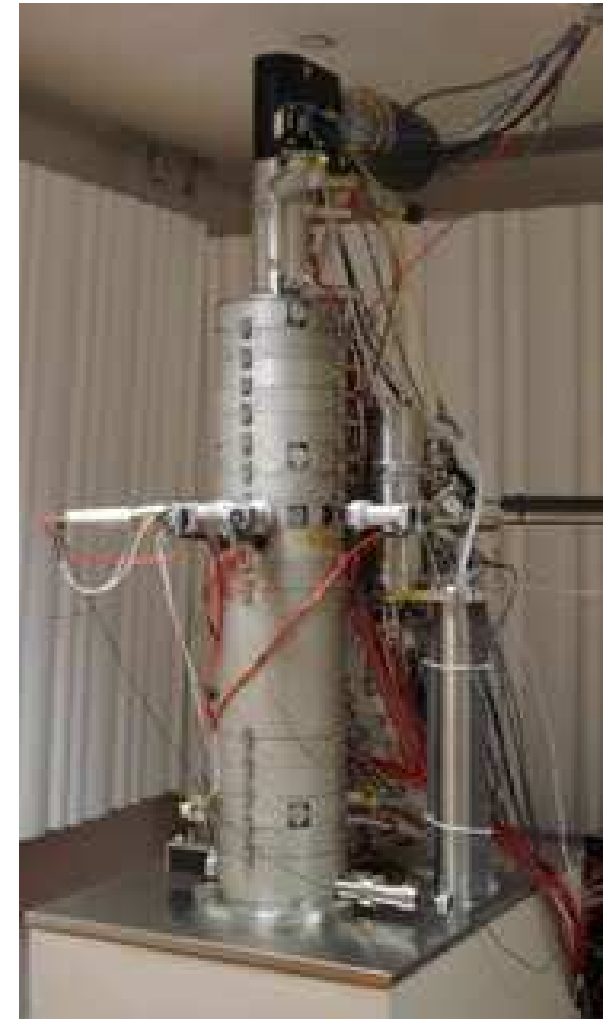
BF/MAADF/HAADF

detectors: 0-6/35-100/70-  
210mrad collection angles

UHF Enfina spectrometer  
with multipole coupling up  
to 19mrad EELS collection

*Ex-situ* gas reaction cell

superSTEM2

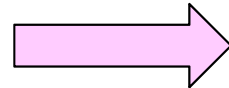


# *SuperSTEM Daresbury*

11 January 2012

Launch Day of the EPSRC National Facility for  
Aberration Corrected STEM

superSTEM1



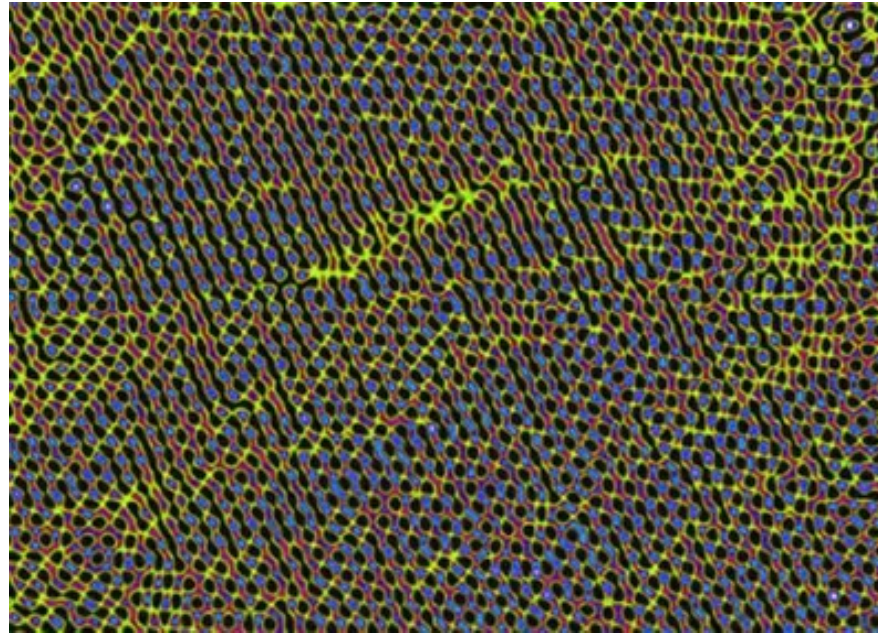
superSTEM2



*Nion Ultrastem™ 100*

$C_5$  Nion QO corrector, full  
correction up to six-fold  
astigmatism  $C_{5,6}$   
40-100kV cold FEG emitter  
with 0.3eV energy spread  
Flexible post-specimen  
optics for EELS collection  
Ultrastable x, y, z sample  
stage with multi-holder in-  
vacuum magazine  
UHV Enfina EELS  
spectrometer  
Bruker SSD EDS detector  
(0.13sr solid angle)

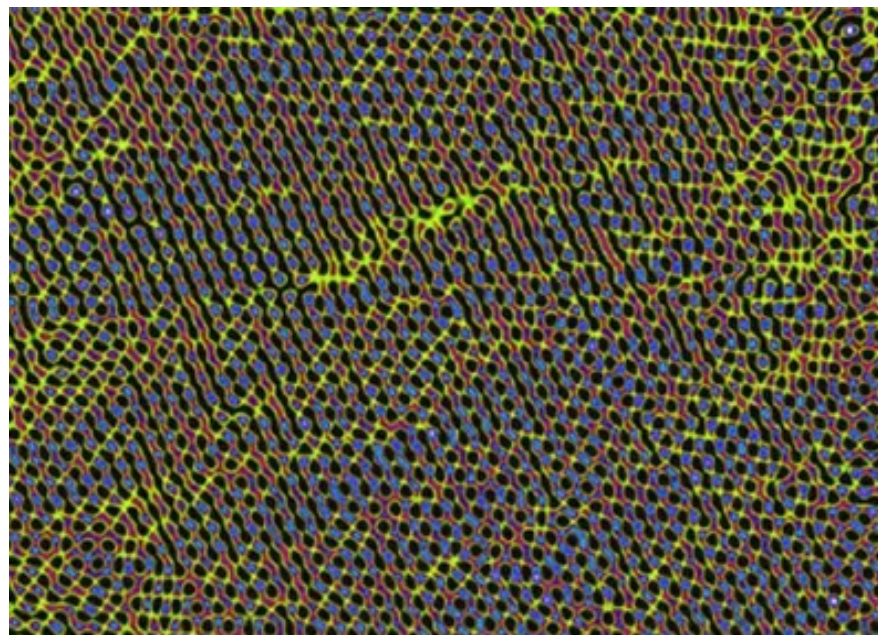
EPSRC  
Daresbury  
(Nion)



### **Ripples in suspended Graphene**

HAADF image to show ripples in suspended graphene. Black 'beads' are the centres of 'benzene' rings. The bead-strings gave a separation of 0.21 nm, the colour coding is chosen so that the atoms on tops and in troughs of ripples appear yellow and in the flanks bluish. The ripple amplitude is ~0.5 nm and their 'wavelength' ~5 nm

EPSRC  
Daresbury  
(Nion)

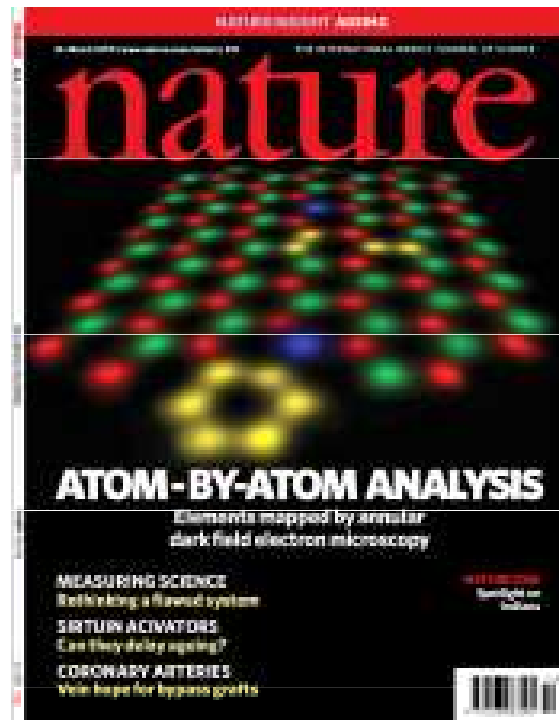


### Zvlnění zavěšeného grafenu

HAADF zobrazení ukazující zvlnění zavěšeného grafenu. Černé 'korálky' jsou středy 'benzenových' prstenců. Spojnice korálek dávají vzdálenost 0.21 nm, barevné kódování je zvoleno tak, že atomy na vrcholech a v prohlubních vlnek se jeví jako žluté a na bocích namodralé. Amplituda vlnek je ~0.5 nm a jejich vlnová délka ~5 nm.

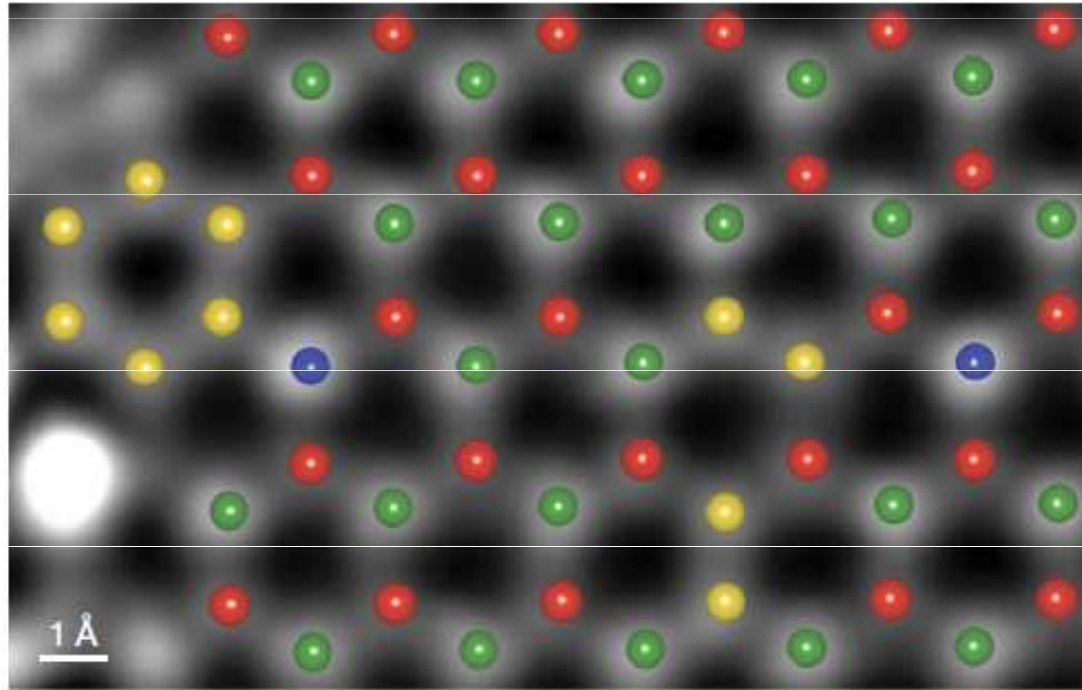
# *superSTEM 2 se dostal na obálku Nature*

STEM ORNL  
Oak Ridge  
(Nion)



chemická analýza povrchu  
atom po atomu

# Originál obrázku



**Figure 3 | The atomic structure determined by the histogram analysis.** Part of a DFT simulation of a single BN layer containing the experimentally observed substitutional impurities overlaid on the corresponding part of the experimental image. Red, B; yellow, C; green, N; blue, O.

# *Brno a elektronový mikroskop*

... tedy

Armin Delong a elektronový mikroskop



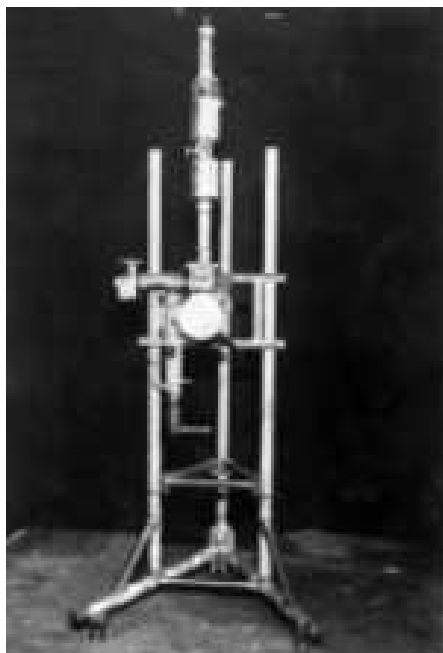
Prof. Armin Delong

hlavní spoluvůrce několika generací čs. elektronových mikroskopů

zakladatel a první mnohaletý ředitel Ústavu přístrojové techniky

laureát ceny Česká hlava 2006





**"Trojnožka" (1950)**



**Stolní elektronový mikroskop  
Tesla BS242 (1954)**

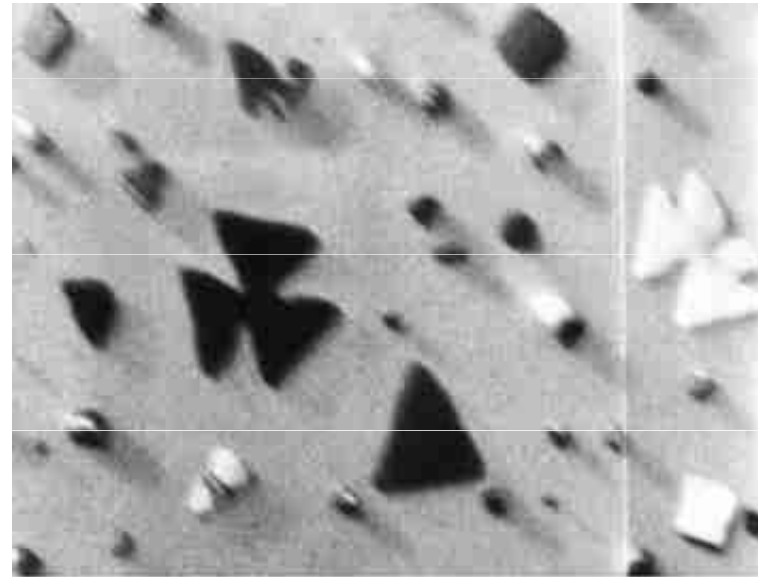
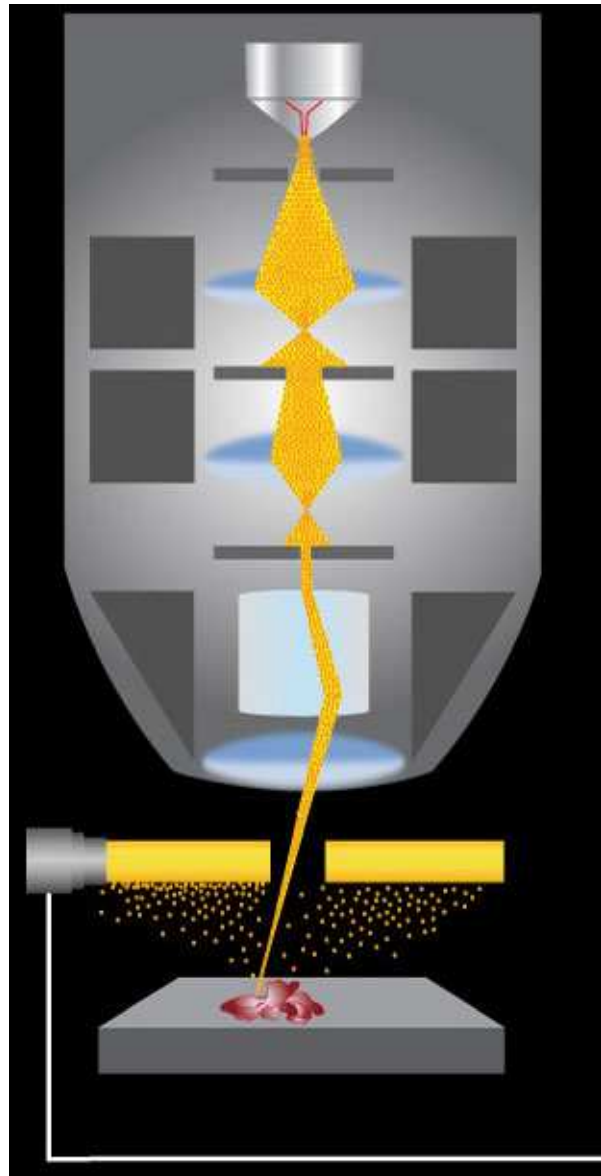


**Elektronový litograf (1985)**

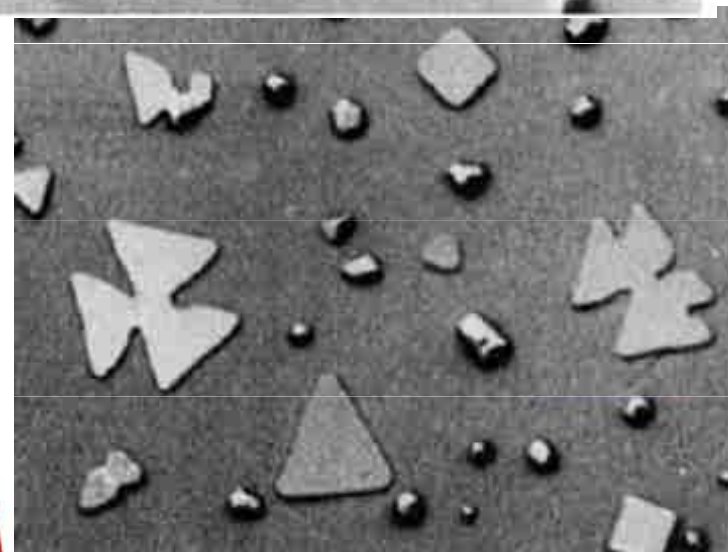


**První environmentální rastrovací elektronový  
mikroskop v ČR pro pozorování vzorků v jejich  
přirozeném stavu (1996)**

# Scanovací elektronová mikroskopie s pomalými elektrony

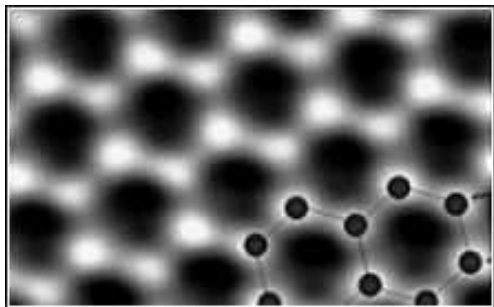


5500 eV



80 eV

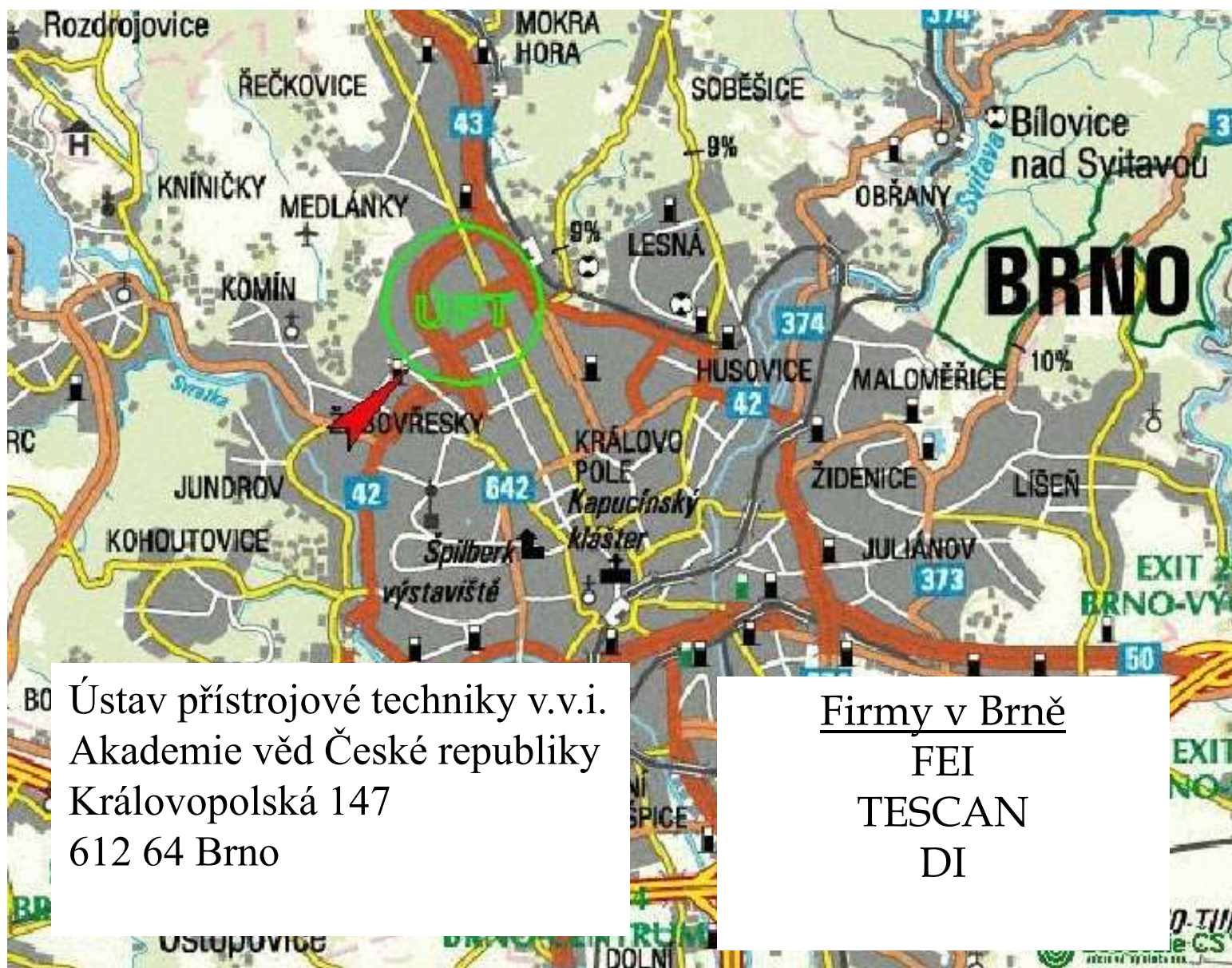
# Scanovací elektronová mikroskopie s pomalými elektrony



grafen

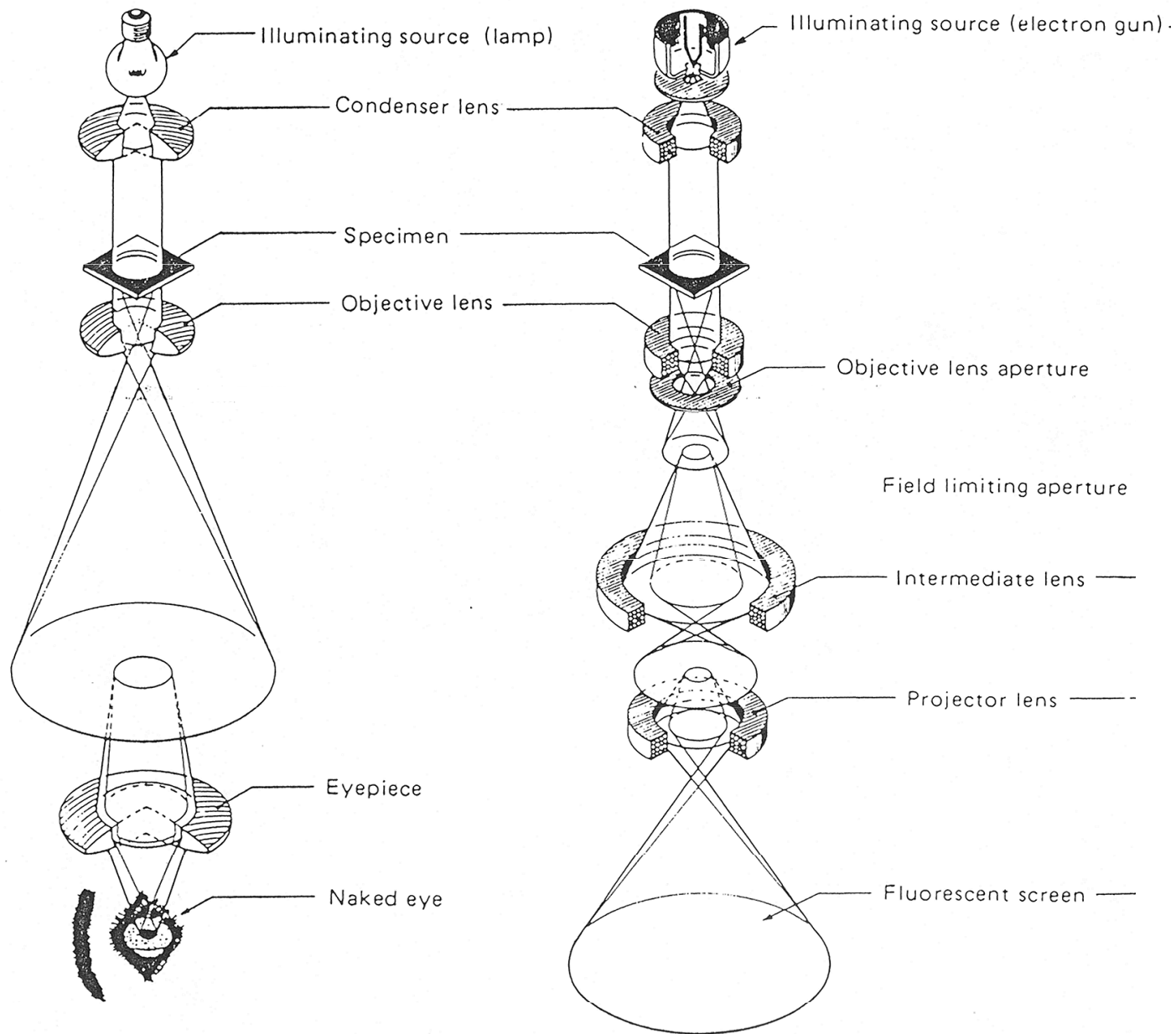
„Saša“ Novoselov  
NP 2010





*The end*

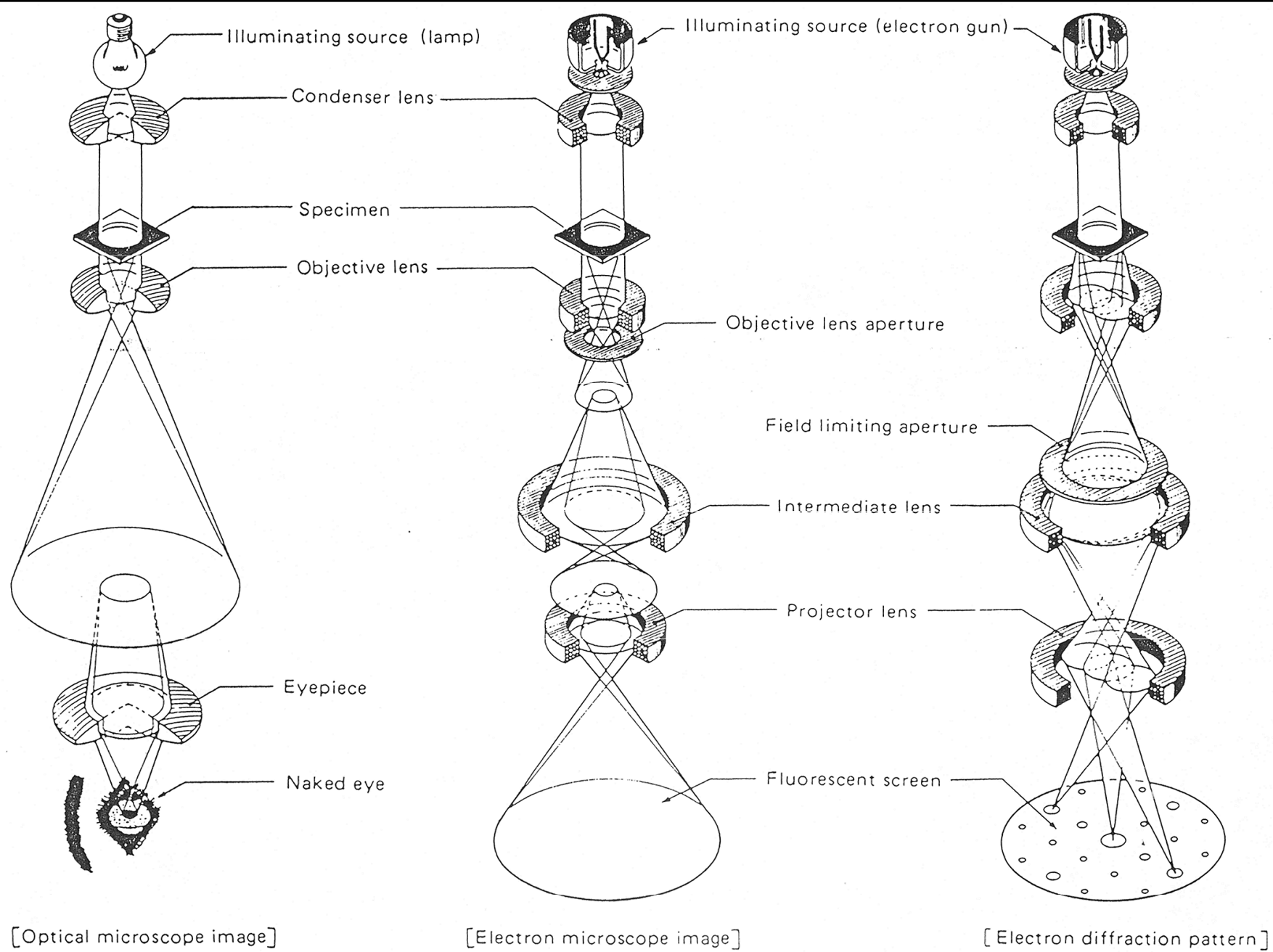
# Porovnání optického a elektronového mikroskopu



[Optical microscope image]

[Electron microscope image]





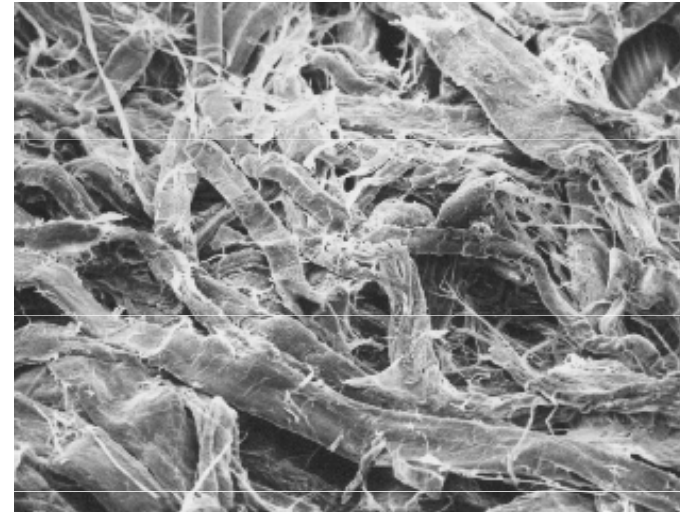
**Figure 3. Comparison of image formation.**



Obrázky ze SEM (neomezená hloubka ostrosti  $\times$  optika)



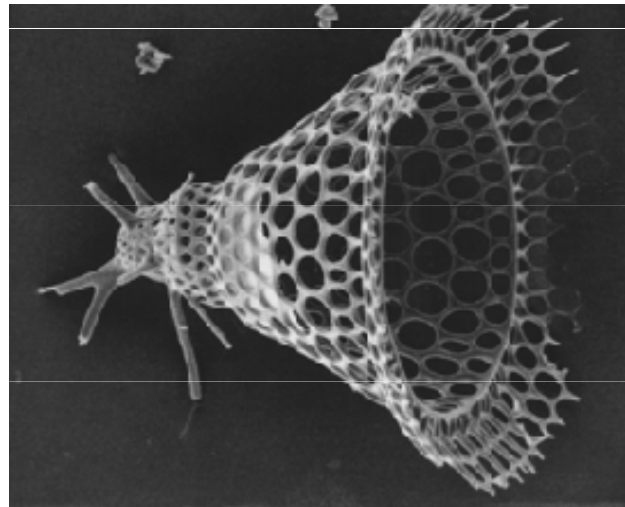
černá vdova (x 500)



toaletní papír (x 500)



inj. stříkačka (x 100)



radiolara (x 750)

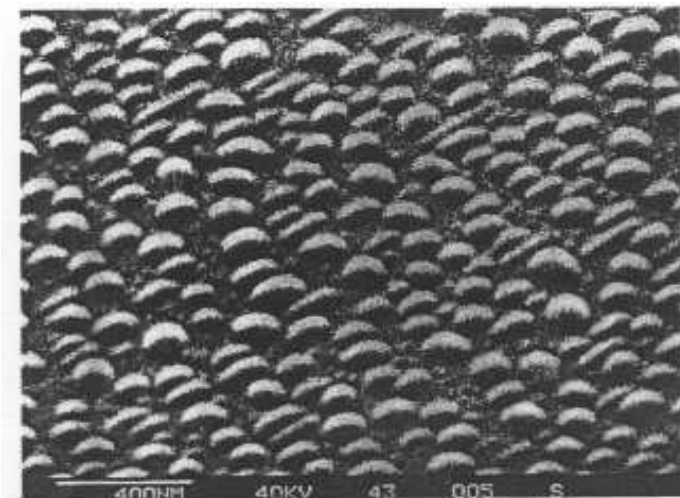


Fig. 3.28. Scanning electron micrograph of an Sn film (nominal coverage 38 monolayers) deposited on a cleaved GaAs surface [3.20]

kapičky Sn na povrchu GaAs